

^{特集} 赤外線ではかる

July 1993 No.7





○誌名について

誌名"Readout"(リードアウト)には、「当 社が創造・育成した技術を、広く世にお知らせ し、多くの皆様に読み取っていただきたい」と いう願いが込められています。

○表紙写真

撮影:松井秀雄氏(二科会写真部関西支部所属) 一度は行ってみたい丘の向う。童話の世界を想 わせる家とグリーン。

Readout No.7 特集●赤外線ではかる □巻頭言 堀場と赤外線応用技術 石田 耕三 3 □特別寄稿 赤外分光技術の展望 三石 明善 5 ●特集論文 陸上生態系における大気温暖化ガスの動態を測る 原薗 芳信・宮田 明・三笠 元 13 HPLC分離/ピンポイント濃縮/顕微FTIRによる界面活性剤の高感度検出と同定法 礒 節子・池田 昌彦 23 反射スペクトルのクラマース・クローニッヒ変換による解析 右近 寿一郎—— -29 油分濃度計 (OCMAシリーズ) 福嶋 良助 39 自動車整備検査用排ガス測定器 (MEXA-324G) 小島 建之助——45 鼓膜体温計 (IT-500M) 松本 直之・辻岡 唯二・迫田 博文-----52 焦電形赤外線センサ 松本 浩一・岡本 一隆 57 ニューマチック赤外検出器 青木 潤次——64 赤外線ガス分析計を支える高機能赤外線多層膜干渉フィルタ 石田 正彦 72 □特別寄稿 旋光計によるアミノ酸、ペプチドおよびタンパク質の研究 泉屋 信夫 81 ●一般論文 堀場製作所におけるソフトウエアへの取り組み 酒井 俊英-----88 卓上形蛍光 X 線元素分析装置 (MESA-500) 吉良 昭道——95 ◆施設紹介 多層膜干渉フィルタ生産用全自動真空蒸着装置 祇園 聡・壽見 芳正―――104 ◇一口メモ 血液分析用試薬の保管方法 臼井 誠次―――108 ◇知有権メモ _____109 ◇社外技術発表リスト(1992年11月~1993年4月) _____111 ◇バックナンバー掲載記事 ―― 112

	Foreword	HORIBA and Infrared Applied Technology Kozo Ishida——— <i>3</i>	
	Guest Forum	Outline of Infrared Spectroscopic Techniques Akiyoshi Mitsuishi———5	
	Feature Articles	Measurements of the Atmospheric Greenhouse Gases Dynamics in Land Ecosystems Yoshinobu Harazono, Akira Miyata, Hajime Mikasa———13	
		Determination of trace amount of non-ionic surface active reagent by HPLC with micro-FTIR using pin-point condensation techniqueHigh sensitivity detection and HPLC separation method for polyethylene glycol alkyl ether and polyethyl- ene glycol alkylphenyl ether Setsuko Iso, Masahiko Ikeda-23	
		Analysis of Reflectance Spectra by Kramers-Kronig Transformation Juichiro Ukon——29	
		Oil Concentration Meter(OCMA) Ryousuke Fukushima	
×		Portable Automotive Emission Analyzer for Automobile Repair and Inspection (MEXA-324G) Kennosuke Kojima——45	
		Tympanic Thermometer (IT-500M) Naoyuki Matsumoto, Yuiji Tsujioka, Hirofumi Sakoda——— <i>52</i>	
		Pyroelectric Infrared Sensor Koichi Matsumoto, Kazutaka Okamoto——57	
		Pneumatic Infrared Detector Junji Aoki64	
		Highly Functional Infrared Multilayer Interference Filter for Supporting Infrared Gas Analyzers Masahiko Ishida——72	
	Guest Forum	Studies of Amino Acids, Peptides and Proteins by Polarimeter Nobuo Izumiya—— <i>81</i>	
	Selected Topics	HORIBA's Involvement in Software Toshihide Sakai88	
		Desktop X-ray Fluorescence Element Analyzer (MESA-500) Akimichi Kira—— <i>95</i>	
	New Facility	Fully Automatic Vacuum Deposition Unit for Producting Multi-layer Interference Filters Satoshi Gion. Yoshitada Sumi104	
	♦ Short Notes	How to Store the Blood Analysis Beagent Seiji Usui-108	
	♦ Patents10		
	♦ Technical Reports List————————————————————————————————————		

.

堀場と赤外線応用技術

HORIBA and Infrared Applied Technology

赤外線は私たち人類の発展に必要な多くの物質との相互作用を持っていることか ら,化学分析の分野や工業分野において重要な役割を果たしている.

わが社における赤外線分析計の開発は1955年にさかのぼる.当時,pH計に続く 事業の柱としてガス分析計の開発が検討され,ガスクロマトグラフ法か赤外線吸収 法か,さらに分散方式かそれとも非分散方式にするのかという議論がなされた. 結果として分析・計測の原点である,高速応答性,高い再現性,高い信頼性,そし てメンテナンス性に優れる非分散形赤外線法の採用が決定された.

その背景には、堀場社長(現会長)の『分析原理は物理的に明快であること』という考え方と、当時、重化学工業化が急速に進む中で、反応の制御用として工業用プロセス連続ガス分析計のマーケットが大きく開け始めていたということがあった.

それ以後,赤外線分析計は工業用から自動車の排気ガスの計測に代表される環境 用計測器として,今日もなお,当社の主力製品であると同時に今後ますますその市 場が拡大していくと考える.もちろんこの間に絶えず技術的改良が加えられて,コ ストパーフォーマンスも飛躍的によくなった.

わが社における赤外線分析技術のエポックとしては、まず、コンデンサマイクロ フォンによるニューマテイック検出器をベースとしたこと、そして、当初零位法で あったものを1962年に直接偏位法へ切り換えたことである.この時期から、基本要 素部品であるフッ化リチウムやフッ化カルシウムなどの赤外線透過窓用の結晶の製 造を開始した.

使用過程車のアイドルCO規制が始まった1970年には、従来の概念を打ち破った低コ ストの可搬型赤外線分析計の開発に成功し、分析機器の量産時代が到来した.

自動車排ガス規制や煙道排ガス規制の強化に伴う測定レンジの高感度化の要求と 相まって,干渉問題の解決を迫られることになった.これらの要求を満たすため, 1973年には自社で多層膜赤外線干渉フィルタの製造を開始し,同じ頃デュアルデテ クタ方式による干渉影響低減法の開発に成功し,目的成分と干渉成分の弁別比が一 挙に2桁改善された.また,この時期には,さらなる高感度化への対応と安定性の 要求に対し流体そのものによるクロスフローモデュレーション方式の開発に成功し, 感度,安定性の飛躍的向上が図れることになった.実に感度では2桁以上,ドリフ トとくにゼロドリフトを完全になくすことが可能となった.

この様な非分散形赤外線分析計の開発の流れの中で、新たな取り組みとしてフー リエ変換を用いた干渉形赤外分光分析計を開発し、汎用型への展開と平行して、自 動車排ガス専用の多成分連続測定機への展開を図りつつある。一方、用途の広がり と低コスト化の市場要求に応えるため、半導体赤外線検出器や焦電赤外検出器を用 いた分析計の開発を行い、前者は超高速排ガス分析計としてミリ秒単位の情報を得 ることが可能となり、後者では3成分の同時測定ができる小型軽量で低コストの量 産型赤外分析計を提供することが出来るまでになった。



^{常務取締役} 石田 耕三 ^{工学博士}

Kozo Ishida, Dr. Eng. Managing Director

巻頭言

Foreword

一方,わが社として分析計以外の新しい赤外線技術,製品への取り組みとして, サーモパイル赤外線検出器を用いた非接触温度計は,工業用は勿論のこと,鼓膜体 温計などへの展開を通じてわが社の赤外線利用技術の製品として新たな地位を築き つつある.また,焦電検出器は,セキュリティや自動スイッチなど生活の場のセン サとしてあらゆる場面でお目にかかる時代になり,そのセンサ市場も急速に広がっ てきている.

オゾン層の破壊にともない降り注ぐ紫外線が生体系へ影響を与え始めているといわれている.確かに紫外線やX線など高いエネルギーの電磁波を使うことで科学技術の進歩が加速されてきたことは事実であるが,生活環境の中ではなじみにくい領域であり,取扱いにしても専門の領域からでにくいと思う.

一方,生体に優しい可視から赤外領域の電磁波を用いた分析技術や応用製品は身近なものとしてますます広がりを見せてくると考えられる.1968年に始めてわが社の赤外線分析計に出会い,70年に入社してからこの方,赤外線分析計の開発に直接間接に携わってきた小生にとって,赤外線技術のこれからのさらなる進歩を願うと同時に,世界の人々に役に立つ多くの製品が生まれでることを願ってやまない.

特別寄稿

Guest

Forum

赤外分光技術の展望

Outline of Infrared Spectroscopic Techniques

1. はじめに

赤外線は周知のように、1800年にHerschelによって発見された.彼は分光され た太陽光の強度分布を測定していて、赤外の外側の目に見えない所に置かれた水銀 温度計が赤色部よりさらに高い温度上昇を示すことを見出した. Hudson¹¹によると、 Herschelはこれをinvisible rays, thermometric spectrum, the rays that occasion heatとかdark heatとか述べていて、infraredという言葉は1880年代までの文献には出ていないとの ことである.なお、これが熱線のような特殊なものでなく、可視光と同じ電磁波で あることを確立したのはAmpere(1835年)である.

赤外線は①目に見えない, ②フォトンエネルギーが小さい, ③波長が長く散 乱されにくい, ④物体の熱放射として放射されている, ⑤多くの物質に吸収され易く, そ の温度を上昇させるなどの特色を持っている.

フォトンエネルギーの小さい赤外領域(波長で0.75 µ mから 1 mm位まで)には, 分子の回転・振動,固体の格子振動を始めとする多様な励起があり,これらの基礎 研究およびその分析・評価への応用が精力的に行なわれてきている.このための分 光法,光学素子,分光装置の研究開発は目覚ましいものがある.

物体の熱放射は黒体の場合、その温度をT(K)、分光放射強度のピーク波長を $\lambda_{\rm M}$ (μ m)とするとき、 $\lambda_{\rm M}$ T=2,898=3,000(μ mK)の関係がある。常温で10 μ m、1000K で3 μ mとそのピークは赤外域にあり、これから温度計測・リモートセンシング応 用が、主として検出器を含めた検出系の進歩と共に発展し、多方面に利用されてい る.

目に見えず,散乱されにくい性質は,赤外光通信として利用され,第2次大戦で は、ドイツでリモートセンシング技術と共に強力に研究され,実戦に供されたとのこ とである²¹.しかし現在では,光ファイバーを用いた近赤外光通信の方が, 研究開発の主力であり,中赤外域の赤外光ファイバーも各種研究されているが,ご く近距離のエネルギー輸送や温度情報伝達などに用いられ,赤外光通信にまでは 至っていない.

金属以外の多くの物質が赤外線を吸収することは、赤外線による乾燥・加熱に応用される.この分野も古くから開発されていたが、本格的に注目されだしたのは Ford が車輌の塗装の乾燥に大型の赤外乾燥設備を導入してからである(1935年).当時は赤外線電球が用いられていたが、現在は、被加熱物質の赤外吸収バンドと合致した放射分光分布をもつセラミックスヒーターが開発され、多方面へ実用されている.

これらの赤外線の技術の発展には、近年のコンピューターによる機器の機能・操 作制御、データ処理技術の目覚ましい進歩や、半導体を始めとする種々の機能性材 料の開発なども大きく寄与している.



^{龍谷大学理工学部教授} 三石明善

Akiyoshi Mitsuishi, Dr. Sci. 大阪大学名誉教授 理学博士

<略歴> 1948年:京都大学理学部卒業 1950年:同上大学院特別研究生 前期終了 1964年:大阪大学工学部助教授 1968年、大阪大学工学部教授 1968年~69年: アレキサンダーフォン フンボルト財団奨学生 西ドイツフライブルク 大学留学 1989年:大阪大学定年退官 同年:龍谷大学理工学部教授

<研究分野> 光物性 赤外及びラマン分光

<研究業績> 「赤外分光と光散乱分光」 (実験物理学講座第6巻,光学 技術,第11章,桑原五郎編,共 立出版) 「赤外線工学」(共著,オーム 社)

<趣味> スポーツ(野球, テニス), 音楽鑑賞, 推理小説 筆者は, 永年, 遠赤外域の固体分光の研究に従事してきたので, ここでは紙数の 関係もあり, 分光分野についてだけ展望する. その他の分野について関心のある読 者は文献を参照されたい³⁾.

2. 分光分野

分光測定には、光源、分光系、検出系それに試料系などが必要である、図1に、 赤外域の主な光源、分光法および検出器を示してある。図の上部に全赤外域の波長 区分が示してある。分光学では0.75~2.5 μ mを近赤外、25 μ mまでを普通赤外または 中(間)赤外、それ以上約1mmまでを遠赤外と区分していたが、1960年に50 μ m以上 を遠赤外とすることが勧告されている⁴¹. 25 μ mはKBrプリズム分光の限界で、現在 でも多くのフーリエ変換分光装置は25 μ m(400cm⁻¹)までのものが多いし、ここでは 区分にあまりこだわらないことにする。



図1 赤外域の主な光学素子の使用波長域 Frequency ranges used in main optical elements in the infrared range

2.1 光源

通常の赤外分光測定は、広い領域に亘っての透過(吸収)スペクトルや反射スペクトルに関するものである。そのためには、赤外全域に亘って放射強度の強い光源が必要で、従来から熱放射体が用いられている。約100μm以下の赤外域にはグローバー、遠赤外域では水銀灯が依然として用いられ、新しい発展はない。波長が広い領域に亘って可変であるレーザーがあれば、理想的な分光系不要の光源になる。現在の所、ある限られた領域に対して、非線形光学効果を利用したものなど各種のものが報告されているが、実用には至っていない。ただ鉛塩系の混晶(Pb1-xSnx Se, Pb1-xSnxTeなど)から成る半導体レーザーは、約3μmから30μm位までの領域をカバーし、市販品もあり、超高分解能スペクトルなどの研究に用いられている⁵⁾.勿論、各種の離散的レーザーは高磁場と組合わされて、遠赤外ESR、サイクロトロン共鳴、磁気共鳴などの共鳴現象に重用されている。また、光励起遠赤外レーザーは、数種の気体分子を用いることにより、遠赤外全域を平均7cm⁻¹の波数間隔でカバーできるので、高純度・高輝度の光源として利用されている。

現在,精力的に研究の行われているシンクロトロン放射光や,自由電子レーザー は,赤外全域をカバーできる高輝度光源になりうるが,まだ大型で設置場所での測 定が行えるだけである.

サブミリ波領域は,不十分な水銀灯のほか,後進波管(BWO)や,固体発振器とその逓倍が用いられているが,優れた光源の研究の待たれる領域である.

2.2 検出器

検出器は、その検出原理から一般に熱型と量子型(これに整流型を加えることもある)に分類される.また、素子の構成から、単素子と多素子(1次元アレイと2次元アレイ)がある.検出器の性能指数としては、波長感度、時定数、NEP(雑音等価パワーで最小の検出パワーを示す)およびこの逆数を規格化したD*などがある.

分光測光には,殆どの場合,単素子検出器が用いられる.検出器も,1950年代の 半導体を中心とする物性研究と結晶育成技術の進歩により,図1に示す高感度な量 子型半導体検出器や極低温ボロメーターが導入され,現在もまだそれらの性能の改 善や新しい検出器の開発が推進されている.例えば不純物半導体検出器については, 初期には全域にGeを母体とするものが用いられてきたが,シリコン技術の進歩によ り約30μm以下はSiを母体とするものに代わってきている.

市販の回折格子分光装置では依然として熱電対が用いられている.フーリエ分光 装置(分光法も含めて以下FT-IRと略する)では,処理する光強度が従来の分光法に較 べ比較的大きいので,感度は他の検出器に較べ低いが,数KHzまでの周波数応答を 持ち,常温で使用でき,取扱いも容易で丈夫な焦電検出器が汎用されている.高感 度を必要とするときは,窒素冷却のMCT(Hg1-xCdxTe)検出器が用いられる.遠赤外

7

では,図1の極低温ボロメーター,不純物半導体検出器が用いられる.

これらの検出器の検出限界は、脊景放射光の雑音で決められる(BLIP: Background limited photodetector). 最近、赤外線天文学が急速に進展し、脊景光も著しく小さい (3Kの黒体放射)宇宙空間での赤外測定が行われている. Ge:Ga(長波長限界120 μ m) やこれに加圧したもの(205 μ mまで延びる)が、新しい不純物ドーピング法の開発な どとも関連して強力に研究され、NEPで10⁻¹⁵~10⁻¹⁷ W/ μ rが、達成されている. こ の場合はプリアンプなどの増幅器にも特別な配慮をしなければならない.

検出器も狭帯域の感度を持ち,そのピーク波長を広い波長域に亘って変化でき る波長同調型のものがあれば,原理的には分光器不要の分光ができる.図1に示 してあるInSb同調型光伝導セルは,高磁場における不純物サイクロトロン共鳴を 用いる狭帯域検出器であるが,従来型に較べ特別な利点はなく実用されていない. 後に述べる半導体の不純物準位の光学的および熱的2段階励起による光伝導も, 磁場によりある波長域に亘って同調型にでき,検出器としての可能性が指摘され ている.最近,精力的に研究されている多重量子井戸構造の検出器は,井戸の幅 や高さによって同調波長を可変にできるバンド型波長感度を持つ光伝導検出器で あるが,まだ今後の研究に待つ所が大きい.

2.3 光学材料

赤外分光は、プリズムによる分光から始まり、図1に示すアルカリハライド、セシュームハライド、アルカリ土類ハライドなどの良質な大きな結晶が育成され、 窓板などの光学材料にも用いられてきた.回折格子分光やFT-IRの進歩と共にプリ ズム分光はすたれたが、ATRプリズムや試料保持基板、窓材などに透過特性に優れ、 耐湿性で整形・加工も容易な光学材料は依然として重要である⁶⁰.

結晶育成技術の進歩と共に,高純度の大きなSiやGeの結晶,CVD法による良質な大口 径のZnS,ZnSe,CdTeなどの結晶が市販され,赤外光学材料として活用されている. ダイヤモンドは,SiやGeと同じ共有性結晶で2音子過程による弱い吸収しかなく屈 折率も比較的低く,全赤外域に透明な優れた光学材料であるが,まだ大きな結晶は 育成されない.強力な赤外レーザー用の窓材としては,米国のプロジェクト研究で 既に吸収係数10⁻⁵ cm⁻¹程度の高純度のものが開発されている.赤外光ファイバーも 銀ハライドやタリュームハライド,カルコゲナイドガラス,重金属フッ化物ガラス が研究されている.宇宙応用には,耐環境特性の優れた材料が研究されている.

2.4 分光装置と測定法

1950年前後から市販されて、赤外分光の普及に大きな貢献をしたプリズム分光装置は、その後回折格子分光装置によって駆逐され、さらに現在はFT-IRが全盛である. FT-IRは、周知のように、同時測光の利点(Fellget advantage)と明るさの利点(Jacquinot advantage)があり, さらにHe-Neレーザー干渉縞で制御されている波数精度の高い利 点もある.市販のFT-IR装置と回折格子分光装置について, 検出器の差なども考慮 にいれた理論的比較でも, FT-IRの有利さが示されている⁷.

また機器は、コンピューターで機能・操作制御され、データ処理されている.これ らのため、従来、不可能か困難であった多くの測定が可能になり、赤外分光の応用 分野は多方面にまたがり多彩になっている⁸¹.

現在,大体4600cm⁻¹から400cm⁻¹までの波数域を測定するマイケルソン型のFT-IRが最も多く市販されている.これらは大別して小型低価格の簡易型(波数分解 $\Delta \nu = 4 \text{ cm}^{-1}$)小型低価格であるが多機能な中級器(例えば $\Delta \nu = 2, 4, 8 \text{ cm}^{-1}$), および高感度・高安定で多機能な高級器($\Delta \nu : 0.5, 1, 2, 4, 8 \text{ cm}^{-1}$)がある.これら の装置は,マイケルソン型干渉計の移動鏡をステップ走査でなく,定速走査する型 で,多数回の積算も容易に行なえる.

さらに,高分解能な機種(△ν~0.002cm⁻¹)や,真空で遠赤外(>10cm⁻¹)まで測定可 能な機種も高価であるが市販されている.また,赤外顕微分光測定を専門に行なう 機種や,干渉部を共有したFT-IRとFT-Raman共用の機種も市販されている.

初期には多くの場合,定型試料に測定が限られていた.即ち,適切な面積・厚さ の平行平面板(透過測定)か,片面が鏡面の試料(反射測定)である.このための整形,研 磨などの前処理が面倒であった.最近は,非定形試料,微小試料,薄膜・表面吸着 種など各種の形態の試料が測定できる種々の附属測定部品が開発され,容易に装置 に挿入できるようになっている.いろいろな極限へ向かっての測定技術の開発・改 良という立場でこれらを簡単に展望する.

(I)より長波長へ

遠赤外域には、分子の回転スペクトルや特色ある振動モード、さらに固体の非常 に多彩な励起によるスペクトルが現れる⁹⁾. FT-IR装置は、現在10cm⁻¹(1 mm)までの ものが市販されている. さらに注意深く自作された針金格子偏光干渉分光装置 (Martin-Puplett型)で2 cm⁻¹(5 mm)までのものが報告され、市販もされているようで ある.約500 μ mから5 mm位の間の領域は、インコヒーレントな光技術とコヒーレ ントな電波技術の境界領域で、光源、検出器、分光法について盛んな研究が行われ ている¹⁰.

(II)より高分解能に

スペクトルの微細な構造の解析には、分解能Δν(cm⁻¹)の小さいことが望ましい. 市販装置では0.002cm⁻¹が得られ、分子分光で振動回転構造や回転スペクトルや電 気双極子禁制遷移などの精密な測定が行われている.固体でもGaAs中のSiの局在 モードの同位元素効果による置換サイトの決定など興味ある結果が得られている. (III)より小さく

微結晶等微小な物体や局所分析の測定など、FT-IRに顕微鏡の導入がルーチンになっ

ている.中赤外域で10 μ m ϕ の空間分解能が得られて多方面に応用されている^m.

FT-IR装置は、既に述べた利点により、高速走査で数十回から数万回の積算が行 える.これにより信号・雑音比がよくなり、例えば、LB膜のモノレーヤーから数 レーヤーの表面層の透過測定が可能になっている.

(V)より薄い層を

薄膜・表面吸着種,界面,表面モードなどの研究が大きな関心を持たれ,FT-IR は有力な手段になっている¹²¹.高感度反射法(reflection absorption spectroscopy : RAS) は,金属面の吸着種や薄膜を測定する手段である.75°~89°の大きな入射角で鏡面 反射させると,入射面に平行な偏光成分は,入射波と反射波が定在波を形成し大き な電場が得られ,通常の透過測定の10~50倍の吸収強度が得られる.試料のついた 鏡面を向い合わせて多重反射させると,この効果は増強されるが,反射するたびに 強度は弱まるので,反射回数は限られる.RASは鏡面に垂直な電気双極子を持つ振 動モードを検出する.また金属面の反射による効果なので,厚い膜には有効でない.

減衰全反射法(attenuated total reflection: ATR)は、高屈折率媒質内での全反射の場合、 低屈折率側の媒質に滲み出るエバネッセント波による吸収を利用する方法である. この方法は内部反射分光法(internal reflection spectroscopy: IRS)ともいわれ、全反 射素子(internal reflection element: IRE)としては、ZnSe, KRS-5, Si, Geなど高屈折 率結晶の三角柱や半円柱の形が用いられている. 試料は、全反射面に密着したり、コート して測定し、非常に多くの物質に適用できる. 侵入深さは全反射角、IREの屈折率 などで変えられ、RASよりは厚い膜が測定できる. 全反射で、反射損失はないので 細長い直方体のIREで多重反射させるとより効果的である. IREの全反射面と試料 面にギャップを置いた配置をOtto配置といい、表面ポラリトンモードなどの測定に用 いられる.

また金属面上の薄膜の発光スペクトルを,面の法線に対して大きな測定角で測定 すると,表面に垂直な振動双極子成分を持つモードが大きな強度で測定される. (VI)不定形物質を

従来,粉末試料はKBr錠剤法やNujol法で測られていたが,最近は拡散反射法 (diffuse reflectance infrared Fourier transform spectroscopy:DRIFT)や光音響法(photoacoustic spectroscopy:PAS)が用いられる.DRIFTは,KCl,KBrの粉末に希釈した試料の拡 散反射を測定する方法で,試料の調整が簡単である.PASは,測定試料を不活性 ガス(ヘリュームやアルゴン)と共に赤外透過窓付きの小室に密閉する.断続した赤 外光を照射すると,物質が赤外光を吸収し,温度が周期的に変化する.これによっ て生じるガスの圧力の変化を高感度マイクロフォンで測定する.この方法は,粉末 のほか,ゴムや皮革や繊維などそのままの形態で測定できるので非常に簡便な方法 である.

(VII)より弱い吸収を

光ファイバーとか赤外強力レーザー(HF2.7 μ m, DF3.8 μ m, CO5.25 μ m, CO $_2$ 10.6 μ m) の窓材など,できる限り吸収の弱い物質($\alpha \sim 10^{-5}$ cm⁻¹)が追求され、そのためのレーザーカロリメトリーなどの新しい測定法が開発された¹³⁾.

現在、ミリ波域でジアイロトロンの低吸収窓材開発が要請されている.

(VII)より微量な不純物を

赤外分光でどれだけ微量な不純物を測定できるかも興味ある問題である.半導体の電子的な浅い不純物準位の測定には光熱イオン化分光法(photo-thermal ionization spectroscopy: PTIS)が有用である.これは遠赤外光でドナー(アクセプター)を基底状態から励起状態へ励起し、ついで熱的にイオン化して自由になった電子(ホール)を光伝導で測定する方法で、光励起のエネルギーの波数に光伝導のピークが出る.ゼロバックグラウンドの測定であるから高感度で、ホール効果と組合わせてGe中の10^mcm⁻³の浅いドナー不純物の検出・同定が行われている¹⁴.

このほかにも,時間分解とかいろいろあり測定法もいろんな面で極限への努力や 新手法の開拓が続けられている.

3. おわりに

予定の枚数をかなり超過したが、赤外分光は市販品の普及と相伴って、非常に多 方面に応用され、またさらなる改良、開発が続けられているが、これらのすべてに 言及することはできない.実際の応用例については、各メーカーがアップリケーショ ンデータ集を発行しているし、また適当な文献を参照されたい^{8,15)}.

近年,レーザーラマン分光も,CCDの導入やFT-Ramanの開発などで急速な進展 をとげている.赤外分光とは相補的な面も多いがよきライバルとして両者の益々の 発展を願いたい.

参考文献

- 1) R.D.Hudson: "Infrared System Engineering", Wiley-Interscience(1969)
- R.D.Hudson and J.W.Hudson: "The Military Applications of Remote Sensing by Infrared" Proc. IEEE,63,No.1,pp.104-128(1978)
- 3) 赤外線技術研究会編: "赤外線工学"オーム社(1991)
 日本赤外線学会誌, 1. No.1, No.2(1991), 2. No.1, No.2(1992)
 三石明善: "赤外線技術概論" 精密工学会誌 56, no.11, pp.1957-1960(1990)
- 4) "Transaction of the Triple Commission for Spectroscopy", J.Opt.Soc.Amer. 52, no.4, pp.746-747(1962)

5) 水谷由宏,水谷郁夫: "半導体レーザー分光応用"分光研究 41,no.5, pp.339-349(1992) R.C.Eng, J.F.Butler, and K.J.Linden: "Tunable diode laser spectroscopy" Opt.Eng. 19,no.6 pp.945-960(1980)

- 6) J.A.Savage: "Infrared Optical Materials and their Antireflection Coating" Adam Hilger Ltd.(1985)
- P.R.Griffiths,H.J.Sloane, and R.W.Hannah : "Interferometers vs Monochromators: Separating the Optical and Digital Advantages" Appl.Spectr. 31,no.6 pp.485-495(1977)
- 8) 化学方面ではAnal.Chem.64 no.12,770R-303R(1992). 一年置きに主な成果とその文献が出ている. 坪内正造,田中誠之,田淵三生(編),赤外・ラマン振動(Ⅰ)基礎と最近の進歩(1983)(Ⅱ)現状と将来の 展望(1983)(Ⅲ)ハイテク時代の基礎技術と応答(1986)南江堂,固体についての文献は三石明善: "赤外 分光と光散乱分光"(実験物理学講座第6巻 桑原五郎編 光学技術第11章 437頁-623頁(1984))

J.R.Izatt : "Far Infrared Science and Technology", Proc.SPIE 666, pp.1-217(1986)
 M.N.Afsar and K.J.Button : "Millimeter-wave Dielectric Measurement of Materials"
 Pros. IEEE 73 no.1, pp.131-153 (1985)

- 10) 阪井清美: "遠赤外分光技術"分光研究 42, no.1, pp.40-61(1993)
- 11) J.E.Katon and A.J.Sommer : "IR Microspectroscopy" Anal. Chem. 64 no.19, pp.931A-940A(1992)
 R.G.Messerschmidt and M.A.Harthcock (eds) "Infrared Microspectroscopy-Theory and Applications." Marcel Dekker. Inc. (1988)
- 12) 末高治: "赤外および可視・近紫外領域の分光学と固体表面情報"分光研究,

31, no.3 pp.195-210(1982)

S.R.Culler, H.Ishida, and, J.L.Koenig: "The Use of Infrared Method to Study Polymer Interface" Ann.Rev. Mater.Sci. 13, pp.363-386(1983)

D.M.Back : "Fourier Transform Infrared Analysis of Thin Film" in Physics of Thin Film 15(Thin Film for Advanced Electronic Devices,eds.M.H.Francon and J.L.Vossen), pp.265-310(1991)

- A.Hordvic: "Measurement techniques for small absorption coeffcient:recent advances" Appl.Opt. 16,no.11 pp.2827-2833(1977)
 - 三石明善: "高出力赤外レーザー窓材の光吸収" レーザー研究 6,no.1, pp.3-15(1978)
- 14) E.E.Haller : "Semiconductor Physics in Ultra-Pure Germanium" Festkorper Probleme 26 pp.203-229(1986),
 E.E.Haller, W.L.Hansen and F.S.Goulding : "Physics of Ultra-pure Germanium" Adv.Phys. 30, no.1 pp.93-138(1981)
- 15) 錦田晃一,西尾悦雄: "チャートで見るFT-IR" 講談社サイエンティフィック(1990)
 錦田晃一,岩本金吉: "赤外法による材料分析" 講談社サイエンティフィック(1986)
 平石次郎編: "フーリエ変換赤外線分光法-化学者のためのFT-IR-" 学会出版センター(1985)

Outline of Infrared Spectroscopic Techniques

A brief outline is given of the recent status of infrared spectroscopic techniques.

After introducing the main properties of infrared radiation and the applications based on them, the practical light sources, detectors and optical materials are discussed. Then the present feature of the Fourier transform infrared spectrometer and its various measuring techniques are described.

陸上生態系における大気温暖化ガスの動態を測る

特/集/論/文 Feature Articles

Measurements of the Atmospheric Greenhouse Gases Dynamics in Land Ecosystems

原菌 芳信*・宮田 明*・三笠 元 Yoshinobu Harazono, Akira Miyata, Hajime Mikasa

【要旨】

大気中の温暖化ガスの濃度上昇が問題になっている.陸上生態系は、水田や湿地でのメタン発生、農耕地における亜酸化窒素の放出など、大気温暖化ガスに深く関与しており、その動態把握は重要である.本論文では、水稲群落上のメタン 濃度の日変化を二酸化炭素濃度と比較しつつ明らかにし、フラックスを評価した. また、人為的な発生源を含む広域的な陸上生態系におけるメタンフラックスを評価し、早春に水田と同レベルのフラックスがあることを示した.さらに、低濃度 メタン測定用の非分散形赤外線分析計を開発し、これにより草地においてメタン の吸収フラックスがあることを明らかにした.

Abstract

Recently, the increasing concentration of atmospheric greenhouse gases has become a problem. Land ecosystems are contributing considerably to atmospheric greenhouse gases through the generation of methane gas in paddy fields and swamps, and the emission of nitrous oxide in arable land, and it is now important to understand the dynamics of land ecosystems. This paper clarifies the daily changes of methane concentrations in wetland ecologies while comparing the concentration of carbon dioxide, and evaluates flux. This paper also evaluates methane flux in wide-area land ecosystems including artificial sources of generation, and shows that there is the same level of flux in early spring as that of paddy fields. Furthermore, this clarifies the fact that there is absorption flux of methane in grasslands.

1. はじめに

温室効果ガスである二酸化炭素(CO₂),メタン(CH₄), 亜酸化窒素(N₂O)などの 大気濃度は年々増加しており,地球規模の気候変動との関連で,吸収源(sink)や 発生源(source)の特定とその強度の把握が重要になっている^{1,2)}. CH₄やN₂Oの赤 外放射吸収能はCO₂の約30~100倍大きいため,その大気濃度が低いにもかかわ らず,大気温暖化への影響が大きい³⁾.これらの発生源には,工鉱業生産活動に 伴う人為的起源のものと,地球の生態系(Earth Ecosystem)自体の営みの過程で放 出される天然起源のものとがある.

* 農業環境技術研究所

河川や湖沼を含む陸上生態系では、光合成による植物へのCO2固定と、植物や 土壌微生物によるCO2放出とがあり、各種生態系毎の収支の正確な把握が求めら れている.また、CH4は嫌気状態の土壌微生物により有機物が分解される過程で 発生し、畑地や草地などでは好気性土壌微生物により分解され、N2Oは窒素化合 物が土壌微生物により無機化される過程で生じる.陸上生態系ではsinkとsourseと が混在するため、多様な生態系毎に地域的変化や季節的変動があり、これらの定 量的な実態解明が強く要請されている¹¹.

筆者らは、陸上生態系における大気温暖化ガスの動態を観測しており、最終的 には地球規模での濃度変化に対する農耕地や林地などの寄与を評価することを目 標としている.以下、陸上生態系におけるCH4濃度の実態とフラックスに関する 結果を示し、現在進めつつある非分散形赤外線分析計(NDIR)を用いたCH4フラッ クス測定について示す.

2. 観測装置及び観測方法

2.1 フラックスの微気象学的な測定方法

自然生態系で観測されるフラックスは、植物群落や裸地面などと大気との間で 交換されるガス(CO_2 , CH_4 , N_2O , $O_3 \alpha E$)や水蒸気などの単位時間単位土地面 積当りの鉛直方向の輸送量である。輸送の向きにより放出または吸収となる。測 定方法としては、 $501 \sim 1 \text{ m}^3$ のチャンバを対象群落にかぶせて内部ガス濃度の 時間変化率から求める小スケールのチャンバ法⁵¹と、植物群落上での濃度勾配か らその気層での乱流拡散輸送量を求める微気象学的方法とがある^{6,7,81}.

微気象学的方法は,植物群落上の2高度Z1,Z2のガス濃度S1,S2と,ガスの 鉛直輸送に関する乱流拡散速度Dを求め,両者の積として(1)式からフラックスF を求めるもので,ある程度の空間で,より自然状態の代表値が得られる特徴があ る.

Dは2高度の風速u1, u2の測定から空気力学的方法(2)式で, また純放射量Rn, 地中伝熱量G, 2高度の気温 θ_1 , θ_2 と比湿q1, q2の測定から熱収支法(3)式に より求めることができる. なお, κ はKarman定数, dは地面修正量, Cp, ρ は 空気の定圧比熱と密度, Q は水の気化潜熱である.

水田など湛水状態では,水深や流入・流出水量に依存する水への貯熱量の評価精 度が低く,熱収支法より空気力学的方法の適用が多い⁹⁾.

2.2 陸上生態系における大気微量ガス濃度の測定

陸上生態系における微気象学的なフラックス測定では濃度勾配の測定精度とD の評価精度が鍵となる.生態系におけるガス濃度は,風速変動や日射強度の変化 に伴って著しく変化するので,平均場における時間平均濃度を把握する事が重要 となる. CO₂については十分な感度の非分散形赤外線分析計(NDIR)が開発されて おり,従来多くの成果が上げられてきた.他の大気微量ガスについては,大気中 の濃度が低く十分な精度で測定できるNDIRはなかった.このため,ガスクロマ トグラフ(Gas Chromatograph, GC)が多用されてきたが,非連続測定であること,分 析試料が少ないことなど,生態系での測定には問題を含んでいる.フーリエ変換 赤外分光光度計(FTIR)による大気微量ガス濃度の測定も可能であり,著者らは CH₄, N₂Oの濃度測定に利用しているが,連続測定という観点からは,NDIRが 望ましい.

なお、ガス濃度の変動(c')と、超音波風速計などにより風速の鉛直成分の変動 (w')を測定することにより、渦相関法を適用したフラックス(F=cw')の測定が可 能である¹⁰¹.しかし、オープンパス型の赤外線濃度変動計が開発されているの はCO₂と水蒸気のみであり、これら以外の大気微量ガスについては、濃度変動を 計測可能な測定器が未開発である.一方、微量ガスやフラックス強度の弱いフィー ルドでの観測では、顕熱や潜熱輸送に伴う密度補正の必要性が指摘されてお り¹¹¹、渦相関法による観測の優位性が弱まりつつある.

2.3 非分散形赤外線分析計の低濃度CH4測定への応用

NDIRはセル中のガス濃度をリアルタイムで検出でき、大気を連続的に吸引し、 適当な時間範囲で平均化することにより、その場の平均濃度を求めることができ る.今回、低濃度で濃度変動が大きい陸上生態系でのCH4濃度を測定するための NDIRを開発した.これは、気象庁綾里観測所で用いられている低濃度測定用の NDIR¹²¹をベースとし、フィールドでの移動測定を可能とした.本装置の外観を 図1に示す.

分析部は試料ガスとCH₄を含まない雰囲気(比較)ガスとの濃度差を測定する差 量式のクロスモデュレーション(流体変調)方式NDIRであり,NDIRの選択性と, 試料ガスの前処理による選択性を組み合わせたところに特徴がある.構成ブロッ ク図を図2に示す.



図1 水稲群落で観測中のフィールド用NDIRメタン 分析計の外観 Overview of the NDIR CH₄ analyzer developed for the measurements in natural ecosystem, such as paddy rice field.



図2 NDIRメタン分析計の前処理部の構成ブロック図 Block diagram showing the treatment part of the NDIR CH₄ analyzer,

試料ガスは加湿された後, CH₄以外の炭化水素ガス(NMHC)を触媒(NMC)によ り酸化除去し, さらに電子冷却器により露点温度2.5℃に除湿されて一定流量で 分析部へ導入される.分析後のガスは加湿後,全炭化水素ガス(THC)を触媒(CAT)



図3 非メタン炭化水素酸化触媒(NMC)の酸化除去 効率例 Performance of the catalyzer (NMC) to remove non-methane hydrocarbon used. により酸化除去し、さらに電子冷却器で除湿されて比較ガスとして一定流量で 分析部へ導入される.

NMCの酸化効率の特性を図3に示す.NMCはNMHCを完全に酸化除去させる 温度条件ではCH4が10%程度損失するが、エタン(C2H6)が50%程度除去される 温度ではCH4の損失を抑えることができる.50%にまで除去されたC2H6の干渉 については、NDIRの選択性により無視できる範囲に抑えることができる.その 他の干渉成分についても、比較ガスとして試料ガスと同一温度に除湿しCH4以外 のベースを試料ガスと同一としたものを用い、差量測定すること、干渉補償型 NDIR方式であることなどにより、無視できる範囲に抑えることができる¹³⁾.

また、一定時間毎に2種の校正用標準ガスを導入し、ドリフトをチェックし、出 力値を補正可能とした.

これにより、実験室環境下で、測定レンジ0~1/2/5/10ppm、最小検出感度 10ppb以下を達成できた.なお、ここで示した最小検出感度とは、2分間隔で 25回サンプリングしたデータの標準偏差(σ)をノイズとし、その2倍の値(2 σ) を最小検出感度とする定義に基づいた測定結果である.

本装置を用い,水田及び草地で観測を実施し,陸上生態系におけるCH4フラックス測定に関する問題点を検討した.

項目 測定高度(m) 奘 置 メタン濃度 1.8, 0.5 赤外線メタン計(堀場製作所, GA-360E) 二酸化炭素濃度 赤外線CO2計(富士電機, ZFU1DE2) 18 05 オゾン濃度 紫外線吸収式オゾン計(Dasibi型) 1.8. 0.5 (ダイレック, 1006-AHJ) 通風乾湿計(白金測温抵抗体 100 Ω) 乾球温度, 湿球温度 3.4, 0.6, 0.5 風向 矢羽型風向計(牧野応用測器, VFO-16) 3.5 水平風速 3.4, 1.8, 1.0, 0.5, サーミスタ風速計(本田工業, GeY-10) 0.2 全天日射量 1.2 熱電堆式日射計(EKO, MS-62) 反射日射量 1.2 熱電堆式日射計(飯尾電機, S-SR2) 正味放射量 1.2 通風式放射収支計(EKO, MF-11) 地中熱流量 -1cm 熱電堆式熱流計(EKO, MF-9) 地温 -5cm, -10cm 白金抵抗測温体 100.0

2.4 フィールド観測の概要

フィールドでの観測項目と測定器配置例を表1に、観測状況を図4に示す.

表1 フィールドでの大気温暖化ガス濃度の測定時の微気象観測項目と測定高さ Observed elements and setup conditions of equipment for the measurements of atmospheric greenhouse gases dynamics in the natural ecosystem. 図4 牧草地における大気温暖化ガス濃度と微気象観測の様子 Overview of greenhouse gasses measurement and micrometeorological measurements in the land ecosystem.

観測は、卓越風向に対して十分な吹走距離が得られる広い場所で実施し、高さ4mの観測用ポールを建て、群落直上および群落上0.4~0.7mの2高度に空気の採取口を、これを含む5高度に風速計および日射計、通風乾湿計などを配置した. 両高度の試料空気は、テフロン・チューブでNDIRに導入し、2分毎に電磁弁の 切り替えて2高度の濃度を測定した.比較のため、同じサンプリング経路より導入した試料空気のCO2濃度とO3濃度を測定した.なお、1992年夏季までのCH4濃 度測定では、空気採取口から吸引した空気を1~2時間毎に15~30分間テフロン バッグ(テドラ製)に採取し、これを実験室へ持ち帰りFTIRやGCで測定した.

3.結果及び考察

3.1 水稲群落上におけるCH4濃度およびフラックスの特徴

水稲群落上で観測したCH4濃度の日変化を図5に示す.静穏な大気が安定状態*1の場合には、夕方から濃度が上昇し早朝に最大となり2ppm以上の高濃度となった後、日射強度の増大に伴って日中のレベル(1.7~1.8ppm)に低下した.一方、夜間の風速が大きく大気が中立状態の場合には、夜間から早朝に顕著な濃度の増大は認められなかった.

CH4濃度の上昇は水田からのCH4放出を示しているが,地表付近の大気のCH4 濃度には風速の影響,すなわち,大気の拡散による影響が大きいことがわかる. CO2濃度の日変化では,日中は光合成による吸収があり,夜間は呼吸による放出 があるため,日変化に対して生態系が能動的であるのに対し,CH4の場合は,大 局的には早朝に極大,午後に極小という日変化傾向であるが,大気安定度に依存 した受動的な日変化と言える.

水稲群落直上の2高度間のCH₄の濃度差の日変化を図6に示す.ここで,正の 濃度差は群落から大気へのフラックスに対応する.図6では,時間的にばらつき があるが,濃度差は日中は小さく夜間に大きくなる傾向が認められ,拡散の影響 が大きい.水稲群落上での濃度勾配の最大値は225ppb/mで,生育中期に観測さ れた.濃度分析にはGCを用い,1~2時間に10分間のサンプリングであったこ と,分析試料が0.5mlと少ないことなどのため,図6に示したように濃度勾配の 測定値にばらつきが生じたと考えている.



図5 水稲群落上のCH₄濃度の日変化 Daily variations of CH₄ concentrations over a paddy rice canopy under both stable and neutral atmospheric conditions.

水稲群落上の濃度勾配とその時刻の拡散速度を気象条件から求め、(1)式により 各時刻毎のCH4フラックスを評価した.フラックスの最大値19mg/(m²h)は、水稲 の生育中期に観測されたが、測定時刻毎のばらつきが大きかった.図7に昼間と 夜間に区分した平均フラックスを示す.中干し後の8月中旬には、フラックスは ほぼ0になり、その後湛水状態になると再びCH4フラックスが増大した.このよ うな水稲の生育や圃場管理に伴うフラックスの季節的変化の傾向は、チャンバ法 による観測結果と一致している¹⁴).昼間のフラックスは、中干しの8月下旬を除 き、1.8~7.6mg/(m²h)の範囲である.また、夜間は大きい濃度勾配であるが拡散 速度が小さいため、フラックスは昼間に比べて小さい.日積算フラックスは季節 的に30~140mg/m²に変化した.水田でのCH4フラックスは土壌条件や施肥、栽培 管理法によっても異なるが、この値はIPCCによる見積¹¹より低い値である.

1.9 July 25-26,1988 1.8 ∆CH₄(ppm) (mqq) 1.7 0.10 0.05 1.6 CH 0.00 -0.05 ^{__}6 12 0 12 18 18 6 time of day(h)

図6 水稲の生育が旺盛な時期の群落上のCH₄濃度と群落直上2高 度間(鉛直距離0.4m)の濃度勾配の日変化(1988年7月) Daily variations of CH₄ concentration and gradient of the concentration over paddy rice in its maximum growing stage.

*1 安定状態 地面から上層へ向かって気温が高くな る順勾配の状態で、低温で密度の高い 空気が下層にあるため、大気が安定と なる。



図7 水田における日中と夜間のCH₄フラックスの季節変化 Seasonal change of CH₄ flux over a paddy rice field.





3.2 広域的なフラックスの評価

農業環境技術研究所(農環研)の微細気象観測露場(150m×100m)のほぼ中央に設置された観測塔で,高さ25mと1.5mの2高度のCH4濃度ならびに微気象要素を測定した.周囲は畑地,水田,林地等が混在して分布しており,観測塔での観測値は半径2~4kmの陸上生態系の平均的ガス濃度の状態を代表する.

夜間のCH4の濃度増加率と平均風速の関係を図8に示す.風速が1m/s以下の 場合は30ppb/hを越える濃度増加であるが,風速が1m/sを越えると濃度増加率は 10ppb/h以下になり,風速の増加に伴い低下している.風速が低く境界層大気が 安定な静穏夜間には,安定層全体をひとつのチャンバとみなすことにより,簡単 な1次元定常モデル(ボックスモデル)を用いて,広域的なCH4フラックスFoを 評価できる¹⁵⁰.地上におけるCH4濃度の増加率をAoとし,安定層の上端(高さH) におけるフラックスが0で,安定層内の高度zにおける濃度増加率A(z)は高さと ともに直線的に減少すると仮定すると,Foは次式で求められる.

$$F_0 = 0.5 A_0 (pM/RT) H$$
(4)

pは気圧, MはCH4の分子量, Rは気体定数, Tは気温である.

微気象学的にフラックスが得られている水稲群落について,このモデルを適用 して比較した結果を**表2**に示す.

安定層の高さHとして典型的な値である50~200mを用いた.両手法間の評価 値には差があるが、微気象学的方法による拡散速度の評価精度は夜間低風速時に 日中より低下することを考慮すると、このモデルで求められた値は妥当な範囲と いえる.同様に、CO₂の濃度増加率5.7ppm/hの場合に適用すると、0.26~1.0g/m²h) のCO₂フラックスが得られた.この値は微気象学的に求めたCO₂フラックスとよ く合致し、この時期の水稲群落の呼吸量としても妥当な値である.

大気が安定な夜間に観測塔で測定されたCH4濃度増加率から求めたフラックス は、2~3月の静穏夜間に、夏季の水田からのCH4フラックスに匹敵する値と なった.周辺の農耕地土壌は乾燥状態であり植物活性も小さい時期に相当量のフ ラックスが観測されたことは、陸上生態系内に存在する人為起源や家畜などによ る発生量が相当大きいことを示唆する.

3.3 フィールドにおける濃度変動とCH4の吸収フラックス

2.3節に示した非分散形赤外線CH4分析計を用いて,農環研観測露場(草地)で測定した結果を図9に示す.地上高0.3mと1.7mの2高度の試料空気を常時分析計

Date	Nocturnal methane flux (mg/(m ² h))		
Dale	1-dimentiona model	Micrometeoro- logical method	
June 29, 1988 Sep. 9, 1988 July 10, 1991	0.55 - 2.2 0.54 - 2.2 0.56 - 2.2	0.45 1.56 0.34	

表2 空気力学的方法と境界層ボックスモデルに より求めた、大気が安定な静穏夜間のCH4 フラックス

Comparison of nocturnal methane fluxes evaluated in a stable calm condition by means of both the one-dimensional box model and the micrometeorological method. まで導入し、2分毎に電磁弁を切り替えることにより2高度のガスを分析した 結果である.同じ試料空気を CO_2 分析計でも測定しており、図中には CH_4 濃度と CO_2 濃度の経時変化と、風速、風向変化を示している.



図9 日没後の草地上0.3mと1.7mのCO₂濃度とCH₄濃度の経時変化 (地上0.3mと1.7mの試料空気を2分毎に切り替えてNDIRで分析) Change of CO₂ and CH₄ concentrations and wind conditions over grass. Fluctations of the both concentrations show the difference between the two heights (0.3m, and 1.7m above the ground surface) measured by the switching on every two minutes after sunset.

上下2高度のCH4濃度は4分周期の波動として捉えられ、風速が1m/s以下の 場合には振幅が増大し、2高度間の濃度差が拡大したことが明瞭である。日没後 のため、CO2濃度は地上高0.3mのほうが1.7mより高く、植物や土壌微生物の呼吸 で発生したCO2が地上から大気へ放出され、上向きのフラックスとなっている。 CH4とCO2の濃度変動を比較すると、CO2濃度が極大値の時にCH4濃度は極小値 を示しており、CH4濃度変動の位相がCO2のそれとは半周期ずれている。これは、 CH4の濃度勾配では、CO2とは逆に、地上1.7mのほうが地上0.3mより高いこと、 すなわち、CH4フラックスは大気から地上へ向かう吸収フラックスであることを 示している。草地におけるCH4の吸収フラックスは、草地の土壌中や植物に寄生 する好気性微生物によりCH4が分解消失し、大気中のCH4が拡散により地表面へ 輸送されていることを示す。このような、自然条件下でのCH4の吸収フラックス は、今回開発したNDIR方式の移動型CH4分析計により初めて観測された事実で ある。

3.4 CH₄発生源近くの牧草地におけるCH₄濃度とフラックス

牛が放牧されている牧草地(草地試験場,栃木県西那須野町)における11月上旬 の測定結果を図10に示す.日中は2~3m/sの風が吹き,境界層は弱い不安定か ら中立状態,16~17時に日没により安定状態となった後再び風が強まり中立と なった場合である.牧草地には寒地性牧草が植えてあり,早朝にはかなりの結露 が認められたが,土壌が湛水状態になることはなく,水田土壌のような嫌気性土 壌微生物によるCH4発生はないと考えられる.しかし,牧草地には牛の糞尿が相 当量排出されており,また糞尿の集積場所も点在することから,これらからCH4 が放出されることは十分に考えられる状況である.





比較のために CO_2 濃度の時間変化も図10に示しているが、日中は牧草による CO_2 吸収のため、高さ1.8mと0.5mとの間に3~5ppmの濃度勾配が生じ、日没近 くまで大きい変動は認められない、日没後は牧草と土壌微生物の呼吸により逆の 濃度勾配となり、風速が変化したことから、 CO_2 濃度も変動が大きくなった.

distributed

CH4濃度は風速が比較的高かった14~15時に3~5ppmの高濃度となり,最高 8ppm以上を記録した.また,17時頃再び高風速となった時間帯にも上昇してい る.日中の平均濃度はつくば市での観測値より高く,時間的な変化が著しいこと は,周辺の糞尿集積場所や観測地点の北約2kmにある養鶏場など,CH4の発生 点源と推測される場所からの移流による影響と判断された.

高さ1.8mと0.5mとの濃度勾配では、CH4濃度が時間的に大きく変化しない場合には、大気から地表へ向かう弱い濃度勾配が観測され、下向きのフラックスであること、牧草地がCH4のsinkになっていることが確かめられた.この時の濃度勾配は大気のCH4濃度が高いほど顕著であり、牧草地のような畑地土壌の生態系では高濃度のCH4が移流してきた場合に、吸収フラックスが増大することを示唆する.一方、CH4濃度が大きいトレンドを持つ場合には(図10の15時前後)、今回の測定方法では2高度の濃度勾配を把握できない.したがって、CH4の発生源や吸収源が混在する陸上生態系での動態把握には、2高度の試料空気の濃度差を直接測定する差動型分析計(Differential Type)による観測が有効であり、測定器の開発が望まれる.

発生点源からの放出により高濃度のCH4ガスが付近一帯に停滞し高濃度となる こと、そのような場合の濃度勾配が大きくなることなどは、GCやFTIRを用いた 従来の不連続測定では把握し難い現象であり、NDIR方式によるフィールドでの 連続測定がCH4の動態に関して新たな知見をもたらすと言える.

4. おわりに

陸上生態系における大気温暖化ガスの動態は、植生状態により大きく異なり、 短時間(小)スケールでは気象条件の影響が大きく複雑である.長時間(大)スケール では、緯度や気候区分、地形、土地利用状況などによる差異と季節変化が重畳す る.大気温暖化ガスの濃度上昇に関わっているのは、水田や湛水土壌からの発生 や家畜の糞尿による陸上生態系のみならず、埋立地や廃棄物処理場など人為的発 生、石炭石油の採掘に付随する放出など、様々である.大気温暖化ガス濃度の上 昇を抑制するには、それぞれの発生源強度を正しく評価し、それぞれの寄与を明 らかにすることが重要である.特に、陸上生態系では放出源と吸収源が混在する ことから、その把握は困難であっても重要である.これらにより、個別に効率的 な抑制対策などが検討できよう.今求められているのは、より正しい実態把握で あり、そのための手法と技術の開発と改善である.

筆者らは,種々の生態系における観測を継続中であるが,精度の高いフラック ス評価には、フィールドで信頼度の高いデータが取れる分析計の普及が必要であ る.NDIRを用いた本観測研究により、CO2の場合と同程度のCH4濃度変化や濃度 勾配を測定できることが実証され、種々の陸上生態系でのCH4濃度やフラックス の動態把握に有効であることが確かめられた.しかし、観測時の風速が低い場 合,拡散速度を精度よく評価できず、多様な植生状態と気象条件で精度の高いフ ラックスを評価するには、分析計自体の分解能の向上の他、分析計の時間分解能 と適合するサンプリングと解析手法を適用するなど、測定上の改善にも研究の余 地が残されている.様々な気象条件下でのフラックスの定量的把握には、評価手 法自体の理論的検討が必要と考えている.

引用文献

- Houghton, J.T., Jenkins, G.J. and Ephraums, J.J. Eds., "IPCC Scientific Assessment : Climate change", p365, Cambridge Univ. Press, Cambridge, U.K. (1990).
- 2) 気象庁気候問題懇談会"温室効果気体の増加に伴う気候変化II", (1990).
- 3) 公害資源研究所地球環境特別研究室編"地球温暖化の対策技術"オーム社,東京, 329p (1990).
- (1991).
 (1991).
- 5) 井上君夫・陽捷行"草地土壌から発生する亜酸化窒素のフラックスの測定",農業気象, 41,145-149(1985).
- 6) 青木正敏 "農業気象の測器と測定法:光合成と呼吸の測定法",日本農業気象学会関東 支部編,農業技術協会,273-315 (1988).
- 7) 原薗芳信・山田千絵・西沢利栄"ダイズ群落上の乱流輸送特性", 筑波大学水理実験センター報告, No.16, 13-25 (1992).
- 8) Thom,A.S, "Vegetation and the atmosphere : Momentum, mass and heat exchange of plant communities" ed by J.L.Monteith, Academic Press, London, 57-109 (1975).
- 9) Denmead, O.T. and Bradley, E.F. "The Forest-Atmosphere Interaction : Flux-gradient relationships in a forest canopy.", eds. Hutchison, B.A. and Hicks, B.B., D. Reidel Publishing, 421-442 (1985).
- Ohtaki, E. "Application on an infrared carbon dioxide and humidity instrument to studies of turbulent transport", Boundary-Layer Met., 29, 85-107 (1984).
- Webb, E.K., Pearman, G.I., and Leuning, R. "Correction of flux measurements for density effects due to heat and water vaper transfer", Quart. J. Roy. Meteorol. Soc. 106, 85-100 (1985).
- 12) 青木剛, "大気中メタン・一酸化炭素濃度観測システム", Readout, No.3, 85-90 (1991).
- 13) 今木隆雄·三笠元 他, "大気中のCH4濃度測定装置", 実開平4-3346号(1992).

- 14) Yagi and Minami "Effect of organic matter application on methane emission from some Japanese paddy fields", Soil Sci. Plant Nutr., 36(4), 599-610(1991).
- 15) 高田久美子・村松久史"大気中メタンの季節変化及び日変化の観測と解析",京都大学 防災研究所年報,32(B-2),231-247 (1989).



原菌 芳信 Yoshinobu Harazono 農業環境技術研究所 気象特性研究室室長 農学博士



宮田 明 Akira Miyata

農業環境技術研究所 気象特性研究室



三笠 元 Hajime Mikasa (株)堀場製作所

製品開発部 課長

HPLC分離/ピンポイント濃縮/顕微FTIRによる 界面活性剤の高感度検出と同定法

特/集/論/文 Feature Articles

Determination of trace amount of non-ionic surface active reagent by HPLC with micro-FTIR using pin-point condensation technique ---High sensitivity detection and HPLC separation method for polyethylene glycol alkyl ether and polyethylene glycol alkylphenyl ether ---

> 礒 節子*・池田 昌彦 Setsuko Iso, Masahiko Ikeda

【要約】

ODSを分離カラム、アセトニトリルを溶離液としてポリオキシエチレングリコ ール(POE)系非イオン界面活性剤を分離した.POEアルキルエーテルはRI検出器 で100ppm,POEアルキルフェニルエーテルはUV検出器で5ppmが限界であった.溶 出液をフッ素樹脂コーティングした鏡面金属板に滴下すると、溶媒の蒸発にとも ない約2分後には局所に集中し、液滴の外径は滴下直後と比較し1/100程度になり 濃縮される.この残渣を顕微FTIRで反射測定すると赤外スペクトルが得られる.アセ トニトリル中の不純物はHPLCポンプの直後にODSカラムを設置することにより 減少し、POEアルキルエーテルとPOEフェニルエーテルとの判定限界が100倍改 善された.

Abstract

POE non-ionic surfacants were separeted by normal (nonreversed)-phase high-performance liquid chromatography (HPLC) using ODS colume and acetonitrile as elutant. Polyethylene glycol alkyl ether (AE) and polyethylene glycol alkylphenyl eth-er (APE) were determined by HPLC with RI detector down to 100ppm, with UV detector down to 5ppm respectively. Pin-point condensation technique using perfluorated polymer film on SUS mirror was used to elution from HPLC. Spectra of residua were measured by microscope/FTIR in the reflection mode. Inpurities of acetonitrile were removed by ODS colume which is located between pump and sample injection port. This method improved 100 times to ascertain the identify of AE and APE.

1. はじめに

近年,エレクトロニクス業界では,従来のフロン洗浄から,代替方法としてポリ オキシエチレングリコール(POE)エーテル型非イオン界面活性剤の使用が進んでいる. POEエーテル型非イオン界面活性剤には,POEアルキルエーテル(AE)と,POEフェ ニルエーテル(APE)がある.APEは,河川や湖沼などの水中では,AEに比べ微生 物によって分解されにくいことが分かっている^{1,2)}.これらの界面活性剤は,使 用後に排水として放流するときには何らかの排水処理が必要となる.この排水処 理システムは,界面活性剤の種類を同定し,最適条件で処理できるよう設計しな ければならない.すなわち,AEあるいはAPEの判定と,それぞれの定量分析が重要 となる.

* オルガノ株式会社

ところで,現在工場排水中の非イオン界面活性剤の試験方法は,JIS K 0102に 規程されているが,この方法ではテトラチオシアナコバルト(II)酸アンモニウム 溶液を用いており,非イオン界面活性剤の分子中のオキシエチレン鎖(モル付加 数)の違いや側鎖の種類により吸収感度が異なる³⁾ために,未知物質の種類によって は正しい定量分析が困難である.

高速液体クロマトグラフィー(HPLC)で非イオン界面活性剤を分離し定量分析 する方法がある.この方法は、まず官能基の確認のための定性分析を行い、次に 定量分析を行うため煩雑である.また、ppmレベルの微量の定性分析に必要な標 準物質の選択のための一般的な方法はまだ確立されていない.

構造が既知の非イオン界面活性剤の定量分析を行うときは、紫外線の吸収帯を もたないAEに対しては、水酸基を誘導体化した後、逆相HPLCで分離して紫外線 検出する.一方APEは、順相HPLCで分離した後、紫外線吸収と蛍光で検出する ことにより、1ppmまでの定量分析が報告されている⁴⁾.

今回筆者らは、POE系非イオン界面活性剤混合物を逆相HPLCで分離し、その 溶出液を筆者らが先に開発したピンポイント濃縮法^{5.6} で処理・濃縮し、残渣を 顕微FTIRで赤外線スペクトルを測定することにより、1ppmレベルのAEとAPEを判 別する技術を開発した.

本稿では、1ppmレベルのAEまたはAPEをHPLCで定量分析をする前に必要と なる標準物質の構造に関する情報を、確実かつ迅速に得る方法を検討した結果を 報告する.

2. 方法

2.1 試薬

モル負荷数とHPLC溶出時間(リテンションタイム)の関係を求めるための試薬 には、東京化成(株)製の特級試薬、POEラウリルエーテル(C₁₂)、POEオレイルエー テル(C₁₈)、POEオクチルフェニルエーテル(C₈)、およびPOEノニルフェニルエー テル(C₉)を使用した.またAEとAPEのリテンションタイムの検討には、同じく東 京化成(株)製の特級試薬、C₁₈とC₉ 0.1gを500mlの精製水に溶解し(200ppm)、実験 にはこれらを適宜希釈し使用した.また溶離液は、和光純薬の高速液体クロマト グラフィー用アセトニトリルを使用した.

2.2 装置

液体クロマトグラフィーは東ソー社のCP-8000で、検出器はUV-8000および RI-8000、カラムはInertsil ODS-2(4.6mmi.d.×250mm, 5m)を使用した.またプレカラ ムはTSK ge1 ODS-80TM(3.2mmi.d.×15mm)とし、溶離液濃縮用サンプラーはマイク ロニクス(株)のピーク自動検出機能付きX-Yステージを使用した.X-Yステー ジの移動距離は、X軸が60mm、Y軸が60mm、停止精度は50µmで、スプリット 比連続可変機構及びサンプリングノズル下降機構付きである.サンプリングプ レートは50mm×50mm×3mmのステンレス板の片面を研磨し、その上にフッ素樹脂を 100nmの厚さにコーティングした.FTIRは堀場製作所製の顕微専用 FT-530 で、 カセグレン対物鏡は×25を使用した.固相抽出はWatersのSet-pak tC₁₈を用いた.

2.3 フッ素系樹脂フィルムを用いたピンポイント濃縮

溶液中の有機物を赤外分光分析で同定するためには、従来から溶媒除去について数多くの方法が検討されてきた.溶媒1 μ 1は、球状にすれば直径約1.2mmとなるが、鏡面研磨した金属板に滴下すると、アセトニトリルでは約3mmに広がる.滴下後溶媒の蒸発は全体的に始まるが、溶質は薄状の数 μ m~+数 μ mの無数の小さな島となり、直径3mmの環状残渣として残る.非晶質フッ素系樹脂フィルムをコーティングした鏡面金属板上に100ngのトリトン溶液を滴下すると、図1に示すように、フッ素樹脂と溶液の接触角が大きいために、滴下直後の液滴の大きさは3mm~5mmとなるが、溶媒の蒸発にともない液滴の外径は小さくなり、最終的に直径約100 μ mの半球状態に凝集・濃縮される.

従来得られる最も薄いポリテトラフロロエチレン(PTFE)製フィルムの厚さは 12µmであり、1200cm⁻¹と1150cm⁻¹付近にCF2対称および逆対称伸縮振動や、 C-C伸縮振動による非常に強い吸収を示す.従って、このフィルム上に形成され た物質の透過または反射スペクトルを測定することが困難であった.今回採用 した厚さ0.1µmアモルファスフッ素樹脂フィルムは、フィルム自体による吸収 が小さく、750cm⁻¹~4000cm⁻¹の範囲のスペクトルを測定することが可能となっ た.

2.4 測定

液体クロマトグラフィーでは、試料100μ1を注入し、100%のアセトニトリル を溶離液として1ml/nの速度で分離し、UV検出器の次にRI検出器を取り付けてピ ークを検出した.UV検出器の測定波長はAPEの最大吸収波長である280nmである.検 出器からでてくる溶離液を1/10に分流し、30秒間隔でサンプリングプレートに滴 下した.X-Yサンプラーは30秒ごとに6mmずつ移動させた.サンプル注入後 15分間で30回のサンプリングを行った.図2にサンプリングシステムのブロック図 を示す.サンプリングしたプレートをFT-530のステージに設置し、マスクサイズ 10μm×10μmに限定し、100回の積算を行って赤外線反射スペクトルを測定した.









1 μ m of Triton with a concentration of 0.1 μ l/mL in (\bigcirc) water, (\bullet) water at 60°C, (\square) methanol, (\triangle) acetonitrite on perfluorated polymer film and (\bigcirc) water on a SUS plate.



ルフェニリェーテル (AE) 100ppmの混合 物の典型的なクロマトグラム Typical chromatogram of mixture of polyethylene glycol alkyl ether (AE)100 ppm and p-polyethylene glycal alkylphenyl ether (APE) 100ppm

(A) : RI Detector, (B) : UV Detector, (1) APE, (2) AE



A: AE [R-O(CH2CH2O)nH] B : APE [R- φ -O(CH2CH2O)nH]

3. 測定結果と考察

3.1 EOモル付加数とHPLC溶出時間

親油基であるアルキル鎖と親水基であるエチレンオキサイド(EO)を含むPOE系 非イオン界面活性剤は、アルキル鎖とEOモル付加数の違いによって、HPLCでの 保持時間が変化した(図3).

C12とC18はいずれもAEである. C18の溶出時間は、EOモル付加差が10につき約30 秒の割合でが早くなった. C12については、C18と同様のEOモル付加数の異なった 試料についての検討はできなかったが、C18を基準とする場合、アルキル基一個 について約1分間溶出時間は早くなったことから, EOモル付加数の増加にとも ないC18と同様に変化するものと推定される.

一方, C₈とC₉はいずれもAPEである.C₉の保持時間は、EOモル付加数の違い による差異は少なく殆ど同一であるが、AEと同様アルキル基の数とともに変化 した. 市販の界面活性剤の親油基には分布があるため、クロマトグラムの保持時 間だけでPOE系界面活性剤の種類を決定する事が困難である。

3.2 UVとRIを検出器としたクロマトグラム

図4に標準物質としてC18とC9をそれぞれ100ppmを含んだ混合物を注入して得 られるクロマトグラフを示す. UV検出器では、注入約5分後にC₉のピークだけ が現れている.一方RI検出器では、注入約5分後にC₉が、約11分後にC₁₈による 小さなピークが検出されている. RI検出器の検出限界は、ベースラインのノイズ や不純物の影響が現れて、C18とC9はそれぞれ20ppmと100ppm程度となる。UV検 出器の検出限界はCoで約5ppmであった.

3.3 溶離液のピンポイント濃縮/FTIRによる同定

POE系界面活性剤の赤外スペクトルは、図5に示すように、APEにはベンゼン 核特有の1600cm⁻¹と1500cm⁻¹付近に2つの吸収帯がみられ、AEと容易に判別で きる.

C18とC9それぞれ1ppmの混合物をHPLCに注入し、溶離液をX-Yサンプラー でサンプリングし、ピンポイン濃縮後残渣をFT-530で測定した.注入約5分後の フラクションとC9単体の赤外スペクトルを図6に示す.また約11分後フラクション とC18単体のスペクトルの比較を図7に示す.これらのスペクトルが一致してお り、5分後のフラクションがCoであり、11分後のフラクションがCosによるもの であると判定できる.

1ppmのC₁₈とC₉をHPCLに注入し、そのピークトップの溶出液をピンポイン ト濃縮すると、最終径が約20µmの一つの球状の残渣となり、5回の再現精度 はCV値で約3%であった.またC18のピンポイント濃縮残渣を10µm×10µmに 視野を絞って中心部の赤外スペクトルを測定すると、1150cm⁻¹の吸光係数は約

Infrared absportion secptrum of AE and APE 0.8となった.しかし、一つの溶出ピークを溶出開始から終了までの間を順次サ ンプリングし、それらをピンポイント濃縮して赤外スペクトルを測定した.それ らの吸光度プロファイルは、HPCLと比べてなめらかでなく、凹凸したものとなった. この原因は、試料が球状で濃度によって半径が異なり、顕微FTIRで測定すると、 光軸上における光学的厚さが変化し、さらに光軸の中心に試料を再現性よく設置 することが困難なことなどである.

3.4 溶離液中の不純物の影響

溶離液であるアセトニトリルに含まれる不純物は, PPMレベルの微量測定の さいには大きな妨害原因となる.アセトニトリルを蒸発させた残渣つまり不純 物は,テトラヒドロフランに可溶性であるため,ODSのプレカラムをポンプの 直後に取り付けて除去した.1mlのアセトニトリルを直接ピンポイント濃縮した ときと,ODSカラムで不純物を除去した後の残渣の赤外スペクトルを図8に示 す.不純物の除去処理により,2800cm⁻¹付近のCHに由来の影響は約1/20に低減 した.

3.5 実際試料への応用

Sep-pak tC₁₈を固定充填剤とした吸着カラムを、メタノール5mlと水10mlでコン ディショニングを行った.このカラムに工場排水試料50mlを流し、無機イオン などの不純物を除去したのち、100%のアセトニトリル2mlで固相抽出した.こ の抽出液を100µlだけHPLC注入したところ、UV検出器には5.04分後にピークが、ま たRI検出器には5.22分後の大きなピークと7.67分後に小さなピークがあるクロマト グラムが得られた.図4に示すように、AEのリテンションタイムは11.55分程 度であったが、実試料のリテンションタイムは7.67分になった.この原因は、標 準物質としてアルキル鎖がC₁₈、モル負荷数10のものを用いたためである.

一方,図3ではアルキル鎖が変化するとリテンションタイムも変化することを示 している.実際試料のリテンションタイムが7.67分であることから,実際試料は C18以下であることが推定できる.また,赤外スペクトルから,5.22分後のピー クはAPEで,7.67分後のピークがAEと判定することができた.UV検出器とRI検出 器のピーク出現時間に差異がある原因は,UV検出器とRI検出器間の空間容量によ るものと考えられる.

4. まとめ

FTIRとHPLCを組み合わせ、HPLCの溶離液の赤外スペクトルから物質の同定 を行い、HPLCの標準物質の選択のための新しい方法を検討した.本方法を、工 場排水中に含まれるPOE系非イオン界面活性剤を、逆相HPLCで分離し、ピンポ イント濃縮し、顕微FTIRによる赤外スペクトル分析に応用した.AEとAPEが混 合している試料に対しては、最小1ppmまでの定性が可能であった.これはHPLCの UV検出器による定量限界と同等であり、HPLC分析における標準物質の選定に は有効な方法である.従来から行われているHPLCの溶離液を、FTIRを用いた拡 散反射法⁶⁾でStahl's色素試験溶液の分析を行った場合に比べ、30倍以上定性能力が 向上した.

今後の課題は、固相抽出による前処理を行ってさらに低濃度の定性が可能と すること、定量精度向上のために、ピンポイント濃縮の最終径の一定化を図る こと、さらに、HPLCで分離された近接ピークが一つの液滴としてピンポイント濃 縮サンプリングされないよう分解能を維持することなどである.



 (A): Infrared spectrum of 10 µg of APE after eluation from HPLC collected on perfluorated polymer on SUS mirror
 (B): Reference spectrum of 10 µg of APE



polymer on SUS mirror (B) : Reference spectrum of 10 μ g of AE



スペクトル Infrared spectrum of residual in acetonitrile

> (A) : Residua of HPLC grade acetonitrile in 1ml (B) : Residua of acetonitrile in 1ml eluated from ODS pre-column

参考文献

- 1) 伊藤伸一, 内藤昭治, 畆本力:衛生化学, 33, 416 (1987).
- 2) 伊藤伸一, 内藤昭治, 畆本力:衛生化学, 34, 424 (1988).
- 3) 三浦恭之, 鈴木裕子, 長谷謂真人, 康 智三: 分析化学38, T15 (1989).
- 4) M.Kudo, H.Ozawa, S.Fudano and K.Tsuji: Journal of Chromatography, 287, 337 (1984).
- 5) M.Ikeda and H.Uchihara: Applied Spectroscopy, 46, 1431(1992).
- 6) D.Kuehl and P.Griffiths: Journal of Chromatographic science, 17, 471 (1979).



礒 節子 Setsuko Iso

オルガノ株式会社 総合研究所分析センタ主任 環境計量士



池田 昌彦 Masahiko Ikeda

(株)堀場製作所 分析センタ副部長 理学博士,技術士 特/集/論/又 Feature Articles

反射スペクトルのクラマース・クローニッヒ変換による解析

Analysis of Reflectance Spectra by Kramers-Kronig Transformation

右近 寿一郎 Juichiro Ukon

【要旨】

反射測定法によるスペクトルの歪を補正する手法に、クラマース・クローニッ ヒ変換がある.これを利用するときの注意すべき点には①K-K変換する範囲② ベースラインの変動がある.ここでは反射スペクトルとK-K変換の基礎的な説 明をし、実際の測定スペクトルに近い計算によって求めたスペクトルから注意す べきことについて説明する.また、実際の測定例についても紹介する.

Abstract

Kramers-Kronig transformation is a method of correcting for distortion in spectra obtained by reflection measurement methods. When using this transformation, we should pay attention to (1) the range of K-K transformation, and (2) base line fluctuations. This paper describes reflection spectra and the basics of K-K transformation, and the points to pay attention to in a spectrum obtained by the calculation to an actual measured spectrum. This paper also introduces some actual measurement examples.

1. はじめに

試料を前処理することなく容易に赤外スペクトル測定をする方法に,正反射測 定法がある.この方法は反射率の高い金属表面に薄く塗布された膜の測定には適 しているが,塊状の樹脂やガラス状の試料の測定では,吸収帯の付近で屈折率が 異常分散を起こし,赤外光の位相が変化するため反射スペクトルに歪が生じる.

塊状の試料からの反射スペクトルをそのまま用いてスペクトルを解析すること は難しいが,クラマース・クローニッヒ変換(K-K変換)を使うと反射スペクトル を吸収スペクトルに変換することができる.しかし,K-K変換の利用には注意 すべきことがいくつかあり,それらを考慮せずK-K変換をおこなうとそのスペ クトルがかえって歪んでしまうことがある.

K-K変換を与える式は0~∞の波数範囲で測定することを求めるが,実際の 測定されたスペクトルは限られた範囲によるものであり,そのため変換されたス ペクトルに誤差が生じる.また,反射スペクトルの測定で生じるベースラインの 変動によっても誤差が生じる.ここではK-K変換によって生じる誤差について, 実際の測定スペクトルに近づけた計算によって求めたスペクトルから,それら注 意することについて説明する.また、実際の測定例についても紹介する.

2. クラマース・クローニッヒ変換と誤差

2.1 屈折率の異常分散と反射スペクトルい

樹脂や結晶などの均質な誘電体に光が入射するとき,空気の屈折率をn₁,光が入射する物質の屈折率をn₂とすると,入射角**θ**₁と屈折角**θ**₂との関係は

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$
(1)

で表され、スネルの式と呼ばれる. 屈折率の異なる境界面での光線の追跡に利用 される. また、光が境界面に入射したときの透過率(T_o:平行偏光、T_s:垂直偏光) と反射率(R_o:平行偏光、R_s:垂直偏光)は、つぎのフレネルの式にしたがい偏光 面ごとに計算することができる.

$$T_{p} = \frac{\sin 2\theta_{1} \sin 2\theta_{2}}{\sin^{2}(\theta_{1} + \theta_{2}) \cos^{2}(\theta_{1} - \theta_{2})} \qquad \cdots \cdots \cdots (2-3)$$

屈折率は、物質による吸収のない波長領域では、光の波長が短くなるにした がって徐々に増加していき、これを正常分散と呼ぶ.しかし、光が物質によって 吸収を受ける(透明でない)とき、屈折率は図1のように吸収波長を中心に急激な 変化をする.このような屈折率の変化を異常分散と呼ぶ.物質が光を吸収すると き、その波長での屈折率は次式のように複素数で表され複素屈折率となる.

$$n^* = n - ik$$
(3)

複素屈折率をもつ物質に,空気(屈折率を1とした)から垂直入射したときの反射 率は

$$R = \frac{(1-n)^2 + k^2}{(1+n)^2 + k^2}$$
(4)

のようになる.赤外光の吸収がローレンツにより提案された振動子による光と物 質との相互作用によるとすると、複素屈折率のk(虚数部)は波長に応じて変化を する.例えば吸収帯の中心を1000cm⁻¹,半値幅を30cm⁻¹,k₁₀₀₀を1としこれを式 (4)に入れると、図2のように反射率は1000cm⁻¹付近で急激に変化し、反射測定 でよくみられるスペクトルの形になる.これは光によって励起された振動子が吸 収帯では摩擦力のためにエネルギーが消費され位相が遅れ、結果として反射光の 位相が変化するためであると説明されている.このことから反射光の波長ごとの 位相変化がわかれば、反射スペクトルから吸収スペクトルを求めることができ る.このために用いるのがクラマース・クローニッヒ(K-K)変換である.





0

k 1000=1

2.2 クラマース・クローニッヒ解析^{2,3)}

物質の光の吸収は複素屈折率の虚数部すなわちkによるのであり,反射スペク トルから複素屈折率が求められれば,吸収スペクトルが得られる.

K-K解析は垂直入射(入射角 $\theta = 0$)での反射スペクトルと位相変化を与える.

ϕ(ν i): 波数 υ i での位相角変化

R (ν):反射スペクトル

lnは自然対数

複素屈折率の実数部nと虚数部kは、位相角 ♦ から

で求めることができる. K-K解析を表す式(5)の積分範囲が $0 \sim \infty \text{cm}^{-1}$ になって おり,反射スペクトルは $0 \sim \infty \text{cm}^{-1}$ の範囲で測定されなければならない. また積 分の中で $\nu_{i} = \nu$ となるところでは不定となりこのままでは解を求めることが できない. このためいろいろな近似計算法^{3,4)}が提案されているが,最近では二 重フーリエ変換法⁵⁾と呼ばれるものが最もよく利用されている. 計算法の詳細に ついては参考文献に詳しい⁴⁾.

いずれの計算法を利用するにしても、測定範囲が限られることからK-K解析 する反射スペクトルの範囲設定には注意が必要である.

2.3 クラマース・クローニッヒ解析での留意点

2.3.1 K-K 変換の範囲設定

K-K解析では測定範囲が0~∞cm⁻¹の反射スペクトルが必要である.しかし 実際の測定では範囲が限られ,変換された吸収スペクトルに誤差が生じる.実際 の測定例からこの誤差を見積もることが難しいため,計算により求めたスペクト ルからそれを検討する.

複素屈折率のnとkは複素誘電率 $E^* = E_1 + 1E_2$ から次のように与えられ,

$$n = \frac{1}{2} \{ (\mathbf{\epsilon}_{1^{2}} + \mathbf{\epsilon}_{2^{2}})^{1/2} + \mathbf{\epsilon}_{1} \} \qquad \dots \dots \dots (8-1)$$

$$k = \frac{1}{2} \{ (\mathbf{\epsilon}_{1^{2}} + \mathbf{\epsilon}_{2^{2}})^{1/2} - \mathbf{\epsilon}_{1} \} \qquad \dots \dots \dots (8-2)$$

複素誘電率の \mathbf{E}_1 と $i\mathbf{E}_2$ は振動子の固有振動数 ν_3 (吸収の位置),ダンピング定数 γ_3 (吸収帯の幅)と振動強度 S_3 (吸収強度)から求めることができる.

固有振動数 $\nu_{j} = 1000 \text{cm}^{-1}$,振動強度 $S_{j} = 200$,ダンピング定数 $\gamma_{j} = 20 \text{cm}^{-1}$ として k スペクトル(図 3)を計算し,複素屈折率から図 4 の反射スペクトルが得られる.計算の範囲は $0 \sim 10000 \text{cm}^{-1}$,計算の間隔は 2 cm^{-1} , ε_{∞} (遠紫外域での誘電率)は2.2としてある.

計算範囲を(a)800-1200cm⁻¹(b)600-1400cm⁻¹(c)400-1600cm⁻¹としてK-K変換し,その結果と図3のkスペクトルとの誤差を図5に示す.この図から測 定範囲が広いほど変換誤差は小さくなることがわかる.実際の測定では測定範囲 をできるだけ広く設定し,かつ反射スペクトルの吸収帯の裾の影響がほとんど見 られないところで打ち切り変換することでK-K変換での誤差を小さくすること ができる.

K-K変換する範囲の外にも吸収スペクトルが存在することはあるが,式(9)を みると,測定範囲が吸収帯から離れるほどそれによる寄与は著しく小さくなるこ とから,実際の測定で変換範囲の外側に吸収帯があっても上記シミュレーション 結果と同様に,反射スペクトルでその影響がほとんどないと認められるところで 変換範囲を設定すれば良い.

2.3.2 ベースライン変動の影響

正反射測定法では,絶対反射率として得られたスペクトルだけがK-K変換に よって正しく吸光度スペクトルに変換される.しかし実際の反射スペクトル測定 ではリファレンスに鏡を置いて,このスペクトルを基準として試料の反射スペク トルを測定するので,鏡の反射率が低かったり汚れていたりすると正しい反射ス ペクトルが得られない.また鏡と試料を測定した光軸が一致していないときにも, 得られた反射率は誤差を含み,反射スペクトルのベースラインがシフトしたり,傾く ことがある.ここでは計算で求めた反射スペクトルにベースラインのシフトや傾きを 与え,その影響を調べる.

ベースライン変動の影響を調べるためのモデルとして、ポリエチレンに近い吸 収を持つkスペクトルを作成した.4 cm⁻¹毎に0~12000cm⁻¹までを計算の範囲と し、吸収帯の数は6つとしてそれぞれの定数を

> 固有振動数 $\nu_{j} = \{800,1000,1300,1400,1500,2900\}$ cm⁻¹ 振動強度 S_j = $\{205,100,70,100,300,600\}$ $\gamma^{*} \nu \nu^{*} \nu \gamma^{*} \equiv \{30,30,50,40,45,50\}$ cm⁻¹

とした.式(8),(9)より求めた複素屈折率から,式(4)を使って反射スペクトル を計算すると,図6の(a)のようになる.ここで縦軸は反射率を常用対数で変換 し-1を掛けて吸光度と同様の処理をしてある.それに対応するkスペクトルを図7 の(a)に示す.



スペクトルのシミュレーション

吸収中心:1000cm⁻⁻', 半值幅:20cm⁻⁻',

Simulation of spectrum

振動強度:200

0.4 0.3

k 0.4

0.1

-0.1 20

図 3

0.

0.05

0.0

0.02

R 0.0

A 5 K-K変換で次めたドスペクトル k Spectrum obtained by K-K transformation

変動範囲が広いほど誤差(Δk)は小さい.

2.3.3 ベースの上下変動

図6の(a)のスペクトルに0.2を加えベースラインをシフトする(図6の(b)). これを K-K変換した結果を図7の(b)に示す. また同様にスペクトルから0.2を引 きベースラインをシフトし(図6の(c)), これをK-K変換した結果を図7の(c) に示す.



この結果からみて、ベースラインが測定上の問題から上下に単純にシフトする と、kスペクトルの形状には大きな歪は生じないが、ベースが下がったスペクト ルをK-K変換するとピークの強度は大きくなり、逆に上がったものをK-K変換 すると小さく見積もられる.このことから、反射スペクトルより、定量を目的と してkスペクトルを正しく求めるには、ベースラインのシフトが発生する要因と なるリファレンス鏡の反射率を正確に求めておくことが必要となる.また再現性 が重要となるときにも、リファレンスとなる鏡によるベースの変動を抑えなけれ ばならない.

2.3.4 ベースの傾き

反射スペクトルの測定で,光軸のずれまたは試料の測定部分が湾曲したままで 反射スペクトルを測定することがあるが,このとき得られた反射スペクトルでは 全体が傾くことがある.そこで図6の(a)の反射スペクトルにたいして傾きを加 え,これをK-K変換したときのkスペクトルをみてみる.実際の測定ではベースラインの変動はより複雑になるが,ここでは単純に直線状の傾きを与えることとした.

傾いた反射スペクトルは、図6の(a)のスペクトルに2000cm⁻¹を中心に高波 数側に向かって1000cm⁻¹で±0.1の傾きを与えたもので、それぞれを図8の(b),(c) に示す.図9の(b),(c)にはこれをK-K変換した κ スペクトルを示す.これを みると、ベースラインの傾いた反射スペクトルを変換して求めた k スペクトル は、そのベースラインが0からずれ、また吸収帯の形状も歪んでいる.吸収強 度をみると、傾いた反射スペクトルの値が傾きのない元の反射スペクトルの値 より小さいところでは吸収強度が大きくなり、逆に大きくなっているところでは k スペクトルの強度が小さくなっている.このことは上記のベースラインのシフ トの影響の結果から容易に類推できる.

実際のK-K変換で求めた吸光度スペクトルでも吸収帯のない部分(ベースライン)が0からずれていたり,吸収帯の形状が歪んでいることがあるが,これはこの結果からみて測定した反射スペクトルのベースラインが傾いていることによると推定できる.反射測定される試料の吸収スペクトルがわかっているなら,K-K変換したスペクトルと比較することで,吸収のないところでのベースラインの浮き上がりや吸収帯の歪から,正しく反射スペクトルが測定されいてるか調べることができる.

2.4 試料の形状での留意点

これまで説明した以外にも, 試料の形態についてもいくつか注意すべきことが ある.

K-K変換は、測定した反射スペクトルが試料表面からの反射光だけのスペク トルであるとしておこなわれる.そのため試料の厚さが数mm以下と薄く、表面 を透過し裏面から反射した光も測定してしまうと、反射スペクトルに透過スペク トルが重なり、変換したスペクトルは歪む.これは試料が平行平板のとき顕著に 起こるが、反射スペクトルに透過スペクトルが重なっているかは表面裏面間の多 重反射によって生じる干渉縞があるかどうかで確認することができる⁶⁰.また、 表面が荒れて光を散乱すると反射スペクトルは拡散反射に近くなる.したがって 測定表面が光沢面であることが必要となる.しかし赤外光は可視光に比べて波長 が長いので、測定表面を照らしてみて多少の光沢があるようなら問題なく反射測 定がおこなえる⁶⁰.

3. 反射法によるサンプル測定

正反射測定法は固体表面による測定が一般的だが,測定原理からみて液体にたいしても適用できる.ここでは,実際の測定例について述べる.

測定は 堀場製作所製の顕微専用FTIR (FT-520:図2)を利用した.分解能は4 cm⁻¹ でおこなった.正反射測定法は汎用のFTIRでも利用できるが,顕微FTの利用には次のような利点がある.

① 観察光学系で試料表面に正確に焦点を合わせられる.

② 測定領域が小さい.

③ 光軸がステージに垂直に設定されている.


図10 顕微専用FTIR (FT-520) FTIR for microscope (FT-520)

正反射測定は絶対反射率の測定であるため、参照スペクトルと試料スペクトル を別々に測定するFTIRではそれぞれの測定の再現性が重要である.そのため測 定面を正確に赤外光の焦点に置かなければならない.顕微FTでは可視光と赤外 光の焦点が一致していることから、目視観察で測定表面に焦点を合わせるだけで 赤外測定の焦点を合わせることができ、精度の高い測定ができる.

すでに述べたように、正反射測定法では平で光沢のある測定面が必要である. このような表面は測定領域が小さくなるほど容易に探し出せる.顕微FTでの測 定領域は10μm~数100μmぐらいなので、目視で観察しながら平坦な測定面を 容易に探し出すことができる.

また顕微FTではステージ面と光軸は垂直であるため、試料が平行平板である とき特に液体試料では光軸の調整を必要としない.

このような理由から顕微FTの利用は正反射測定を容易にし、また測定を精度 よくおこなうことができる.つぎに紹介する測定例はすべて顕微FTでおこなっ た.

3.1 固体試料の測定

3.1.1 ポリメチルメタクリレート (PMMA)板

厚さ3mmのPMMA板を試料ステージに置き表面に焦点を合わせ、反射スペクトルを測定した.金蒸着した平面鏡からの正反射スペクトルをリファレンスとした.以下の測定例でも参照スペクトルには同じ鏡を利用した.測定範囲は5000~700cm⁻¹とした.スキャン回数は参照スペクトルと試料スペクトルともに400回であるが、試料を測定時には増幅器のゲインを8倍高くして測定した.これは反射率が平均して約10%ぐらいになっているため、測定で得られるインターフェログラム強度が小さいことに起因するAD変換器の量子化誤差を少なくするためである.測定した反射スペクトルを図11に示す.カルボニル基の伸縮振動は吸光係数が大きいため、反射スペクトルは光位相の変化を大きく受け歪んでいる.

図12にはこれをK-K変換して求めた吸収スペクトルを示す.変換の範囲は 5000~860cm⁻¹とした.高波数側には吸収帯がないことから5000cm⁻¹とし低波数 側では吸収のない860cm⁻¹としたが,近傍の指紋領域に多くの吸収帯があるため その付近での誤差は避けられない.K-K変換による吸収スペクトルで,変換範 囲の両端から離れたカルボニル基の伸縮振動の吸収は歪もなく鋭く現れている. また,そのピークの吸光度は3近くにあるにもかかわらず,吸収法による測定に みられる吸光度の高いところでのSN比の劣化が現れない.これは反射スペクト



ルでこの吸収帯の値が2~20%の範囲にありノイズ成分をあまり含んでいないこ とによる.これもK-K変換によって得られた吸収スペクトルの特徴である. 吸収がない2500~2000cm⁻¹付近の吸光度は0付近にあり,反射率測定が正し く測定されたことを示している.

3.2 液体試料の測定

3.2.1 エチレングリコール

液体試料は顕微FTが水平な台に設置されていれば,カップをステージに置く だけで光軸にたいして垂直な反射面ができ,しかも平坦な光沢面であるので容易 に正反射スペクトルを測定できる.



図13と図14にそれぞれ反射スペクトルとそれをK-K変換した吸収スペクトルを示す.測定範囲は5000~700cm⁻¹とした.スキャンの回数は参照スペクトル,試料スペクトルとも400回おこなったが,試料測定では試料の反射率が5%前後と低いため増幅器のゲインを参照側より16倍高く設定した.

変換の範囲は4000~820cm⁻¹とした.2400~1700cm⁻¹の吸収のないところの吸 光度は0付近にあり、反射率測定が正しくおこなわれていることを示している.

3.2.2 重油

重油の吸収スペクトル測定は液体セルの光路長を10µmぐらいにして測定され るが、光路長の短かい液体セルは厚みの管理が難しい.エチレングリコールの例 からもわかるように液体の正反射測定は取扱い易く、スペクトルの再現性もよい ことからこのような試料に適している.

測定範囲は5000~700cm⁻¹とした.変換の範囲は低波数側でベースラインが変動しているため4000~1050cm⁻¹とした.スキャン回数は参照スペクトルと試料 スペクトルともに400回スキャンとし,試料測定での増幅器ゲインは参照スペク トル測定より8倍高くした.反射スペクトルを図15に,変換した吸収スペクト ルを図16に示す.



4. まとめ

測定が容易な反射スペクトルはK-K変換を利用して吸収スペクトルとするこ とができ,赤外スペクトル測定の範囲を広げる有用な測定法である.しかし,む やみにこれをおこなうと必ずしも正しいスペクトルを得られるとは限らない.

K-K変換をするうえでの注意すべき点は、①K-K変換する範囲、②ベースラ インの変動、の二つを挙げることができる.まず変換範囲はその両端で、近傍の 吸収帯からの影響が少ないところとし、吸収帯にかかって打ち切ることは避けな ければならない.つぎに、反射スペクトルにシフトや傾きの変動があるままで変 換をおこなうと、得られた吸収スペクトルは歪んだり吸収帯のないところが浮き 上がったりする.このため吸収スペクトルがあらかじめ測定できるなら変換して 得られた吸収スペクトルと比較し、リファレンス測定と試料測定で表面が傾いた りして光軸のずれが生じていないか、また試料面が湾曲していないかなど測定上 に問題がないことを確認することが重要である.

測定例としてポリメチルメタクリレート板,エチレングリコール,重油の測定 を示した.液体の測定ではその液面が平坦な光沢面で光軸に垂直であることから 正反射測定に適していることを示した.

赤外反射測定法は、吸収測定法でのKBr錠剤法やヌジョール法のように前処理 の煩わしさや膜厚の問題が少ない簡便な測定といえる.ここで説明したような点 に注意してこれを利用すれば、研究分野のみならずプロセス管理にいたるまで、 今後ますます応用範囲が広がることが期待される.

参考文献

- 1) ロッシ著 福田国弥, 中井祥夫, 加藤利三, "光学", 吉岡書店 (1969)
- 2) 錦田晃一,岩本令吉, "赤外法による材料分析", 講談社 (1986)
- 3) 高橋博彰,平石次郎,石井紀彦,"正反射法",分光研究, Vol.25, No.3, (1976)
- 4) K.Ohta, H.Ishida, Appl.Spectrosc., Vol.42, No.6, 952 (1988)
- 5) C.W.Peterson, B.W.Knight, J.Opt.Soc.Am., Vol.63, 1283 (1973)
- 6) J.A.Reffner, W.T.Wihlborg, International Laboratory, Nov.'90/Feb.'91, 22 (1991)



右近 寿一郎 Juichiro Ukon

科学計測開発部 課長 1980年入社 光応用分析装置の研究開発に従事

ŧ

油分濃度計 (OCMAシリーズ)

Oil Concentration Meter (OCMA)

福嶋 良助 Ryousuke Fukushima

【要旨】

生活環境の保全を目的に水質汚濁防止法が施行されているが,河川や沿岸海域 における水中の油分も汚濁防止の対象の一つで,日本国内では,ノルマルヘキサ ン,または四塩化炭素によって抽出したのち赤外線分析法により測定する方法が 油分測定法として日本工業規格(JIS)に規定されている.本稿では,当社の非分 散形赤外分析方式の卓上形油分濃度計(OCMA-220)および連続モニタリング油分 濃度計(OCMA-25)の概要を紹介し,油種の違い,抽出用溶媒の種類や抽出条件 の影響などの実測結果を報告する.また,抽出溶媒の当社の取り組みについても 言及する.

Abstract

Methods for preventing water contamination aimed at preserving the living environment are being implemented. One target for preventing contamination is the oil content in river and coastal water. In Japan, the method of measuring oil content by infrared analysis after extraction by normal hexane or carbon tetrachloride has been stipulated by the Japan Industrial Standards (JIS) association as an oil content measurement method. This paper introduces an outline of the HORIBA non-dispersive infrared analysis type tabletop oil concentration meter (OCMA-22A) and the continuous monitoring oil concentration meter (OCMA-25), and reports measurement results such as differences in oil types, type of eluent and the influence of extraction conditions. This paper also focuses on HORIBA's involvement with eluents.

1. はじめに

水質汚濁指標としての油分は、ノルマルヘキサン(以後ヘキサンと言う)で抽出 される物質として定義されている¹¹.測定はヘキサン抽出を行なった後、約80°C でヘキサンを揮発させ、残留する物質を重量測定により求める形で実施されてい る.この分析方法は、主として揮散しにくい鉱物油、および動植物油脂類の定量 を目的とするが、操作・処理の煩雑さなどがあり、定量範囲は5~500mgと感度 が低いとされている.

一方,四塩化炭素抽出-赤外線分析法¹¹では,四塩化炭素で抽出を行なった後, 波長3.4 µm付近の赤外線吸収量(炭化水素C-H結合の特性吸収)を測定している. 本試験方法は,試料中の炭化水素,誘導体,動植物の油脂・脂肪酸など,比較的 低沸点物質も測定可能であり,定量限界が0.2mg以上と感度は高い.

これら2つの測定結果は、サンプルの処理方法や測定原理の違いによる若干の 差はあるが、測定方法を明記することを前提に、ほぼ同じように利用されている.

当社では,操作が簡単で感度が高いなどの点から非分散形赤外線分析法を利用 した卓上形油分濃度計(OCMA-220)と連続油分モニタ(OCMA-25)の2機種を開発・ 販売し,日本国内のみならず,海外でも広く利用していただいている.

2. 赤外線分析法による油分測定

2.1 抽出溶媒

赤外線分析法では,水中の油分を直接測定することはできない.これは水が広い波長範囲で赤外線の吸収を有し,油分が水中で均一に分散しないためである. そこで,あらかじめ水中の油分を溶媒で抽出し,抽出液の赤外線吸収量を測定することにより,油分濃度を求めるようにしている.

従って抽出溶媒の特性としては以下のような点が重要となる.

(1)広い温度範囲で以下の性質を有すること.

①流動性の液体であること(b.p. 50℃以上, f.p. -10℃以下)

②化学的に安定であること(水,酸,アルカリ)

③水中からの油分の抽出効率が高いこと(ヘキサンと同じ程度)

④水との相互溶解度が低いこと

(2)3.4 µm付近に吸収がないこと

(3)抽出後容易に再生出来ること

(4)低毒性で、蒸気圧が低く揮発損失が少ないこと

ヘキサンには3.4nmに強い吸収があるため、赤外線分析法では一般的に有機ハ ロゲンを溶媒としている.日本では四塩化炭素が¹¹,米国ではフルオロカーボン (CFC-113)が²¹公的溶媒とされている.当社では、環境保護を考慮し約15年前 からで他のフルオロカーボン(CFC-316)*¹も併用できるようにしている.各溶媒 の赤外吸収スペクトルを図1に示す.図に示すように、いずれの溶媒も3.4μm 付近には、吸収がほとんどなく、赤外法を利用する上で好都合である.

2.2 測定波長と標準液

赤外線分析法では3.4μm付近の炭化水素の特性吸収帯を利用している.しか し一口に"油"と言っても、油種によって構成される炭化水素が違い、吸収特性 も異なっている.図2にA、B、C 3種類の重油の赤外吸収スペクトルを示す. そこでJISでは、測定波長を「3.3~3.6μmの3本の吸収ピークの透過パーセント をそれぞれ吸光度に換算し、その平均値を用いるか、又は、非分散形赤外線吸収 装置を用いてもよい」と規定している.

一般的には操作性が容易な非分散形赤外分析計を使用する場合が多いが,いず れの分析方法でも油種の違いに対応するためには,測定器の濃度目盛りをするた めに何らかの標準液が必要となる.そこで現在JISでは,OCB標準液*²が規定されて いる.

*1 CFC-316 水中油分の抽出用溶媒としてダイキン 工業(株)殿と当社が開発したクロロトリ フルオロエチレン. (特公 昭和56-13483)





*2 OCB標準液 2,2,4-トリメチルペンタン, ヘキサデカン, ベンゼンを 35.7:37.5:25.0の体積比で混合した もの

3. 油分濃度計

当社では、非分散形赤外線分析計を組み込んだ油分濃度計として、卓上形油分 濃度計(OCMA-220)と連続油分モニタ(OCMA-25)の2機種を生産・販売している.

3.1 卓上形油分濃度計

卓上形油分濃度計(OCMA-220)を図3に示す.本体の右側の抽出器により, 試 料水中の油分を溶媒中に抽出するようになっている.本体には非分散形赤外線分 析計が組み込まれており, 抽出液を分析部に導入して油分濃度を測定する. コン パクトに設計されている.図4にサンプルのフローを示す.

測定は次のように極めて容易に行うことができる.

- ① 一定量の試料水を溶媒に注入し、さらに抽出効率を高めるため、酸を1滴 添加する.
- ② "EXTRACT"スイッチを押して一定時間振盪機を動作させる.
- ③ 抽出器に取り付けられている2つのコックを切り替え,赤外線分析計に 抽出液を1~2回導入し,セル内を共洗いする.
- ④ "MEAS" スイッチを押し測定を開始する.

分析計の濃度目盛りは、純水でゼロ点を、OCB標準液でスパン点をそれぞれ 校正する.さらに本器では、OCB標準液の代りに、機械的に分析計の光路を一部 遮断することによりスパン校正ができるような簡易機構を設けた.これにより スパン校正のたびに標準液を作成する煩雑を取り除いた.手軽な操作で精度の高 い測定ができる点が、本分析計の最大の特長である.

3.2 連続モニタリング油分濃度計

連続モニタリング油分濃度計(OCMA-25)を図5に示す.本器は全自動になって おり,装置の裏面に試料水を導入できるようにしておくと,全ての測定工程を自 動的・連続的にできるようになっている.抽出ー分離ー測定-溶媒の再生を連続 的に行っているフローシートを図6に示す.

試料はツインヘッドポンプの一方で連続的に吸引され,他のポンプから少量の 塩酸を添加された後,ツインヘッドポンプのもう一方のヘッドから吸引された溶 媒とともに,抽出器へ送り込まれる.抽出器では,溶媒と試料水が十分に混合・



11 -

図 3 卓上形油分濃度計 (OCMA-220) Table-top oil concentration meter (OCMA-220)



図 4 OCMA-220のサンプルフロー Sample flow of OCMA-220



撹拌した後,水相と溶媒相に分離され,非分散形赤外線分析計へ溶媒相が導入さ れ,測定される.測定後,抽出油分を含んだ溶媒は,再度,ポンプで吸引され, 溶媒再生器で,油分を吸着処理した後,赤外線分析計の比較セルに導入し,対照 液として使用された後,再度,試料水中の抽出溶媒として利用される.また,本 分析計は,自動校正機能も有しており,試料水の代わりにZERO水に切り換えて 定期的に自動校正が出来るように設計されている.

4. 油分濃度計の特性

以上,溶媒抽出-赤外線分析法の特長と,当社の油分濃度計の構成,動作を紹介した.次に,油種の違いによる相対感度の差や,溶媒の種類や振蕩方法など抽出条件など測定精度を左右する因子について,OCMA-220で得られたデータの一部を紹介する.

4.1 各種油種の相対感度

CCI4を抽出溶媒としたときの各種油種の相対感度の測定結果を表1に示す. また,表2は抽出溶媒としてCFC-316を使用した場合の各油種の相対感度を示す. いずれの場合も,植物油は鉱物油と比較してやや低い値を示しており,それらの 割合はCCI4もCFC-316もほぼ同じような傾向にある.

なお, 試料はいずれも, 水道水10中に各油種をそれぞれ1mgを分散させた ものである.

油種	OCB	B重油	A重油	軽油	白灯油	ガソリン	大豆油	オリーブ油
相対感度	100	105	116	118	121	89	70	81

表1 CCI4で抽出したときの各油種の相対感度

Relative concentration of various oils when extracted by CCI4

油種	ОСВ	B重油	軽油	イソオクタン	マシン油	大豆油	ゴマ油
相対感度	100	105	122	130	115	83	87

表2 CFC-316で抽出したときの各油種の相対感度

Relative sensitivity of various oils when extracted by CFC-316

4.2 CCI₄とCFC-316抽出

(1)抽出溶媒の差

軽油を添加した模擬水を, CCl₄とCFC-316でそれぞれ抽出したときの測定結果 を表3に示す.両者の抽出効率には殆ど差は認められない.

サンプル組成 溶媒	模擬水1容十溶媒1容	模擬水2容十溶媒1容
CCl4	8.1	16.6
CFC-316	8.2	16.7

軽油10μ&を水塩水 1&中に添加後ミキサーで十分に分散し、OCMA-220の抽出器 で40秒間抽出後測定

表 3 軽油水の溶媒による抽出効率の違い Differences in extraction efficiency by a light oil water solvent

(2)抽出条件の差

図7は軽油水をCCI4溶媒で異なる条件で抽出したときの測定結果である.また, 図8は軽油水をCFC-316溶媒で抽出時間を変えたときの測定結果である.

4.3 CFC-113による抽出

CFC-113は米国や,欧州でよく使われる抽出溶媒である.図9は軽油水の CFC-113による抽出試験結果を示す.図で示されるように抽出時間が長くなる と,指示値が高くなっている.これは,抽出操作中に溶媒が揮発するために高 い値を示すものと判断している.

以上のような試験結果から当社のOCMA-220形が内蔵している抽出器は十分に 抽出機能を有しており、また、CFC-316の水中の油分抽出能は、四塩化炭素と同 等であることがわかる.なお、ここで紹介している試験では、塩酸を少量添加し て抽出操作を行っているが、これはJISに記載されているようにpHを3以下にす ることで、抽出効率を高めている.

5. 抽出溶媒の検討

赤外線分析方による油分測定は,操作が容易で感度が高いため広く利用されている.一方,オゾン層の保護の観点から抽出溶媒について検討が加えられている.モントリオール議定書では,成層圏のオゾン層保護のためにCCl₄やCFC-113などのハロン・フロン系の物質は西暦2000年までには全廃されることが決まった.

当社では、このような状況を考え、すでに約15年前から代替抽出溶媒として CFC-316を検討・供給してきた.表4にそれらの物性を示す.

表から明らかなように、CFC-316は沸点が高く蒸気圧が低いため,揮発量は大変 低くなっているい.毒性も他に比較すると格段に低く、安全性が高い溶媒である 判断している.また、特定フロンの指定の範囲外の条件のもとに、さらに当社で は、溶媒再生器をオプションとして用意し、最少限の量で測定できるよう努力し ている.





図7 軽油水の抽出方法とOCMA-220の指示値 Extraction method of light oil water and instructed value at OCMA-220

溶媒物性	CFC-316	CFC-113	CCl₄
沸点 (℃)	+134	+47.6	+76.7
凝固点 (°C)	-143	-35	-23
比重 (g/cc, at 25℃)	1.75	1.57	1.59
表面張力 (dynes/cm, at 25℃)	27	19	26.8
粘度 (Cst., at 25℃)	0.96	0.42	0.63
蒸気圧 25℃	11.5	360	110
(mmHg) 50℃	38	800	310
屈折率 (nD ²⁵)	1.380	1.354	1.457
水の飽和溶解度 5℃	45	50	60
25℃	48	110	130
(ppm) 50°C	55	230	220
水への溶解度 25℃	4.5	170	800
(ppm) 50°C	7.5	_	850
急性経口毒性 (マウス)			
(LD 50)	52.5g/kg	43g/kg	9.6g/kg

表 4 CFC-316, CFC-113, CCI4の物性 Physical properties of CFC-316, CFC-113, CCI4

6. おわりに

以上は,赤外線技術の応用製品として油分濃度計について紹介した.今後は, 分析計をより使い易いように工夫すると同時に,抽出溶媒や自動再生装置の開発 など,地球にやさしい製品の開発を進めていきたい.

参考文献

1) 日本工業規格, "工場排水試験方法", JIS K0102

2) 米国環境保護庁(EPA)規格, 0:1 and Grease 413, 2



福嶋 良助 Ryousuke Fukushima 環境・工業計測開発部 係長 1973年入社 液体計測装置の研究開発に従事

自動車整備検査用排ガス測定器(MEXA-324G)

Portable Automotive Emission Analyzer for Automobile Repair and Inspection (MEXA-324G)

> 小島 建之助 Kennosuke Kojima

【要旨】

1960年代に入ると、めざましい自動車の普及とあいまって、その排気ガスの 規制の必要性が提起された、以来我国では世界に先がけて、規制方法・規制基 準の見直しを繰り返しながら、自動車排ガス規制の強化が行われてきた、現在 わが国の排ガス規制には、道路運送車両法に基づく新車規制(モード走行)と、使 用過程車規制(中古車のアイドリング)がある.後者は、自動車を使用する人が、 その性能維持・安全確保のために、定期的に行う自動車検査(車検)の時点で実施 される.本稿では、車検制度の紹介を含めた使用過程車排ガス規制の経緯と、 車検時に使用される当社の自動車整備検査用排ガス測定器の測定原理・特性に ついて報告する.

Abstract

In the early 1960's, automobiles began to be used at an amazingly high rate, which led to need to regulate automotive exhaust gas. Since then, Japan has taken the lead in reviewing regulation methods and criteria, and has strengthened automotive emission regulations. Japan currently has two automotive emission regulations: new car regulation (mode travel) based on the Road Vehicle Act, and in-use vehicle regulation (idling of used car). The latter is carried out at periodic automobile inspections by the automobile user to maintain automobile performance and safety. This paper reports the history so far of in-use vehicle emission regulations including an introduction of the periodic automobile inspection system, and reports the principles of measurement and characteristics of HORIBA's automotive emission analyzers used in periodic automobile inspection.

1. はじめに

自動車を運転する時には、交通法規を守り、安全運転を心掛けることは当然 ながら、自動車を適正な状態に維持するため、整備・点検を行って正しく管理 する必要がある.

大都市圏における走行中の自動車を対象にした排気ガスの街頭検査によって も、点検・整備を行うことにより、事故や故障を未然に防ぐとともに、排気ガ スの抑制・公害防止に効果のあることが明らかにされている。一方、自動車の 検査・点検・整備に供される排ガス測定装置は、自動車の著しい技術の進歩や、排

ガス規制の歴史とともに高精度・高性能・多機能化が要求され発展してきた.

当社では、国内・外の自動車メーカの研究・開発部門や製造ライン、公的な試 験研究機関などにおいて使用される計測システムを含む大型の排ガス測定装置か ら、本稿のテーマである使用過程車の車検時に使用される可搬タイプの小型排ガ ス測定器まで各種の排ガス測定装置を生産・販売している.とくに小型排ガス測 定器は、排ガス規制開始時から深いかかわりを持ち、いち速く開発・製品化を行 い、わが国の車検場や自動車整備工場はもちろん、世界各国においても多くの皆 様にご利用をいただいている.

2. 車検制度と継続検査の手順

わが国では全ての自動車は、国の実施する車検を受けることが義務付けられて いる.この検査は安全性を確保し、公害を防止するために、自動車の構造装置に 関する基準に適合しているかをチェックするものである.車検の種類には、対象 となる自動車の経歴により、表1に示す3種類があるが、一般に自動車を引きつ づき使用する場合には継続検査を受けることになる.

検査の種類	内	容	対象件数 (1990年度)
			(1990年度)
新規検査	新たに自動車を使	使用するときに受ける検査	6,871,263件
	(型式指定を受け)	た新車は現車提示が省略	型式指定
	される).		5,314,542件
継続検査	自動車検査証の有	動期間満了後も使用しよ	
	うとするときに受	3ける検査(指定整備事業	17,833,833件
	70,000,000	10 3 快赴(消危正面事来	指定整備
	者において整備し	, 検査をしたものは, 現	44 004 000/#
	車提示が省略され	11,864,8921+	
構造等変更	自動車の長さ、高	高さ,幅及び最大積載量等	
検査	に変更を生ずるよ	こうな改造をしたとき受け	71,957件
	る検査.		
参考) 1990年自	動車保有台数		
内訳	乗用車	34,924,213台	57,701,725台
	トラック	21,321,439台	
	バス	245,668台	
	他(特殊用途,三輪)	1,210,405台	-

表1 車検の種類と1990年度対象件数¹⁾ Type of automobile periodic inspection and number inspected in 1990 継続検査を受ける時の手順と主な検査項目を図1に示す.



3. 使用過程車排ガス規制

わが国では、1966年に4モード走行中の排気ガスの一酸化炭素濃度を3%以下に定める新車規制が実施された.さらに1970年には、アイドリング運転中の 排気ガス中の一酸化炭素(CO)濃度を、新車で4.5%以下、使用過程車で5.5%以下にすることが義務付けられた.世界に先駆けて初めて使用過程車に対する規制がスタートし、その後炭化水素(HC)、ディーゼル車の排気黒煙なども加わり 強化され今日に到っている.**表2**に使用過程車排ガス規制の経緯を示す.

規制対象車	規制物質	試験方法	1970	1972	1973	1975
ガソリン車	一酸化炭素 (CO)	アイドリ ング時	5.5% 4.5%(新車)	4.5%	←	+
LPG車 (2 輪車を除く)	炭化水素 (HC)	アイドリ ング時	_	_	排気ガス滅 少装置また は点火時期 調整義務づ け	4 サイクル 1200ppm 特殊* 3300ppm 2 サイクル 7800ppm
ディーゼル車	排気黒煙	無負荷 急加速時	_	_	_	汚染度 50%

特殊*:特殊な構造の原動機を有するもの(ロータリーエンジン)

表 2 使用過程車排ガス規制の経緯と現況³⁾

History and current state of automotive emission limitations



図2 小型自動車排ガス分析計MEXA-324G Portable automotive emission analyzer MEXA-324G

4. 自動車整備検査用排ガス測定器

4.1 適用規格

車検時の使用過程車排ガス測定に用いられる測定器の規格は,道路運送車両 法施工規則第67条に基づき「自動車整備検査用機械器具に係わる技術上の基準」と して定められている.ここでは,排ガス規制物質に対応し,一酸化炭素測定器,炭 化水素測定器,黒煙測定器に関する技術的な規格を定めている.各測定器は型式 認定を受けることができ,その時に適用される規格には「自動車整備検査用機 械器具審査基準」がある.

当社の自動車整備検査用排気ガス測定器MEXA-324G(図2)はこの基準に準拠している.

4.2 測定原理

MEXA-324Gの測定原理は次のようになっている.

赤外線が排ガス中を通過すると,排ガス中に含まれる測定対象成分に特有な 波長の赤外線が吸収されるが,この吸収量を測ることによって対象成分の濃度 を計測するものである.

このとき,光の吸収を扱う場合の基礎となるのがランベルト・ベアの法則 (Lambert-Beer's law)といわれるもので(1)式で示される.

I0: 入斜光の強度 IE: 出射光の強度

μ:吸光係数 1:吸光層の厚さ c: サンプル濃度

従って、サンプルの濃度がCのときに測定器から得られる出力(I)は、(2)式により求められる.

$$I_t = I_o (1 - e^{-\mu c1})$$
(2)

MEXA-324Gに採用しているシングルセル多成分計の光学系の構成を図3に示す.

光源から放射された赤外線は、測定セルを通り、チョッパーの回転により断 続光となって検出部へ入射する.検出部は、CO, HC, CO² の吸収波長帯² およ び吸収のない波長帯(基準波長:REF)を選択的に透過させる光学フィルタと、固体 型赤外線検出器(パイロセンサ)を組み合わせて構成されている.

測定セル内に排ガスが入ると、各ガス成分に固有の波長の赤外線が吸収され、 対応する検出器に入射する赤外線光量が減少する.一方、基準検出器(REF)へ の入射光量は、吸収のない波長を選択しているため光量は変化しない.したがって ガス濃度の検出は、基準検出器の出力(R)と測定成分の検出器の出力(S)の差(R-S) として求められることになる.本分析方法は、一般に非分散形赤外線分析法 (NDIR: Non Dispersive Infrared Analysis)と呼ばれている.

4.3 機器構成と信号処理

MEXA-324Gは,自動車の排気管からガスを採取し前処理するサンプリング系,赤外線吸収量を計測する光学ベンチ部,および電気信号の増幅・表示をする信号処理部から構成されている.図4にガスフロー図を,図5に信号処理のブロック図をそれぞれ示す.



図 3 MEXA-324Gの光学系 Optical system of MEXA-324G



4.4 仕様

MEXA-324Gの主な仕様と自動車整備検査用機械器具技術基準を対比させて 表3に示す.

75 D	计作其准	MEXA-324G		
	拉 侧 奉 华	CO	HC	
測定範囲	CO 5%以上12%以下 HC 1500ppm以上 12000ppm以下	0 -10%	0 -10000ppm	
再現性	±2%フルスケール	土0.04%または 指示値の土2%の いずれか大きい方	土20ppmまたは 指示値の土2% のいずれか大きい方	
精 度	土3%フルスケール	土0.06%または 指示値の土3%の いずれか大きい方	土30ppmまたは 指示値の土3% のいずれか大きい方	
3時間の ドリフト	同上	同上	同上	
応答速度 (T _{9 0})	10秒以下	10秒	少以下	
暖機時間	30分以下	10	分	
表示最小 目盛り	CO 0.1%以下 HC 1%フルスケール以下	0.01%	10ppm	
消費電力	取扱いおよび移動が	約50	ow	
外形寸法	容易なもの	260(W)×360(D)×160(H)	
重量		約	5 kg	
運輸省型式 認定番号		INSO	CO • HC-9	

表 3 自動車排ガス測定器に関する技術基準とMEXA-324Gの主な仕様 Technical standards relating to automotive emission analyzers and main specifications of MEXA-324G



MEXA-324Gのおもな特長は次の諸点である.

(1)小型化と短い暖機時間

固体型検出器を採用したことにより信頼性の向上と共に光学系が小型化され、 測定器の電源投入から測定可能になるまでの時間(暖機時間)は10分と非常に短い. (2)希釈チェック機能と高いガス選択性

ー本の測定セルで3成分(CO, HC, CO₂)の同時測定が可能となり, CO₂濃度 を測定する事により,自動車のマフラーからサンプリング状態を監視できる希釈 チェック機能を持っている.また,共存ガスによる干渉影響に対し補正を行ない, 高いガス選択性を得ている.

(3)高い測定精度

MEXA-324Gの測定精度は,指示値に対して誤差±3%以内を保証している(ただし2%CO以下の範囲では±0.06%CO以内). これはフルスケールに対して保証する場合に比べ,とくに低い濃度領域でも一定の測定精度が得られる特長がある. 図6にCO計における測定濃度と指示誤差の関係を示す.

(4) プロパン/ヘキサン換算係数の自動補正

自動車排ガスには未燃燃料や不完全燃焼によって生成される各種の炭化水素 が含まれている.HC濃度を測定する場合は、JIS D 1030⁴¹ではノルマルヘキサ ン当量に換算して表示するように規定している.NDIRガス分析計では、取扱・ 安定性の点からプロパンガスを感度校正用に使うが、分析計ごとに固有のプロパン /ヘキサン換算係数(Propane/Hexan Equivalency Factor: PEF)を持っているため、プ ロパンガス濃度に小数点以下3桁のPEF値を乗じると言う煩わしい演算が必要と なる.MEXA-324Gでは、測定器毎に固有のPEF値を記憶させており、スパン校 正時には自動的にPEF値を0.500に補正するようにし、煩わしい演算を不要とした.

(5)内部校正機構による高い安定性

ガスセルの汚れや光学系の劣化による感度変化があった場合に、スパンガスに よる感度校正の代わりに、信号処理部の測定ラインに模擬信号を発生させて、内 部校正を行い感度補正をしている.この方法により、光源電圧の25%の変化にも 十分に感度補正をしていることを図7に示す.

(6)大型デジタル表示

測定結果の表示はディジタル方式を採用し、とくに整備工場での直射日光下でも はっきり見える液晶タイプとし、字高18mmの大型8セグメント表示とした. (7)シンボルマークによる警報表示

測定器の異常や操作ミスを知らせるために,図8に示すシンボルマークを点滅 して表示するようにした.これにより,一目で警報の内容を把握し,操作者が対応し易くした.

(8)ワンタッチ入力

フロントパネルのスイッチ類はワンタッチ入力が可能なキーシート方式とし操 作性を向上させた.



図 6 CO計の測定濃度と指示誤差 Measurement concentration and readout error of CO analzyers



Effectiveness of compensating gas sensitivity by internal calibration function

シンボルマーク	警告内容
▲	指示値が急激に上昇または下降してい る事を示し、読み取り中止のサイン
Œ	フィルタの目詰まりや流路内目詰まり により応答速度が規格を外れる流量低 下を警告
?	測定範囲を超えた時に表示
	測定モード中にサンブルが希釈されて いる時に表示 (プローブを十分挿入するよう警告)
	パージモード中にサンプルガスを吸引 している時に表示 (プローブを抜き取るよう警告)

図 8 MEXA-324Gの警告表示 Alarm displays of MEXA-324G

5. おわりに

自動車排ガス規制は世界的にますます厳しくなっている.排ガス測定器は,複 雑になっていくエンジンの診断・調整を行うために,多機能化,高性能化,高精 度化,軽量・コンパクト化はもちろん,世界中のニーズに合わせて測定濃度範 囲の拡大化,操作性や保守性の向上,省エネルギー化やランニングコストの低減 などが一層必要となっている.

一方,測定器の技術基準は,現在,米国(BAR90),日本,EC圈(PTB,TÜV,SIM, NMI,スイス他)など各国毎に規定されているが,今後は,1991年に国際会議に於いて承認されたOIML(R99)規格が,世界共通の規格として整合されて行くことが予想される.

今後とも皆様のご指導をあおぎ、より高性能で使いやすい排ガス測定器の開発・販売を通じて、地球にやさしい環境づくりに少しでも貢献できることを願っている.

参考文献

- 日産自動車株式会社編"自動車産業ハンドブック(1992/1993)",紀伊国屋書店(1992)(抜 粋引用).
- 2) 関東運輸局東京陸運支局 "自動車検査場案内" (1985,4)(抜粋引用).
- 3) 岩田雄作"車検の秘訣",鉄道日本社発行(1979,5).
- 4) JIS D 1030-1976 "自動車排気ガス中の一酸化炭素,二酸化炭素及び炭化水素濃度の連続 測定方法".



小島 建之助 Kennosuke Kojima

自動車計測開発部 係長 1975年入社 排ガス分析装置の研究開発に従事

鼓膜体温計 (IT-500M)

Tympanic Thermometer (IT-500M)

松本 直之・辻岡 唯二・迫田 博文 Naoyuki Matsumoto, Yuiji Tsujioka, Hirofumi Sakoda

【要旨】

従来の約1/100の時間で,簡単に体温を測定できる鼓膜体温計 IT-500M を株式 会社ニッショー殿と共同で開発した.本機は病院や診療所などの医療現場での 体温測定をより簡単にする目的で開発,製品化した.本機は,鼓膜及びその周 辺の温度を非接触で測定するものであり,鼓膜を傷つけることなく,約2秒で 体温を測定できる.また本機は従来の電子体温計と同レベルの測定精度(再現性) ±01℃を実現している.本稿では鼓膜温による体温測定の利点および本機の概 要と測定原理について説明するとともに,本機の測定精度の実測結果および臨 床データについて報告する.

Abstract

HORIBA has recently developed the tympanic thermometer IT-500M capable of simply measuring body temperature in about 1/100th the time of conventional thermometers jointly with Nissho Corp The IT-500M was developed and commercialized for the purpose of simplifying the measurement of body temperature at the site of treatment such as in hospitals and clinics The IT-500M measures the temperature of the ear drum and its periphery in a non-contact manner, and can measure the body temperature in about 2 seconds without any damage to the eardrum Also, it achieves a measurement accuracy (reproducibility) of $\pm 0.1^{\circ}$ C, the same level as that of conventional electronic thermometers This paper describes the advantages of measuring body temperature by the temperature of the eardrum, an outline of the eardrum thermometer, and principles of measurement, and reports the results of measuring its accuracy and clinical data

1. はじめに

体温は健康状態の重要なバロメータであり,病院や診療所はもとより一般家 庭においても体温測定は日常的に行われている.

体温測定の方法としては,腋下,舌下,直腸温をはかるのが一般的である. しかし腋下,舌下温は外気温の影響をうけやすく,体内温度の指標とするには 不適当な場合がある.そして温度計を挿入するときに測定部位の体温が一時的 に低下し,もとの温度にもどるまでは5分間以上が必要となる これらのため に腋下,舌下温を正確にはかるのには時間がかかってしまうことになる.一方, 直腸温は内臓の温度をよく反映しており,安定した測定結果が得られるが,被験者 が脱衣する必要があり容易に測定できるものではない.この為現状では,外来・入 院患者の体温測定は,一般に成人では腋下で,乳児では直腸で測定している.そ こで,より簡便に,短時間でかつ正確に体温をはかる手段の開発が永年望まれて いた.

当社はこれまで汎用の放射温度計を開発 製品化してきたが、体温の測定にこ れらの技術を応用することを検討してきた. 放射温度計は接触式の温度測定方法 にくらべて短時間で、かつ測定対象に熱的・物理的な影響を与えずに測定できる という長所がある.しかし体温測定に用いるには、放射温度計自体の精度と人体 のどの部分で測ればよいのかという点が問題となっていた

今回, 内頚動脈に近く, そのため脳温によく一致するとされている鼓膜温に着 目して, 鼓膜付近の温度を非接触で測定する鼓膜体温計IT-500Mを株式会社ニッ ショー殿と共同で開発した.

図1 鼓膜体温計 IT-500M の外観 External appearance of tympanic thermometer IT-500M

2. IT-500M の構成

21 IT-500M の構造

本機の外観および構成を図1,図2に示す.



本機は鼓膜およびその周囲から放射され赤外線をプローブ部の先端でとらえて 体温に換算,表示する.測定の際,本機のプローブ部を被測定者の外耳道に挿入 することになる.この時おきるプローブ部先端のよごれの防止および患者間の相 互感染の防止のため,プローブ部にプローブカバーをとりつけて測定するように 設計している.また鼓膜等を傷つけることがないようにするため,プローブ部は 外耳道の奥までは入らない構造にしてある.

本機は片手で持って使用できるように、コンパクトなボディに光学系、検出器、 回路などをおさめている また単三乾電池2本で長時間使用できるように設計され ている.

22 IT-500M の使用方法

本機の使用方法を図3に示す プローブカバーを取り付け,被測定者の外耳道 にプローブ部を軽く挿入しSCAN(測定)ボタンを押す 約2秒で測定が完了し, ブザー音とともに測定結果が表示される

繰り返し測定するときは、プローブカバーを交換、あるいは消毒する. プローブカバーは赤外線を透過する材質でできているが、汚れたり傷がついた



りすると透過率が低下して所定の測定精度が維持できなくなる また患者間での 相互感染の恐れもあるので、プローブカバーは使用ごとに交換あるいは消毒する 必要がある.

23 測定時のポイント

本機は前述のようにプローブ部を耳孔に挿入し,測定ボタンを押すだけで誰に でも簡単に使える体温計である.しかし,より正確に安定した測定を行うために は、次の点に注意する必要がある.

- a プローブおよびプロープカバーにゴミ,汚れなどの異物がついていると正 確な測定ができない.
- b プローブカバーを取り付けたときに、先端にたるみ、汚れ等があると正確 な測定ができない.
- c プローブを耳孔に挿入する場合,プローブを鼓膜の方に確実に向けること により正確な測定結果が得られる.この時,耳介を後方上向きに軽くひっ ぱると鼓膜までがほぼ一直線になり,挿入しやすくなる.

なお,同じ被測定者を繰り返し測定して得られた結果の再現性が悪いときは, プローブ部の挿入方向,深さが一定していない場合が多い そのようなときは上 記の c に留意して測定してみる必要がある.

24 IT-500M の仕様

本機の主な仕様を表1に示す.

測	定	範	囲	32∼42°C
測	定	制	度	±01℃ 但測定範囲370~390℃、周囲温度23℃、相対湿度55%の場合
				±0 2℃以内 周囲温度18~28℃、相対湿度45-85%の場合
動化	宇周囲	温度	範囲	15~35℃
電			源	3 0V単3乾電池2本
消	費	電	カ	100mVA
電	池	寿	命	約140g(乾電池含む)
外	形	र्ग	法	161 x 90 x 32 (mm)

表1 IT-500Mの仕様 Specifications of IT-500M 現在,非接触で体温を測定する体温計の測定精度についての規格が制定されていないため,電子体温計のJIS 規格(JIS T 1140)に準拠した 本機は予測式ではなく実測式であるが,測定部位から放射される赤外線で温度測定しているため,測定時間が約2秒と非常に早い.

3 測定原理

31 赤外線による温度測定

すべての物体は電磁波を放射している この電磁波の波長と強度はその物体の 温度に依存する.物体の温度が室温付近であれば,放射される電磁波は赤外線領 域になる.温度が高くなれば放射される赤外線の強度も大きくなる.したがって 測定対象物から放射される赤外線の量を赤外線検出器で測定して演算をすれば, 測定対象物の温度を求めることができる 図4に測定系を簡略化したモデルを示 す 対象物の温度をTx,放射率を ε,対象物の周囲の温度をTr,検出器の温度 をTs とする 対象物が検出器の視野よりも大きく,また光学系の絞りなどの視野 外の部分の温度が検出器の温度Ts に等しい場合,検出器への入射赤外線量Iは

となる ここで f(T) はレンズ,検出器の分光特性などによって決まる関数である 放射率は物体の材質と表面状態によってきまり,すべての物体の放射率は0から 10の間の値になる.同じ温度であれば放射率が高いほど単位面積あたりから放射 される電磁波は強くなる ゴム,紙,水,人の皮膚などの放射率は10に近い値 である 一方,金属の光沢面,空気などは0に近い値になる.

IT-500M は赤外線検出器にサーモパイルを使用している.サーモパイルは入射 赤外線量に比例した直流電圧を出力する.

対象物の温度T_sは、周囲温度T_rと検出器の温度T_sが同じ場合、赤外線検出器の感度をq、出力をVとすると

で求められる.

32 汎用の放射温度計との違い

体温計では ± 01 Cの精度が要求される. 一般に市販されている放射温度計で は、これほどの精度を有するものはない. 放射温度計は(2)式によって、赤外線 検出器の出力と検出器の温度から測定対象の温度を算出している. このため温度 センサの出力から直接、測定対象の温度が求められる接触式の温度計よりも誤差 発生の要因が多くなる したがって放射温度計では、接触式の電子体温計と同等 以上の精度を実現するためには、それ以上の精度で検出器自体の温度を正確に測 定する必要がある. IT-500M では、このような面での精度の向上をはかった結果、 ± 01 C の精度を実現できた.

4 性能

ー般に普及している接触式の電子体温計の規格および試験方法はJIS規格(JIST 1140) に定められている.一方, IT-500M のような非接触の体温計の規格は現在のとこ



図 4 放射温度計の測定原理 Principle of measurement of radiation type thermometers



Method of inspecting accuracy of IT-500M



Results of measurement accuracy test



了 周囲温度影響試験結果 Results of peripheral temperature influence test



ろ制定されていない JIS 規格では,電子体温計の精度の試験方法は,被試験機 を恒温水槽に入れ,水槽の温度との比較で行う.しかし放射温度計の場合は恒温 水槽には入れられないため,恒温水槽のかわりに精密黒体炉を使用し,この黒対 炉の表示温度との比較で精度試験を行っている.図5に試験方法を示す.精密黒 体炉は,高精度で温度コントロールされており,放射率が10に近い値になる ようにつくられた空洞と開口部をもつ.

図6,7にIT-500Mの当社での測定データを示す.図6は周囲温度を23℃に保ち, 黒体炉温度を32℃,37℃,39℃,42℃の各温度に設定した時の黒体炉の温度と指 示値の差をプロットしたものである.グラフの太線は電子体温計のJIS 規格をも とに定めた製品仕様での許容誤差である

このグラフより全測定温度範囲にわたって、十分に規格を満足していることが わかる

図7は黒体炉を38℃に保ち,周囲温度を15~35℃に変化させた時の黒体炉温度 と指示値の差をグラフ化したものである グラフの太線はIT-500M製品仕様とし て設定した許容誤差である.このグラフにより周囲温度の影響もほとんど受けな いことがわかる.

5 臨床テスト結果

IT-500M で行った臨床テストの結果を図8に示す.

図8は, 滋賀医科大学第一外科で行った成人26名の水銀体温計による腋下温 測定結果とIT-500Mの測定結果をプロットしたものである

IT-500Mによる鼓膜温測定は、従来の測定方法に対して良好な相関を得られる ことがわかる.

6 おわりに

今回開発した鼓膜体温計IT-500M を使えば早く,簡単に,かつ正確に体温を測 定できる 本機により,病院や診療所などの医療現場での体温測定作業が改善さ れることを期待している.また,一般家庭においても,特に乳幼児のいる家庭に おいて,鼓膜体温計のメリットは大きい.今後はこれらの方面にも普及を図って いきたい.皆様方からのご教示を願っている

参考文献

野崎洋文他,"体温モニターとしての鼓膜温",臨床麻酔, Vol 2, No 2(1978)



松本 直之 Naoyuki Matsumoto 科学計測開発部 主任

1980年入社 赤外線検出器,放射温 度計の開発に従事



辻岡 唯二 Yuiji Tsujioka ^{科学計測開発新 :}

科学計測開発部 主任 1986年入社 放射温度計の開発設計 に従事



迫田 博文 Hirofumi Sakoda

営業推進部 主任 1987年入社 放射温度計の製品企画 から販売に従事



【要旨】

快適で安全な生活空間を提供する各種センシングデバイスへの要求は,信頼性 はもとより高感度,高機能,高速応答など多岐にわたっている.当社では,多年 にわたり培ってきた単結晶育成,真空蒸着などの赤外線技術を駆使し,焦電効果 を利用した赤外線センサを開発,人体検知用として販売するとともに,非分散形 赤外線ガス分析計をはじめ各種の計測機器に搭載し,種々な分野で御使用いただ いている.

本稿では,機能材料としてチタン酸ジルコン酸鉛(Lead Zirconate Titanates: PZT)系 強誘電体セラミックスを使用した焦電形赤外線センサの原理や構造を述べ,当社 の高感度化・高機能化への取り組みの一端を紹介する.

Abstract

Many requirements are placed on the various sensing devices used for providing comfortable and safe living spaces: reliability, high sensitivity, high functionality, and high response. HORIBA has applied extensive know-how in infrared technologies such as single-crystal growth and deposition in developing a pyroelectric infrared sensor, and is marketing this for detecting the human body. It also incorporated in various measuring devices such as non-dispersion type infrared gas analyzers, and is being used in various fields. This paper describes the principles of operation and construction of pyroelectric infrared sensors using Lead Zirconate Titanates, PZT type ferroelectric ceramics as their functional material, and introduces HORIBA's involvement in improving the grade and functions of pyroelectric infrared sensors.

1. はじめに

赤外線センサは、19世紀初頭に赤外線が発見されて以来一般には軍事用として 注目されてきたが、急速なエレクトロニクスの発達により、他のセンシングデバ イスと同様私達の身近なものとなりつつある.とりわけ熱型赤外線センサの出現 がこれに大きく寄与している.

赤外線センサは、大きく分けて半導体材料の光電効果*1を利用した「量子型」 と、素子に吸収された赤外線による熱変化を利用した「熱型」に分類される. 焦 電形は熱型に属し、室温で動作し、波長依存性をもたないこと、安価なことを特 長とする. また熱型ではあるが高感度で、応答速度が速い点で優れている. *1 光電効果 物質が光を吸収して自由電子を生じ、 電気伝導度が変化したり起電力が現れ たりする現象をいう。 赤外線センサの具体的な用途としては、赤外線センサの視野を人が横切ると人 体から放射される赤外線を検知する侵入者警報器や自動ドア、自動照明スイッチ などがある.また燃焼物から発する赤外線のゆらぎを検知して炎センサともなる. さらに、ランベルト・ベールの法則を用いたガス濃度計や放射温度計など応用分 野は広い.

2. 焦電形赤外線センサの動作原理

センサの心臓部である焦電素子には、強誘電体*2の特長を生かして信号を取り 出す方向に自発分極*3を持つようあらかじめ分極処理を施しておく(図1).とこ ろで自発分極の値は素子温度の関数となっており、自発分極によって生じる素子 の表面電荷は、素子温度に変化がなければ図2(A)に示すように周囲の浮遊電荷 によって中和されている.この素子に入射する赤外線量が増加すると、そのエネ ルギーは熱に変換されて素子の温度を上昇させ、自発分極の値が変化する.その 結果、素子表面には過渡的に不要な浮遊電荷が残り、図2(B)に示すように素子と 並列に接続した負荷抵抗には電荷の流れが観測される.このように赤外線の変化 に追随して生じる電流を焦電流、この現象を焦電効果という.





*2 強誘電体

る結晶を示す。

自発分極

う.

*3

自発分極が、周囲の電場によっ

てその方向を反転する事ができ

電場をかけないでも自然に電荷 の分布が存在している状態をい

図 3 センサ内部等価回路 Equivalent circuit



焦電形赤外線センサは、焦電流により負荷抵抗両端に生じた電圧で入射赤外線 量を検出するのだが、焦電素子のインピーダンスが10ⁿΩと高いため外乱影響を 受け易い.そこで焦電素子を金属パッケージに封入し、同時にインピーダンス変 換用のJ-FETも組込んでいる。センサ内部の等価回路を図3に示す.図中のRpは 焦電素子自身の抵抗を、Rgは並列に接続した負荷抵抗(10⁹~ⁿΩ)を示す.図3の ように構成されたセンサに、ステップ状の赤外線が入射した場合の入射赤外線、 焦電流波形、電圧波形の関係を図4に示す.この時の出力電圧のピーク値(V_P)は (1)式で、ピークに到達するまでの時間(T_P)は(2)式でそれぞれ与えられる.

$$V_{p} \propto K \cdot \tau_{t} \cdot \theta^{1/(1-\theta)} \qquad \cdots \cdots \cdots \cdots (1)$$
$$T_{p} = \tau_{e} \cdot \ln \theta / (\theta-1) \qquad \cdots \cdots \cdots \cdots (2)$$

図 4 等価回路点における波形 Waveform at equivalent circuit point ここで,Kは焦電材料固有の値で性能指数と呼ばれ,焦電係数をα,比誘電率を ε,体積密度をd,質量比熱をcとすれば(3)式で表される.

また θ はセンサの電気時定数と熱時定数の比(τ_e/τ_t)を示す.ここで注目すべき 点は出力の大小は性能指数と時定数の両パラメータに関連するものの,波形は時 定数によってのみ決定されることである.また,計測を目的としたような一定の 角周波数で変調した場合の電圧感度Rvは,出力電圧Voと入射赤外線エネルギー Ioの実効値の比,(4)式で定義される.

> $R_{v} = V_{0} / I_{0}$ = $\eta \cdot \alpha \cdot A \cdot R \cdot \omega \cdot G^{-1}$ (4) $\cdot (1 + \omega^{2} \cdot \tau_{e^{2}})^{-1/2} \cdot (1 + \omega^{2} \cdot \tau_{t^{2}})^{-1/2}$

なお η は素子受光面での放射率, Aは素子受光部電極面積, Rはセンサ等価回路 での合成抵抗, ωは変調角周波数, Gは熱伝導率である.

以下,センサ主要部品の特徴と高感度化の要因について紹介する.

2.1 焦電材料の選定と増感処理

焦電材料は形態から大きくセラミックス,単結晶,高分子の3つに分けられ, それぞれ代表的なものにチタン酸ジルコン酸鉛 (PZT),タンタル酸リチウム (L_iT_aO₃), ポリ弗化ビニリデン(PVDF)がある.当社ではPZTを使用しているがこれは焦電係 数,性能指数が高いだけでなく、とくに加工性を重視しているためである.なお, PZTとはPb($Zr_{1-x}Ti_{x}O_{3}$ の頭文字を用いた総称であるが,焦電係数,静電容量, キュリー点*4等の特性を向上させるために種々の元素を固溶*5させた組成として いる.

通常セラミックスの場合,ある大きさの母材から所望の素子小片に切断するの だが,図5(A)に示すように切断後の素子表面結晶粒は押しつぶされており,分 極処理の効果を減少させている.この不具合な部分(以下加工変質部と呼ぶ)をし かるべき手段にて除去した後の状態を図5(B)に示す.加工変質部はなくなり, PZTセラミックス本来の結晶粒が見られるようになっている.また,この除去処 理は焦電効果を効率よく活用するだけでなく,素子表面での赤外線の放射率向上 にも大きな役割を果たしている.

- *4 キュリー点
 強誘電体が常誘電相へ転移する温度をいう。
 *5 固溶体
 - 複数の結晶が均一な固相を成して いる混合物をいう.



(A) 加工後 After slicing



(B) 加工変質部除去後
 After removal of area deteriorated by slicing

図 5 PZT素子表面のSEM像 SEM image of PZT device 図6にこの加工変質部除去前後の赤外線領域の透過率ならびに反射率を示す.透 過率,反射率ともに低減され,素子部分における赤外線が効果的に吸収されてい ることがわかる.この処理によるセンサの感度増加は著しく,実表面積の増加に よる実効放射率の向上が主な要因と判断している.





 国 気 時 正 致 に よ る 心 各 波 形 の 変 1 に Change in response waveform by electrical time constant

2.2 電気時定数及び熱時定数の設定

既述のとおり,信号出力の波形や周波数特性は,電気および熱の2種類の時定 数によってのみ決定される.電気時定数はセンサに内蔵する負荷抵抗の値で制御 している.電気時定数を変化させた場合にセンサから出力される実際の波形を 図7に,式(1),(2)を用いた計算結果との相関を図8に示す.また人体検知の場合 には,検知エリアの大きさと人の移動速度(0.3~3.0m/sec)に加え,検知器設置環 境の熱的揺らぎを考慮して0.1~0.2Hzに最大感度を有するよう設定している(図9). また,熱時定数は,素子周辺への熱伝導と熱輻射を極力抑制するよう,主に素子 形状とその支持方法により制御している.





図 9 電圧感度の周波数特性 Frequency characterstics of voltage responsivity

2.3 光学フィルタの選定

物体から放射される赤外線の特性は、プランクの法則など**<u>6</u>.^{1.8}により知ること ができる.例えば人体から放射される赤外線の場合には、10µm付近にピークをも つ連続的なスペクトルを示すことから、太陽光や照明器具のような短い波長の光 を遮断する窓材(6µmカットオンフィルタ)を選定する(図10).当社では、検出対 象とする物体の温度情報と、光学フィルタの透過スペクトルからセンサに入射す る赤外線エネルギー量を演算処理し、個々の用途に最も適した透過特性の光学 フィルタを設計・生産している.



温度 T (K)の黒体から放射される単位 面積、単位波長当たりのエネルギー量 W λ (W · cm⁻² · cm⁻¹)を示す. $W\lambda = C_1 \cdot \lambda^{12} \cdot [\exp(C_2/\lambda \cdot \tau - 1)]^{-1}$ $C_1 \cdot 3 \cdot 3 \cdot [\exp(C_2/\lambda \cdot \tau - 1)]^{-1}$ $C_2 \cdot 1 \cdot 438 (cm \cdot K)$ *7 ステファン・ボルツマンの法則 温度 T (K)の黒体から半球内へ放射される全エネルギー量W (W · cm⁻²)を示す. $W = \sigma \cdot T^4, \sigma_{1} \cdot 5 \cdot 673 \times 10^{-12} (W \cdot cm^{-2} \cdot K^{-4})$ *8 ウイーンの変位則 ある温度での放射エネルギーのビーク 波長 $\lambda_{\tau}(\mu m)$ を示す. $\lambda_{\tau} = B/T, B_{2} \cdot 2898 (\mu m \cdot K)$

₩6 プランクの法則



図11 パイロエレクトリツク検出器: IPシリーズの内部構造 Internal structure of pyroelectric infrared sensor IP series

3. センサの構造

人体検知用センサの構造を図11に、外形寸法の一例を図12に示す.気密封止と電磁シールドのため TO-5 金属パッケージに収納されている.金属パッケージに開口部を設けそこに光学フィルタを具備し、赤外線透過窓とする.この光学フィルタの基材は半導体材料のシリコン(Si)であるが、樹脂接着ではこの部分でシールド効果が減衰する.当社ではRFスパッタリングで金属パッケージとフィルタ基材間に金属薄膜を形成し、充分な導通を確保している.

PZT素子上には2組の受光部を形成し,分極処理の方向が相反するように接続 し,信号出力させている.これにより光学系を介して入射する赤外線には2組の 受光部がそれぞれ機能するが,同相で影響を及ぼすセンサ周辺の温度変化や機械 的な衝撃などの外乱には出力しない.

負荷抵抗は、アルミナ基板上に厚膜印刷法を用いて焼成されており、J-FETは同基 板下面に表面実装されている.

4. センサ機能への新たな提案

水や空気同様,赤外線もごく身近に存在する人に優しい波であり,今後も活用 されていくであろう.しかしセンササイドからすれば,検知対象周辺には不要な 赤外線が多く存在しているのだから,常に選択性を意識しておく必要がある.

これまでにも可視光影響の低減(図13:特許出願中)や指向性の改良(図14:実用新 案権取得済)について提言してきたが¹¹,ここでも更に新たな方策を提案したい.





図12 IP-240外形寸法 External dimensions of IP-240



4.1 自己判定機能

侵入者警報や火災検知等のセキュリテイ分野では,不慮の事態への迅速な対処 と情報化社会の高度な保安システムへの対応が必須となる.ここに提案するのは, 検知システムの機能を遠隔操作で確認できるいわば「自己判定機能」に適応した センサである(特許出願中).この種の検知器は,定期的に人体や模擬的な炎を用い て動作確認を行うのだが,これには多大な工数を要する.本提案のセンサでは通 信回線を利用し,遠隔操作によってこの定期点検の簡略化を意図している.その 構成は焦電素子上に薄膜抵抗(発熱体)を形成し,この抵抗に通信回路から模擬入力 に相当するパルス電圧を加え,動作確認するものである.図15に人の動きを想 定したパルス電圧とその信号波形を示す.



4.2 的確な炎検知のためのスペクトル処理

炎の多くは固形のすすを含んでおり、2~2.5μm付近にピークをもつ赤外線を 放射する.同時に多量に発生するCO2ガスからも4.3μmにCO2固有のスペクト ルが観測される.これを特定波長領域での温度上昇やCO2の4.3μmに限定した 計測では、例えば太陽光や高温物体との区別は難しい.そこで図16のようにす すとCO2ガスのスペクトルに加え炎独特の谷間の波長を計測する、確度の高い 炎検知を提案したい(特許権取得済).平成3年5月には消防法施行規則の改正に より、赤外線輻射を用いた炎検知器が認可された.この分野での応用製品開発 においても光学フィルタを含めた赤外線センサの活躍が期待される.





(A)	炎のスペクトル
(B)	100℃の黒体放射
(C)	400℃の黒体放射
(D)	1800℃の黒体放射

5. おわりに

センサの新たな応用製品展開として、小型かつ廉価な計測器分野への期待が大 きく、センサの基本特性を生かすには周辺部品のラインアップが必須の条件と成 りつつある. 今後、この分野へも独自の提案を繰り広げたい.

本稿では焦電形赤外線センサに重点をおいて解説してきたが,計測機器への応 用例は本号掲載の各報を,「人の動き」を検知する赤外モジュールに関しては文 献¹¹を参照願いたい.

最後に, 焦電形赤外線センサの応用分野がより一層開拓されることを期待する と共に,本稿が製品企画の一助となれば幸いである.

参考文献

1) 操谷俊之,高田秀次:Readout,No 4,P.83-90(1992)



松本 浩一 Koichi Matsumoto

開発センター 課長 1978年入社 赤外線検出器の研究開発 に従事



岡本 一隆 Kazutaka Okamoto

開発センター 主任 1986年入社 赤外線検出器の研究開発 に従事

ニューマチック赤外検出器

Pneumatic Infrared Detector

青木 Junji Aoki

【要旨】

ニューマチック検出器は当社において長い歴史を持つ赤外線検出器である.ま た他の赤外線検出器にはない多くの利点を有していることから,赤外線ガス分析 計の広い分野でなくてはならない重要な検出器となっている.本稿では,ニュー マチック検出器の動作原理,基本特性,応用例について述べる.

Abstract

HORIBA has a long technical history with pneumatic infrared detectors Having many features not to be found in other type infrared detectors, this pneumatic infrared detector is applied in a wide variety of laboratory and industrial fields This paper describes the principle of operation, basic characteristics, and application examples of the pneumatic infrared detector

1. はじめに

当社における赤外線技術との関わりは、1958年に医学用赤外線ガス分析計 GA-1形の販売を開始したことに始まる.1964年から1971年にかけては、現在、 当社の主力製品である自動車排ガス測定装置を、続いて大気汚染監視装置、煙道 排ガス分析装置など、つぎつぎと赤外線吸収を利用した非分散形赤外線分析計 (Non Dispersive Infrared Analyzer:NDIR)を世に送り出してきた.NDIRは、簡単 な構造・堅牢性・高い選択性・連続分析が可能などの優れた性能により、ガス分 析計の代表として広く用いられている.

これらNDIRの持つ高度な分析能力は,高感度,高選択性を有するニューマチック検出器が重要な役割を担っており,ニューマチック検出器およびその応用技術の進歩に伴い,赤外線分析技術が発展してきたとも言える.ここ十数年来,固体型赤外線検出器を用いた分析計の実用化もあるが,ニューマチック検出器の特長を生かした高性能分析計の需要はますます増大してきている.

2. 検出器の分類

赤外線検出器は検出原理から大別すると熱型と量子型に分類され,それぞれ 表1のような特性がある

種類	機構	名称	有効波長域	時定数	温度影響
	抵结刑	サーミスタ			
	14.1几至	ボロメータ			
	熱電体型	サーモパイル			室温での
熱型	ニューマチック型	コンデンサマ イクロホン	全赤外域	10 ¹~10 ⁴秒	使用可
		ゴーレイセル			
	焦電型	焦電素子			
		PbS	0 7~3 8 μ m		
	光導電型	PbSe	0 8∼6 6 µ m		高感度化
루고페		HgCdTe	5∼16 µ m	10 %秒以下	には冷却
重于型	水滨鱼型	InAs	0 6~3 2 μ m		が必要
	兀碍龟坐	InSb	06~56µm		
	光電磁型	InSb	2~7 µ m		

表1 赤外線検出器の分類と特性 Classifications and characteristics of infrared detector

21 熱型

この型の検出器は赤外線の熱的効果を利用するもので,検出素子の温度上昇に よって生じる物理的性質(電気抵抗,熱起電力,熱膨張,焦電効果など)の変化を赤 外線量の変化としてとらえる.このため感度は一般的に波長依存性がない.検出 器の時定数は検出素子の熱容量および熱伝導により定まり,ミリ秒(ms)程度であ る.ニューマチック検出器は熱型に属し,封入ガスの圧力変化による膜の変位を 電気容量変化として捉える,コンデンサマイクロホン型が多い

22 量子型

量子型センサは、赤外線を光量子としてとらえるため、感度が高く、応答速度 も速い.ただし、検出素子に用いる半導体の禁制帯幅(バンドキャップ)に近い波 長の赤外線には感度が高いが、それ以外の波長に対する感度は低く、波長依存性 を有している

量子型は,バンドキャップにより長波長側の検出限界(遮断波長)が決まり,両 者の間には(1)式の関係がある.

λ。: 遮断波長 (μm), Eg: バンドギャップ (eV)

3. ニューマチック検出器の構造と動作原理

当社のニューマチック検出器はNDIRに組み込むことを前提としており、ここではNDIR用検出器の観点から基本構造と動作原理を述べる

31 基本構造

NDIRに用いられているコンデンサマイクロホン型ニューマチック検出器の基



図1 コンデンサマイクロホン型ニューマチック 検出器の構造 (複光路形) Structure of capacitor microphone-type pneumatic detector (complex light path type) 本構造を図1に示す.NDIRの吸収セルの構造には,大別すると複光路と単光路 の2種類があるが,基本的にニューマチック検出器は2つの圧力室から構成され ている.圧力室の中には,赤外活性な測定成分と同種のガスがある分圧で封入さ れている.一方,両圧力室内の間にはコンデンサマイクロホンを設けてあるが, その一部分に両室間のガスがゆっくりと通過(スローリーク)できる構造をとって いるため,周囲温度変化などの外乱による検出器内の圧力バランスへの悪影響を 抑えることができる.

検出器の赤外線透過窓には光学結晶(BaF₂, CaF₂, LiFなど)が用いられ,測定波 長域の赤外線を効率よく透過させるとともに,測定に不要な長波長域での赤外線 をカットする働きをする.さらに検出器前部の赤外線光路上には,吸収波長が重 なり合う成分による干渉影響を低減するため,透過波長帯域を制限する光学フィ ルタ(多層膜干渉フィルタ)を入れることが多い.

3.2 動作原理

(1)NDIRの測定原理

一般に赤外活性なガス分子は、赤外線の照射を受けると、その分子固有の振動 数と同じ振動数の赤外線を吸収する.NDIRはこの吸収エネルギーを測定するこ とにより定量分析を行うものである.

赤外線吸収の程度は、それぞれの成分ガス濃度に応じて変化する.この関係は (2)式のランベルト・ベールの法則により表される.

I。:入射光強度, c :ガス濃度, μ :ガス固有の吸収係数 I :透過光強度, ℓ :ガス層の厚さ

I_o, μ, Iは測定ガス種や装置により決定される定数であるため,透過光強度I を測定すればセル中で吸収された赤外線の量すなわちガスの濃度がわかること になる.

(2)検出器の動作原理

図2にNDIRガス分析計の構成と動作原理を示す.



図 2 NDIRガス分析計の動作原理図 Principle of operation of NDIR gas analyzer 光源からでた赤外線は測定セルおよび比較セルを通る.測定セル内の測定成分ガ スの濃度が変化すると、それに対応した吸収量の変化が起こり、赤外線の検出器 に到達するエネルギー量が変化する.一方比較セルでは、赤外線を吸収しないガ スが封入されているため、常に一定のエネルギーが検出器に送り込まれる.この 結果、検出器に入射する2つの赤外線量に差を生じる.この二つの赤外線を回転 する光チョッパにより断続すると、検出器内の封入ガスが赤外線を吸収すること により膨張し、二つの室を隔てているコンデンサマイクロホンの可動極を振動さ せ、交流電気信号として取り出すことができる.

ニューマチック検出器が他の赤外線検出器と異なるところは、検出器内に測定 成分ガスを適当な分圧で封入している点にある 封入ガスが固有の赤外線を吸収 するため、検出器そのものに高い選択性を持たせることができる.この特性が、 NDIRが幅広い分野で使われる最大の要因となっている.

4. ニューマチック検出器の基本特性

41 感度の周波数特性

ニューマチック検出器の動作過程は、前章で述べたように、受光室の封入ガス が断続的に照射された赤外線により温度上昇する過程と、温度上昇による熱膨張 にともなう圧力変化によりコンデンサマイクロホン可動極が振動する二つの過程 よりなる.

(1)封入ガスの赤外線吸収による温度上昇過程

封入ガスの温度上昇過程を図3に示す 封入ガスの熱容量をH,等価熱伝導率 をG,光チョッパが開いている間に入射する赤外線強度をLとし,ガス温度の上昇 を Δ Tとすると,検出器の系外へはG- Δ Tの熱が失われることになる.この時生じる検 出器の熱的変化の動的な過程は(3)式および(4)式で表される.また図4はニュー マチック検出器の温度上昇の周波数特性を示す 赤外線吸収による温度上昇特性 は、封入ガスの熱容量Hと等価熱伝導率Gの比により定まる.周波数との関係で は、 ω =G/Hより低域では一定となり、高域側では低下していくことがわかる.

$$\begin{split} \eta \mathbf{L} &= \mathbf{H} \cdot \frac{d\Delta \mathbf{T}}{dt} + \mathbf{G} \cdot \Delta \mathbf{T} & \cdots \cdots \cdots (3) \\ \mathbf{C} \subset \mathbf{C} \quad \frac{d}{dt} \rightarrow \mathbf{j} \mathbf{\omega} \quad \mathbf{\xi} \neq \mathbf{Z} \mathbf{\xi} \\ \\ \left| \frac{\Delta \mathbf{T}}{\mathbf{L}} \right| &= \frac{\eta}{\mathbf{G} \left(1 + \left(\mathbf{\omega} \mathbf{H} / \mathbf{G} \right)^2 \right)^{1/2}} & \cdots \cdots \cdots (4) \end{split}$$

(2) コンデンサマイクロホンの周波数特性

図5に受光室の圧力変化を示す.赤外線吸収により受光室内の封入ガスは,温度がΔT上昇すると,圧力はΔP上昇する.このとき封入ガスは,二つの受光室間の圧力差に応じて,両室間のリーク孔(リーク抵抗R_L)を通して流量Qでリークする.いま,nを封入ガスの分子数,Rをガス定数とすると,気体の状態方程式よりこの時生じる圧力変化の動的過程は(5)式,(6)式で表される







図 6 コンデンサマイクロホンの周波数特性 Frequency characteristics of condenser microphone



図 7 リーク抵抗がコンデンサマイクロホンの 周波数特性におよぼす影響 Influence of leak resistance on frequency chacteristics of condenser microphone



図6にコンデンサマイクロホンの周波数特性を示す.

図6に示すように、リーク抵抗R_Lと受光室容積Vによりコンデンサマイクロ ホンの周波数特性は、高周波数域では一定の出力となり、低周波数域ではリーク のために出力が低下することがわかる.

当社の,コンデンサマイクロホンの周波数特性の一例を図7に示す.なおこの 測定は,容積一定の圧力室にコンデンサマイクロホンを取り付けて,その圧力室 にピストン駆動により圧力変化を生じさせマイクロホンの出力を測定することに より行った このとき,マイクロホンのリーク抵抗をパラメータとして測定した. この図からも圧力室の容積が一定の時には,コンデンサマイクロホンの低周波数 領域の応答性はリーク抵抗により決まることがわかる.

(3)ニューマチック検出器の周波数特性

当社のニューマチック検出器の周波数特性の一例を図8に示す.

本検出器の周波数特性は、コンデンサマイクロホンの特性と、赤外線吸収の特 性を重ね合わせたものとなっている.低周波数領域側ではコンデンサマイクロホ ンのリーク特性のための出力低下が、高域側では赤外吸収特性からの出力低下が みられる.このように、ニューマチック検出器の周波数特性は、封入ガスの熱容 量、等価熱伝導率、および受光室の容積とリーク抵抗などにより決定される.



図 9 封入ガスの濃度が検出感度と水分干渉に 及ぼす影響 Influence of filler gas concentration on detector sensitivity and water interference



42 封入ガス濃度と検出感度

ニューマチック検出器の検出感度は,封入ガス中の赤外線吸収特性,熱伝導率, 粘性などによって決まる.とくにに封入ガスの濃度は重要であり,検出感度のみ ならず干渉影響をも左右する場合がある.図9¹¹に,封入ガス濃度と検出感度お よび水分干渉の関係を示す.

43 干涉影響

NDIRでは、試料ガス中に目的成分の赤外吸収スペクトルと重なりあう吸収スペクトルをもつ成分に対しては、干渉影響が現れる場合がある. ニューマチック

検出器を用いていても、干渉ガス成分の濃度によっては、測定精度への影響が無 視できなくなることがある.このような場合、次に示す方法により干渉影響を取 り除いている.

(1)多層膜干渉フィルタの使用	:	目的成分と干渉成分の吸収スペクトルが重な
		らない波長領域を多層膜干渉フィルタで選択
		する.
(2)ガスフィルタの併用	:	干渉成分ガスを封入したガスフィルタを測定

光路中に入れ,干渉成分の吸収スペクトルに 相当する波長領域だけを選択的に取り除く.

5. 応用例

当社では、ニューマチック検出器の構造や使用方法の開発・改良をつ常に行い、 NDIRによる分析のより一層の高精度化に努めている.以下にいくつかの例を示す.

51 補償用検出器による干渉および外乱影響の低減

この方式は図10に示すように2個の検出器を同一光学系に直列に並べて配置す る.測定用検出器(MAIN)と補償用検出器(COMP)とから構成され,MAIN側では 測定成分(A)と干渉成分(B)の合成信号(A+B)を取り出す.一方,COMP側では(B) を取り出す.これらの信号を増幅し,MAINとCOMPの差を減算器により演算し, 目的の測定成分(A)のみの出力を取り出す.

この結果,干渉成分の影響を受けずにきわめて高精度な測定値が得られる.ま たこの方法によると,振動など外乱影響を取り除くことも可能となり,測定の安 定化を一層図ることができる.



Findple of operation of NDIA gas analyzer using compensation type

52 クロスモジュレーション方式

クロスモジュレーション方式の原理を図11に示す.

流体変調方式(サンプルセルに比較ガスと試料ガスを交互に流す)を用いたクロ スモジュレーション方式をNDIRに適用することにより,ゼロ点の経時変化がな く(ゼロドリフトフリー),機械チョッパ方式では必要であった光学調整も不要と なった.また複光路形において,2本のセルに交互に試料ガスと基準ガスを流すこ



図11 クロスモジュレーション方式のNDIRガス分析計の動作原理 Principle of operation of cross modulation-type NDIR gas analyzer

とで,機械チョッパ方式に比べると約2倍の感度が得られるようになった. さら に比較ガスの工夫により干渉影響をキャンセルすることもでき,測定精度を飛躍 的に向上させることができる利点も有している.

5.3 複合検出器

図12に複合検出器の原理図を示す.



Principle of operation of NDIR gas analyzer using composite detector

煙道排ガス測定など,高濃度のCO2ガス(最大25%程度)中にある微量のNO(通常 10ppm以下)を測定するような場合には,補償用検出器だけではCO2の干渉影響を 完全には取り除くことは困難である.このように測定対象のガス濃度に対して, 干渉ガス濃度が2500倍と極端に高い場合の対応として,従来の補償用検出器の使
用に加え、同光学系内に干渉成分であるCO2濃度のみを測定する焦電検出器を設ける.この焦電検出器の出力を用いて、補償用検出器付ニューマチック検出器との減算を行い、高濃度の干渉ガス中の微量測定成分濃度を安定して測定できるようになった²¹.図13には、従来の補償用検出器と焦電検出器の付いた複合検出器を用いた干渉影響のデータを示す.

6. おわりに

当社において赤外線分析技術は40年近い歴史を有するが,現在でもその重要性 は決して変わっていない これは,赤外線吸収法の原理的な優位性と,この原理 をいかんなく使いこなせる周辺技術の追求があってこそ,可能であったといえる. このような環境の中で,ニューマチック検出器を始めとする様々な赤外線技術を生 み育てている 今後も赤外線吸収法の利点を生し,地球環境問題の解決に貢献でき ることを願っている.



図13 NOガス分析計におけるCO2ガス干渉影響 Influence of CO2 gas interference in NO gas analyzer

参考文献

1) 今木隆雄, "定点観測用CO2濃度観測システム", Readout, No 1, p 33-39 (1990)

2) 佐竹司,他"ガス分析計",日本国特許公告平成5年29060



 青木 潤次 Junji Aoki
 生産技術部 係長
 1978年入社
 NDIRガス分析計の研究開発に従事 特/集/論/文 「赤外線ではかる」 Feature Articles

赤外線ガス分析計を支える高機能赤外線多層膜干渉フィルタ

Highly Functional Infrared Multilayer Interference Filter for Supporting Infrared Gas Analyzers

> 石田 正彦 Masahiko Ishida

【要旨】

永年にわたる当社の赤外線ガス分析計を支えてきたキーコンポーネントに、赤 外線多層膜干渉フィルタがある.この高機能赤外線多層膜干渉フィルタの温度特 性を始めとした基礎的なパラメータを詳細に報告するとともに、このキーコン ポーネントが当社の赤外線ガス分析計の高性能をいかにして支えているかを述べ る.これにより先に筆者が既報 (Readout, 1, p 47 (1990))で、提唱したMDIR (Moderate Dispersive Infrared Analyzer)の詳細な例証の一つとしたい.

Abstract

Infrared multilayer interference filters are a key component that have supported HORIBA's infrared gas analyzers for many years. This paper reports in detail the temperature characteristics and other basic parameters of these highly functional infrared multilayer interference filters, and describes how this key component supports the high performance of HORIBA's infrared gas analyzers. Accordingly, we would like to refer to a report already issued by the author (Readout, 1, p 47 (1990)) by way of a detailed illustration of the proposed MDIR (Moderate Dispersive Infrared Analyzer).

1. はじめに

当社の赤外線ガス分析計は、ユーザの皆様にご愛用いただき始めてから30年以 上が経過した。その間に各種の要素技術を開発してきた。赤外線多層膜干渉フィ ルタ(以下干渉フィルタという)の設計・開発・製作技術もその一つである。現在 では、赤外線ガス分析計の仕様に応じて各種仕様の干渉フィルタを開発し、かつ、 分析計の性能を維持するために干渉フィルタの規格を厳しく管理維持している。

なお、干渉フィルタの概論およびそれが使用されている赤外線ガス分析計の原理 などについては筆者の既報¹¹を参照されたい.以下具体例に即して説明する.

2. 干渉フィルタの温度特性

干渉フィルタは通常室温での使用を想定して設計し製作している.したがって, 使用温度が変動する場合には,干渉フィルタの特性がどのように変化するかを予 め把握しておく必要がある.

2.1 温度変化に伴う分光スペクトルの変化

干渉フィルタの温度が変化するとその分光スペクトルも変化する.そしてその 変化は干渉フィルタに使用する蒸着材料・膜の構成などに依存する.

2.1.1 バンドパスフィルタの場合

図1にハイドロカーボン測定用のバンドパスフィルタ(Band Pass Filter: BPF)の 温度特性を示す.



この図が示すように、一般に干渉フィルタは、温度が上昇するとその分光スペク トルは長波長側へシフトする.ただし、この程度の温度変化では分光スペクトル はほぼ相似形と考えてよく、赤外線ガス分析計で使うときには中心波長がいくら 長波長側へシフトしたかを考慮すれば良い.もちろんフィルタの使用温度がより 高温(例えば100℃)になる場合にはそのスペクトル形状の変化をも考慮する必要 があるが、通常は相似形として処理して差し支えない.BPFの分光スペクトルの 変化はとくに分析計の各種の性能に影響を及ぼす.たとえば、濃度校正曲線の曲 がりや干渉ガスに対する特性などに影響する.

2.1.2 ロングウェーブパスフィルタの場合

ロングウェーブパスフィルタ(Long Wave Pass Filter:LWPF)も温度が上昇する と、その分光スペクトルは長波長側へシフトする(図2). この図では、室温での 分光スペクトルは省略(このスケールでは53℃のスペクトルと重なり見にくくな るため)しているが、室温から53℃への変化は、図1の場合と同様に、透過波長 が長波長側へシフトするだけで分光スペクトルの形状そのものは相似形と考えて 良い.分析計ではLWPFは、BPFのように分光特性的に厳しい条件下で使用する 場合は少なく、通常の使用温度(室温~60℃)では比較的手軽に使用できる. しか し、放射温度計のように透過帯全ての波長域を使用するような場合には、その温 度変化による使用波長域全体の分光特性変化(立ち上がり波長及び透過率)をも考 慮する必要がある.



図 3 干渉フィルタ温度変化の概念図 Schematic of interference filter temperature change



図 4 バンドパスフィルタの実測温度特性 Measured temperature characteristics of band pass filter



図 5 ロングウェーブパスフィルタの実測温度特性 Measured temperature characteristics of long wave pass filter



Temperature characteristics of long wave pass

2.2 干渉フィルタの温度特性メカニズムと実測データ

当社で使用している干渉フィルタのほとんどは,温度が上昇すると分光スペクトルは長波長側にシフトする.干渉フィルタが温度変化する概念図を図3に示す. ここでは,物理膜厚dと屈折率nの2つの変化を表わしている.温度上昇とともにdが大きく(d*に)なり,かつnの値も大きく(n*に)なる.すなわち,nとdとの積である光学膜厚ndの変化が分光スペクトルが変化する原因である.そして,熱膨張によるdの変化よりもnの温度特性による変化の方が数倍以上大きい.

BPFでは,設計波長(λo)の2倍の光学膜厚を持つ層をキャビティ層と呼び, この層がBPFの特性の多くを決定する.したがってキャビティ層が,どういう蒸 着材料で構成されているかということが,温度特性を考慮する上でも重要となる. 通常,干渉フィルタは高屈折率材料の1/4波長層(Hで表す)と低屈折率材料の1/4 波長層(Lで表す)とより成る交互多層膜で構成される.したがって,BPFは大き く分けるとHHキャビティ型とLLキャビティ型に分けることができる.赤外域で は蒸着材料として,H層としてはゲルマニウム(Ge)が,L層としては一酸化珪素 (SiO)や硫化亜鉛(ZnS)が多用されている.したがって,干渉フィルタは材料的に はGe-SiO型とGe-ZnS型とに分けることができる.この内,BPFで多用されてい るGe-SiO型の干渉フィルタにおける,両タイプの実測温度特性データの一例を図 4に示す.HHキャビティ型の方が,LLキャビティ型よりも温度変化によるシフ ト量が約3倍大きい.次に,両面併せて約120層程度の膜構成より成るGe-ZnS型 LWPFの実測温度特性データを,図5に示す.この干渉フィルタは,BPFのHH キャビティ型と同程度の温度特性を示している.

2.3 干渉フィルタの温度特性が分析計の性能に及ぼす影響度の評価

次に、干渉フィルタの温度特性が、どの程度分析計の性能に影響するかを見積 もってみる。今、分析計のベンチが温調されていないとして、周囲温度が20℃か ら50℃に変化したとする。すると、それにつれて干渉フィルタの温度も同様に変 化する。使用されていた干渉フィルタが、図4のHHキャビティ型(1例として中 心波長が2268cm⁻¹のものを用いる)だとすると、その分光スペクトルの長波長側 へのシフト量は、

= $2268 \text{ cm}^{-1} \times 1.2 \times 10^{-4} / ^{\circ}\text{C} \times 30 ^{\circ}\text{C} \Rightarrow 8 \text{ cm}^{-1}$

すなわち,2268cm⁻¹が2260cm⁻¹にシフトすることになる.

この変化がガス分析計の濃度校正曲線の曲がりに及ぼす影響を図6に示す.



Measured and calculated values of CO_2 calibration curve using 3 interference filters of central wavelength

実測データが計算値に比べて曲がりがきついのは,実測データでは光がセル管内 壁の反射等により干渉フィルタに対して斜めに入射しているために,実際の干渉 フィルタの垂直入射分光特性よりも,短波長めに作用しているためと考えられる. 前記8cm⁻¹のシフトは,曲がりがおよそ図6の②から③へとリニア側に変化す ることに相当する.したがって,この程度の変化が分析計の仕様上許される場合 には温調は要らないが,そうでなければ温調を考慮する必要がある.ここでは, 濃度校正曲線の曲がりのみ考慮したが,前記シフトは干渉ガス特性や分析計の感 度ドリフトなどにも影響するので,それに対する考慮も必要になる.

以上は、温度変化に伴う波長シフトの観点からの議論であるが、たとえば温度 が一定でも、透過中心波長が一定以上ばらついていたのでは、分析計としての仕 様を満たさないことになる.分析計の仕様に応じてそれぞれの中心波長に厳しい 規格を決めている.この規格の厳しさのイメージをつかんで頂くために、 使用している薄膜材料であるゲルマニウムの実際に蒸着しようとする一層の物理 膜厚の大きさと比較してみる. 例えば,中心波長が2300cm⁻¹(=4.3 μ m =4300nm)で 規格幅が10cm⁻¹であるとすると規格幅は透過中心波長に対し約0.43%に相当す る. 中心波長と設計波長との関係は、4.3 μm=4nd になる. 屈折率n を4.2とす ると、蒸着すべき一層の物理膜厚dは256nmとなりその0.43%は1.1nmになる. ゲルマニウム単結晶の格子定数が 0.57nm であるから 1.1nm は約2原子層に相当 する.いいかえれば、光学薄膜一層当たりゲルマニウム2原子層が制御目標であ るといえる、さらに通常の干渉フィルタが数十層以上の交互多層膜より構成され ていることを考え合わせれば、いかに高精度な部品であるかを例示できたものと 思われる、このように分散形分光器の精度にも匹敵するような高品位のキーコン ポーネントを駆使することにより、当社の分析計の高性能が支えられている。こ の点を筆者はMDIR化への傾向の1つとして捉えている.

3. 干渉フィルタの斜め入射効果

斜め入射による干渉フィルタの分光スペクトル変化は、既報¹¹にも述べた通り 短波長側にシフトする.入射角度が大きいほどシフト量も大きい.以下にその検 証を行う.温度特性の場合と同様に、HHキャビティ型BPFとLLキャビティ型BPF とに分けて説明する.図7(A)にHHキャビティ型の計算データを、図7(B)にHH キャビティ型の実測データを示す.図7~図8の斜め入射は、いず れも平行光が斜め入射したときの現象である.それぞれ対比してみると有益であ る.両タイプとも、入射角度が約30°程度までは、スペクトル形状はほぼ相似形 と考えて良い(但し、図8(B)において30°入射スペクトルにおいて、垂直入射に おいては目立っていた透過帯のリップルが、かえって小さくなっている).より 高角度の斜め入射になると、中心波長のシフトばかりでなく、そのスペクトル形 状の変化も考慮しなければならないことがわかる(形状が大きく崩れだし、透過 率の落ち込みも大きくなる).



図 7 HHキャビティ型BPFの斜め入射によるスペクトル変化 Spectral changes by inclined incidence of HH cavity-type BPF

図8 LLキャビティ型BPFの斜め入射によるスペクトル変化 Spectral changes by inclined incidence of LL cavity-type BPF

シフトの度合いは、HHキャビティ型よりもLLキャビティ型の方が大きい.こ れは、温度特性と逆の傾向である.それは、計算データおよび実測データの両方 とも同じ傾向になっている.これらの結果を中心波長のシフト率としてまとめた ものが図9である.温度特性による実測シフト量は、HHキャビティ型がLLキャ ビティ型の約3倍であったが、角度効果によるシフト量は、実測でLLキャビティ型 がHHキャビティ型の約2.5倍であり、計算では同じく約3倍となっている.角度 効果については、入射角度とシフト量との間には直線的な関係はないが、各入射 角度におけるキャビティ間の波長シフト率はほぼ一定している.これは温度効果 と角度効果は、キャビティ間でおよそ相補的な変化をすると考えられる.そして 2.3と同様の手法で、角度効果が分析計の性能に及ぼす影響度を推定することも できる.

4. 干渉フィルタの他の基礎的パラメータの確認

4.1 干渉フィルタのアテネーションレベルの誤差解析

干渉フィルタにとって、透過帯と同様に重要な特性として、アテネーションレベル(遮断特性)がある.アテネーションレベルには、光を一定レベル以上通さないという意味と一定レベル以上の光を通してオプティカルバランサー"(AS検出器用)の役目をするという2通りの意味がある.したがって、そのレベルが設計した通りに実現できているかは、大変重要な意味を持つ.その確認の1つの手段として、ランダム関数を用いた膜厚誤差解析を用いることができる.図10にGe-ZnS型でおよそ70層のLWPFの膜厚誤差解析のシミュレーション結果を示す.ここで誤差の程度として、光学膜厚でGe層を±0.5%、ZnS層を±1.5%として見積もった.この膜厚誤差は実際の膜厚誤差の2~3倍となっており、充分に安定な膜構成であることが確認できた.

4.2 薄膜の表面分析

X線光電子分光分析(Electron Spectroscopy for Chemical Analysis: ESCA)により,干 渉フィルタに使用されている薄膜の極表面を調べてみた.使用した装置はアル バック・ファイ社製の Model 5400 である.測定時の真空度は 10^{-8} Pa(10^{-10} Torr)台で あり,スパッタ中は 10^{-6} Pa(10^{-8} Torr)台であった.調査に供した干渉フィルタは Ge-SiO型である.図11にESCAでスパッタした干渉フィルタの外観を示す.干渉 フィルタの大きさは,6.5mm角である.図中,円形の部分(5mm ϕ)が SiO層がア ルゴンスパッタにより取り除かれて Ge層が露出している所である.それ以外の 部分は SiO層である.

図12に、アルゴンイオン銃を用いて行った極表面の深さ方向分析の結果を示す. ここで興味深いのは、SiOの最上表面がSiO2に変化している点である.SiOは半 導体産業の勃興期にパッシベイション膜として使用されていたぐらい安定な材料 であるが、それでも空気と接触する最上表面はより安定なSiO2になっていること がわかる.ところでスッパッタレートはSiO2換算で約0.4nm/minであったから SiO--->SiO2への変化層はおよそ1nm(この層は赤外域の分光特性には、全く影響 しない)と見積もることができる.ただし、この変化層は急峻ではなく穏やかな 変化層であるといえる.このときのスパッタ加速電圧は1KVと極力膜の破壊性 を抑えるように工夫した.したがって、このデータは膜の深さ方向の様子を、比 較的忠実に再現しているといえる.スパッタ開始後約3分以降のデータは、SiO 膜のストイキオメトリー(原子組成比)がSi:O=1:1であることからSiO膜として 理想的な状態が実現できていることがわかった.

つぎに、同じようにしてSiO膜をアルゴンスパッタで掘り抜いて、次のGe層に 到達した表面のワイドスキャン結果を図13に示す.このワイドスキャンは、水素 以外の全ての元素を検出でき、もし鉄などの不純物が含まれていたとしたら確実 にチェックできるようになっている.図13でわかるように、Ge以外の元素は検 出されておらず、Ge層も理想的な薄膜が形成されていることがわかる.



図 9 バンドパスフィルタの斜め入射効果 Effect of inclined incidence of band pass filter



5. それぞれのガス吸収スペクトルに対応した各種干渉フィルタ

以上のような基礎的なパラメータを押さえた上で,実際の分析計に搭載する干 渉フィルタは,測定対象であるガスの種類や濃度,試料ガス中に混在する干渉ガ スの影響,さらに分析計の構成などにあわせていろいろな種類のものを製作して いる.図14は,自動車の排ガス分析用として,最もよく用いられる3種類のガス (HC・CO₂・CO)の吸収スペクトルとそれに対応する各々2タイプの干渉フィル タを示している.図15にはCOガス吸収スペクトルと4つの機種のCOガス分析計 に適用している干渉フィルタを示した²⁾.これらはそれぞれの分析計にマッチ ングするように,透過帯のみでなくそのアテネーションレベルをも考慮して開 発したものである.







6. おわりに

ガス分析の分野にも、FT-IRやガスクロマトグラフィー、マススペクトロメト リーなどそれぞれに特長ある技術が採用されつつある.これらは、それぞれ永年 にわたる研究開発によってはじめて成し得た幅広い波及効果を伴ったすばらしい 技術である.以前、FT-IRがセンセーショナルな話題にされだした頃、もう非分 散の分析計は要らないのではないかという議論が活発になされた時期があった. 筆者は、必ず生き残ると確信していたのであるが、実際それ以降の技術動向を 見てみると、赤外線吸収を用いたガス分析技術はNDIR (Non Dispersive Infrared Analyzer)から、MDIRへとグレードアップしてますます発展しているとの感が強 い.これを一言で言えば、ユーザの皆様からコストパフォーマンスのよい連続分 析計を提供しているとの好評を頂いていることにつきると思われる.今後とも当 社の分析計を安心してお使い頂けるよう高品位のキーコンポーネントの研究開発 に邁進して行きたい.

参考文献

1) 石田正彦"赤外線ガス分析計と赤外線多層膜干渉フィルタ" Readout, 1, p47 (1990).

2) 特開平2-116737号



石田 正彦 Masahiko Ishida

ı.

•

開発センター 課長 1975年入社 光学機能部品及び薄膜多層化 技術の研究開発に従事



旋光計によるアミノ酸,ペプチ ドおよびタンパク質の研究

Studies of Amino Acids, Peptides and Proteins by Polarimeter

1. はじめに

私はちょうど40年前の1953年にJP Greenstein研(米国NIH)に留学した.彼の光学 分割(酵素利用)によるタンパク性アミノ酸の合成研究は、当時世界一に活発なもの であった.彼はこれらL-アミノ酸を栄養化学(必須アミノ酸の正確な必要量決定)や オリゴペプチド合成の材料としていた.さっそく私に与えられたテーマはDL-tLeu(図1)の 光学分割であった.このtLeu(非タンパク性アミノ酸)には不斉炭素(C*)が1つあるので、 L-tLeuとD-tLeuの光学対称体が存在することになる.当時この2種類は誰も合成 していなかった.ただKnoop(1923)はDL-tLeuをイヌに食べさせ、その尿より光学活 性tLeu([α]_p-10(π))を分離し、それは不消化物なのでD-tLeuと推定していた.私 はAc-DL-tLeu(Ac,アセチル)にアシラーゼを反応させ、L-tLeu([α]²⁵_p-95(c2, π))と Ac-D-tLeuを分別した.このAc-D-tLeuを熱HCIで脱Ac化して、D-tLeu([α]²⁵_p+95)を結 晶化した.この結果はKnoopの推定をくつがえすものであり、決め手となったのは 旋光計による[α]_pである¹¹.

昭和20年代の留学生は米国の豊富さに圧倒されたわけであるが、私にとっても次の二つは驚くべきことであった。一つはGreensteinよりLとDのtLeuを100g程度合成せよ、と言われたことだった。当時、日本のアミノ酸合成屋は01~1gを合成(低研究費のため)しては、せっせと論文を書いていた。第二は旋光計の大型のことであった。日米とも原理は同一の直視式(半影式)で、暗室での実験が必要であった。私が九大で使用した試料管(セル)は長さ10cm、直径3mm程度であったが、米国のは管長40cm、直径1cmのセルで正確な[α]。測定が可能であった。

直視式旋光計は光学的測定装置としては最も早く完成し(1800年初め),有機化学の発展に重要な役割を演じてきた.近年では物理的測定として赤外分光光度計や NMR装置などが活躍しているが,旋光計は依然として他の方法では得られないユニー クな結果を与える.以下には,アミノ酸に重点をおいて旋光計の有用性を説明する.

2. 比旋光度と分子旋光度

光学活性物質を含む溶液をセルにつめて平面偏光を通過させると、その偏光面 は回転するが、その値をα(旋光度)とする.このαはセル長(ℓ)と溶質の濃度(c)に 正比例するので、比例定数はその物質にとって一定となり、これを比旋光度と称す る.



九州產業大学教授 泉屋 信夫

Nobuo Izumiya, Dr.Sci.

理学博士 九州大学名誉教授

<略歴>	>
1944年	九州帝国大学理学部
	卒業
1945年	海軍技術中尉
1946年	同大学医学部助手
1956年	九川大学理学部助教授
1962年	同大学理学部教授
1985年	同大学名誉教授
	久留米工業大学教養部
	教授
1989年	九川産業大学工学部
	教授

<主な要職,授賞> 日本生化学会常務理事(1978) 日本化学会理事(1980) 日本化学会賞(1983)

<主な著書> ペプチド合成の基礎と実験 (丸善) 生物化学序説(化学同人)



$\left[\alpha\right]_{\lambda}^{`} = \frac{\alpha}{\cancel{2}\times c} \times 100$	(1)
$[\alpha]_{D}^{20} = \alpha \times \frac{100 \text{ g}}{\text{c g}}$	(2)
$[M]_{\lambda}^{t} = [\alpha]_{\lambda}^{t} \times \frac{MW}{100}$	(3)
$[M]_{D}^{20} = \alpha \times \frac{10 M}{z M}$	(4)

(1)式は比旋光度の定義であり±は温度(\mathbb{C}), λ は単色光の波長, gはセル長(10cm のときgとする), cは溶液100ml中の溶質のg数である.(2)式は測定に便利なものであり, DはNaの単色D線, gは10cmである.(3)式は分子旋光度の定義であり, MW は分子量である.(4)式(泉屋の式)において試料はzMとして作製され, gは10cmである.[α]_bあるいは[M]_bの数値には, cと溶媒の種類(これは絶対に必要)を括弧内に記述する.

実験に際して,観測する眼の位置から見て,平面偏光が時計方向にまわるとき右旋性((+)-,d-とも言う),反時計のときは左旋性((-)-,l-)となる.アミノ酸のように,同種族であるが分子量の異なる化合物の旋光性を比較・議論するには,分子旋光度が便利である.他の方向からの分子旋光度の有用性を,実例について説明しよう.L-リシンには純粋物質として3種類のL-Lys,L-Lys・HClおよびL-Lys・2HClが存在するが,それらの[α]²⁰_p (5M HCl)は+25 9,+20 7および+17 3である.しかし[M]²⁰_p (5M HCl) はいずれも同一の+37 8となり,取り扱いが簡単となる.ただし,光学活性物質の構造式が不明(したがって分子量も不明)のときは,[α]_pを測定せざるを得ない.この[M]²⁰_p 測定に便利なものとして,私は数年前に(4)式を導入したが,最近では日米の研究室で採用されつつある.この式からわかるように,[M]²⁰_p とは理論の上で試料管(長さ10cm,容積100ml)に溶質の10M溶液をつめたときの α であり,これは1個の不斉分子と偏光との干渉値の総和(6×10²³倍)となる.

装置として長い間(1800~1965頃),直視式旋光計が使われてきた.私の昔の論文 (日化誌,1951)に,L-メチオニンの[α] $_{D}^{0}$ +234(5M HCl)の記述がある.渡米して Greensteinと雑談中,彼はこの論文を読んでいたらしくどうして10℃で実験したか, の質問を受けた.これに対し,冬期の測定で暖房も無く,眼が暗闇に慣れるまで30 分間ふるえていたことを話した.やがて1965年頃よりは,ずいぶん便利になった. それは光電式旋光計の開発であり,暗室より解放されることになった.精度は直視式の 001°にくらべて,1けた上の0001°に上昇したのもありがたかった.現在良く使われ ているのは米国ではPerkin-Elmerの旋光計,日本では堀場の旋光計SEPA-200型であろう.最近 では改良型(SEPA-300)が開発された.この旋光計の原理などについて,わかりやすい解 説がある²¹.

3. アミノ酸の研究

この地球上には何千~何万種という,異なる分子構造の天然アミノ酸が存在する. そ れらのうち結晶として単離され,構造の決定したものは千種以上に及んでいるが,タ ンパク性アミノ酸(L-リシンなど21種)は特別に重要である³⁾. これらタンパク性ア ミノ酸は分子状(例,尿中)あるいはペプチド・タンパク質の構成ユニットとして存 在する(図7を参照). その大きな特徴としてα-炭素は不斉であるが,21種分子は 全て同一のL型という立体構造(図2)をとることである(Rを側鎖という).

これらアミノ酸の旋光性については1800年代より多くの研究があるが、Lutzの法則(1930)が特に有名である.これは「タンパク性L-アミノ酸や他の非タンパク性L- α -アミノ酸も、酸性溶液の[α]_Dは水溶液のそれよりもプラスに移動する」というものである.その理由は、図3のように分子のイオン状況が水溶液中と酸性中では違うためである.



図 2 L-アミノ酸の立体構造 Conformation of L-amino acid



私らは最近,新しい方法(銅塩法)でL-Lys(ϵ -Ac)(図4)など多くのL-Lys(ϵ -acyl)を 高收率で合成し, [M]_D²⁰ を測定した¹¹. acylとしてはAc以外に,プロパノイル,ベン ゾイルなど7~8種のL-リシン誘導体を合成した.例として,表1にL-Lys(ϵ -Ac)につ いて試料溶液の作り方や, [M]_D²⁰ 測定の実際を示す.表1の[M]_D²⁰ (水~HCl)をグラフ にすると図5のようになり,Lutzの法則にしたがうことがわかる.D-Lys(ϵ -Ac) の[M]_D²⁰ カーブは,L体と対称になった.ところが, α -Ac-L-Lys(図4)の[M]_D²⁰ カー ブは,意外な形となり(図5),むしろD-アミノ酸に類似である.ここに,Lutzの法 則に例外が生じたことになる.その理由を考えあぐねたが,最近にいたり分子の立 体構造(図6)より合理的に説明できるようになった.すなわち, α -Ac-L-Lys分子は 両性イオンとして(D)(あるいは(C))であるが,これはD-アミノ酸(B)と立体的に類 似だからである.

a)			b)		C)
HCIの当量	1 M HCIのml	5M HCIのml	α(測定旋光度)	[M] ²⁰	
0	0	0	+0 026	+5 2	
1	0 25	0	+0 159	+31 8	
2	05	0	+0 189	+37 8	
3	0 75	0	+0 190	+38 0	
5	1 25	0	+0 191	+38 2	
100	0	5	+0 202	+40 4	

例, HCI当量が1の場合の溶液の調製法 L-Lys(E-Ac)の47 1mg(0 25mmol)を5ml定容フ ラスコに入れ、1 M HCIの0 25mlを加え、水で5mlにする 試料について0 05Mとなる a)

ミクロセル(長さ10cm, 2ml)に試料溶液を加え測定 b)

c) (4)式により計算





図 5 アセチル-リシン異性体の分子旋光度曲線 Curves of molecular rotations of acetyl-lysine isomers



図6 アセチル-リシン異性体の分子の立体構造 Conformations of molecules of acetyl-lysine isomers

最近はこの立体構造(図 6)の考察より α -acyl-L-Arg, α -acyl-L-His, L-isoAsn およ び甘味アスパルテーム(H-L-Asp-L-Phe-OMeで, L-isoAsnと立体構造が類似)の[M]_D を測定したところ,予想したようにD-アミノ酸型のカーブを与えた.このように思 いがけなく新分野の展開した理由は、使いやすい光電式旋光計の提供のおかげである.

4. ペプチドとタンパク質の研究

ホルモンペプチドやタンパク質は、タンパク性アミノ酸が逐次結合した化合物で ある(図7). 旋光計によるペプチドの研究はいくつかあるが、ここには著者らのグ ラミシジンS(GS)について説明しよう. GSはB brevis菌により生合成される抗生ペ プチドで、病原性グラム陽性菌を殺菌する.構造は環状デカペプチドで(図8)、天 然結晶GS・2HCl・8H₂O は $[M]_{0}^{20}$ - 3680(EtOH)を示す.



GS分子の構成アミノ酸を、他のアミノ酸で置換した合成同族体をアナローグと いうが、私らはすでに100種近くを合成している⁵⁾.それらアナローグのうち、5,5' 位L-ProをGly に置換した[Gly^{5 5}]GS・2HCl・6H₂O はGS同様の抗菌性を示したが、そ れは[M]²⁰_D - 3229(EtOH)のように大きい.他方、[Gly^{1 1'}]GS・2HCl・5H₂Oは不活性 で、[M]²⁰_D - 1196(EtOH)と低かった.このような傾向(活性アナローグの[M]_DはGS に近く、不活性物は低い値)は合成アナローグに共通した事実であり、かくして [M]_DはGSの構造と機能相関の解釈に有用なデータを与えている.



図 9 リボヌクレアーゼAの三次構造 Tertiary structure of ribonuclease A (RNase A)

タンパク質の[α]_b は多くの単行本に実験値がのっている.例えばタンパク質 化学2巻(共立出版,1979)には、タカジアスターゼA(Tase A)など約20種について [α]_b のリストがある.ほとんどのタンパク質の[α]_b は-10~-80(水系溶媒)のよ うに、左旋性である.いくらか踏みこんだ実験に、例えばTase Aは[α]_b -20(水)であ るが酸性(pH2)にすると[α]_b は-90に変化し、このタンパク質の空間構造を追跡 できる.しかし一般的にタンパク質の旋光性は構成L-アミノ酸の不斉炭素以外に、 ペプチド鎖の部分的空間構造(α – ヘリックスなど)も不斉要因となるので、解釈は L-アミノ酸の場合よりも複雑である.最近、矢島名誉教授と藤井教授(京大薬)は ペプチド化学・タンパク質化学の分野で大研究を完成した⁶⁾.これはRNaseA(アミ ノ酸数nは124)(図9³¹)を化学合成したことであり、世界で初めてのアミノ酸数100以上 のタンパク合成に成功した.合成物の結晶形、酵素活性さらに[α]²⁰₀ – 697(0 1M KCI)は、天然物と一致した.この化学合成により構造も確定したので(MWは13700)、分 子旋光度は[M]²⁰₂ – 9550(0 1M KCI)となる.

5. おわりに

以上, 旋光計を利用する研究に関して抽象的紹介よりも, むしろ具体的説明を心 がけた. この小論文を手がかりとされて, 生化学・有機化学の方々が気軽に旋光計 を使用されることをおすすめする. 他方, 医薬品, 食品分野などで旋光計をお使い の方々に対し, この小論文が分子旋光度の導入などに, いささかの参考になれば幸 いである.

参考文献

- 1) Izumiya,N and Greenstein,JP, J Biol Chem, 205, 221-230(1953)
- 2) 澤田喜行,Readout,No 5,81-84(1992)
- 3) 泉屋信夫,野田耕作,下東康幸,"生物化学序説",pp182,化学同人,京都(1987)
- 4) 赤木有, 添嶋康廣, 泉屋信夫, 九産大工学部研究報告,29,119-124(1992)
- 5) Izumiya, N, Kato, T, Aoyagi, H, Waki, M and Kondo, M, "Synthetic Aspects of Biologically Active Cyclic Peptides -Gramicidin S and Tyrocidines-", pp 166, J Wiley & Sons, New York (1979)
- 6) Yajima,H and Fujii,N , J Am Chem Soc ,103,5867-5871(1981)

Studies of Amino Acids, Peptides and Proteins by Polarimeter

This paper discusses the present state of studies of amino acids, peptides and proteins by the use of high-sensitive polarimeter. In the field of amino acids, molecular rotations by ε -acetyl-L-lysine and α -acetyl-L-lysine are introduced, and unexpected rotation by α -acetyl-L-lysine is explained from the standpoint of conformations of the acetyl-L(or D)-lysine molecules. In the field of peptides, molecular rotations of gramicidin S and its synthetic derivatives are discussed. As a protein, chemical synthesis of ribonuclease A is introduced and it is noted that specific rotations of the synthetic enzyme and natural one are identical.

堀場製作所におけるソフトウエアへの取り組み

HORIBA's Involvement in Software

酒井 俊英 Toshihide Sakai

【要旨】

マイクロコンピュータは、当社の殆どの製品に使われており、今やなくてはな らない存在となっている.本稿では、目ざましいコンピュータ関連技術の革新が 進む中で、計測機器メーカである当社がこれらの動きをどう捉えているか、また、今後 の課題について述べる.

Abstract

Microcomputers are used at HORIBA for almost all of our products, and have come to be absolutely vital in their development. This paper describes how HORIBA as a manufacturer of measuring equipment is grasping with current trends as computerrelated technology is advancing at an amazing pace, and also describes future themes.

1. はじめに

1971年頃,電卓の低価格化の流れの中で4ビットのマイクロコンピュータが 発表された.73頃に8ビットのものができ,それまでの機械式制御や,アナログ 式制御,布線論理回路などの代替として普及がはじまった.その後改良が加え られ使い易くなったマイクロコンピュータが出現した.

70年代中ごろからおもに産業用制御機器などに使われはじめたが,当社のマイク ロコンピュータ(以後マイコンという)の導入は'74年であった.80年代に入ると新 製品には必ずマイコンを組み込むようになり,応用製品の種類も増えていった.技 術の進歩は速く,8ビットから16,32ビットになり,ソフトウエア(以後ソフト という)の規模や組織も拡大した。規模の大型化に伴いソフトのプロジェクト・マネ ージメントの重要性が認識されるようになった.一方,同じころ,いわゆるパーソ ナル・コンピュータ(以後パソコンという)が出現し,当社も'82年頃からは積極的 に導入し,製品への応用が始まったのが'85年頃である.

最近はワークステーションやパソコンが急激に高性能化・低価格化しており,機種の選択やソフトの環境の選択は,計測機器の製品企画段階でますます重要になって きている.

2. コンピュータ技術部とソフトウェア

2.1 コンピュータ技術部の組織

コンピュータ技術部は、当社の製品の共通基盤技術としてのコンピュータ・ハ ードウエア(以後ハードという)の研究開発と、大半の製品用ソフトの開発を担当 している.とくにソフトの開発は、様々な開発資源を一元的に運用することによ り、技術情報やノウハウの共有化・共通化し、開発期間、人員、費用など開発資 源の効率的な運営を目指している.計測機器のアプリケーション・ソフトウエア は、個々の製品の分野の知識がないと良いソフトが作れない.これは一般のコン ピュータのアプリケーション開発で言われていることと全く同様である.

従ってコンピュータ技術部内の組織は、当社の製品別の責任体制に基づく専従 化組織に準じた縦割りの組織になっている.製品の分野別の知識、ノウハウは各 専従化の中に属するようにしている.一方、ソフト開発の統制は、部内を横断す る様々な活動を通じて行っている.

2.2 ソフト開発業務のプロセス

当社ではソフト開発の作業工程を表1のように定義し、工程管理を行い品質の 確保を図っている.

作業工程	作業項目
要求分析 (要求調査)	 (1) 市場調査 (2) 要求調査 (3) 技術調査
システム分析 (要求定義)	 (1) 設計目標の設定 ① 機能概要 ② 性能 ③ 信頼性 ④ 制約条件 ⑤ 規模見積り ⑥ 組織計画 ⑦ 大日程計画
システム設計	 システム構成の決定 ハード/ソフトの機能分割 決作仕様設計 操作仕様設計 開発環境の決定 開発マシン 開発言語、ツール
プログラム設計	 (1) モジュール分割 (2) モジュール機能設計 (3) データ設計 (4) モジュールインターフェイス設計 (5) モジュール論理設計
プログラム作成	 (1) コーディング (2) コンパイル (3) リンク
テスト	 (1) 机上テスト (2) 単体テスト (3) 結合テスト (4) システムテスト (5) 改良
まとめ	 (1) プログラム登録 (2) 図面,指示書の作成 (3) 取扱説明書の作成
インストール	 (1) 社内説明会 ① 品質保証部 ② 製造部 ③ サービス部 ④ 営業部 (2) 現地据え付け・調整 (3) ユーザ説明会
クレーム処理	(1) クレーム対応 (2) 出荷後のバグ対策

Software development control procedure

3. 計測機器のソフトウェア技術

当社の製品用ソフト技術と言っても、世間一般のそれと基本的に大きな差異が あるわけではないが、時代の趨勢としてパソコンやワークステーションを中心に 据えたシステムを考えなければならなくなっている.ひと昔前は、いかにして独 自性や特色を出すかという事を中心に計測機器メーカのコンピュータ技術者は考 えていたが、今やそんな時代ではなくなっている.これはハードに比べてソフト の負荷が段々と大きくなり、メーカが独自のハードやオペレーティング・システ ム(以後OSという)や言語(コンパイラ)などを持つと、必ず改良のための組織が必 要になるからである.

一方,今日のコンピュータ技術は圧倒的な内容と速度で進んで行く. 個々の計 測機器メーカが,それら全てに対応していくことは現実的でなく,世界的に共通 なハード・ソフトの基盤の上に立つて考えていくことが重要である.しかしなが ら計測制御機器には,事務計算処理や科学技術計算が主体のパソコンやワークス テーション(以後WSという)だけでは対応できない領域がある.

ソフトの設計を始める場合に最初に考えなければならないことは、そのソフト を適用する製品の性格である.計測機器には必ず何らかのセンサがあり、そこか ら目的とする物理化学量を電気信号として読みとる.一方センサは、周囲の物理 的・化学的な環境条件と微妙なバランスの上に成り立っており、最適条件で測定 するためには周囲の状態を考慮しなければならない.

また測定の前処理のためには、速い応答、再現性の良い時間制御系が必要になる. さらに他の機器やシステムと通信をすることも必要であり、ランダムな通信 要求にすばやく反応しなければならない. そこで、計測機器の特徴や性格を考慮 して、同時並行処理が可能なソフトの構造、つまり同時並行処理が可能になるよ うにリアルタイムモニタもしくはリアルタイムOSを使用してシステムの構築をし なければならない. 主には当社製のコンピュータシステムで、また市販のパソコ ンを使用した一部システムにも、このようなリアルタイムモニタを使用している ものがある. 図1にリアルタイム・マルチタスクのタスク構成図の例を示す.



図1 リアルタイムマルチタスクのタスク構成例 Example configuration of tasks in real-time multi-tasking

4. ソフトウェア技術の今後の方向性

4.1 ハードとOSの動向

近年, IBM社のパソコン(IBM/PC-AT)とその互換機が, DOS/Vシステムで日本 語が使えるようになった.今後,日本電気社のパソコン(NEC/PC-9801)が高い市 場占有率を保っている日本市場でも,低価格のPC-AT互換機が参入し変化が起き そうな状況である.世界市場を対象としている当社にとっても,世界共通のハー ド・ソフトが使える事は大いに価値がある.

ソフトの基盤として、OSではMS-DOSとUNIX-OSが世界的な標準になったと考 えられる.さらにユーザ・インタフェースは、グラフィカル・ユーザ・インタフェ ース(GUI)が世界的に共通の概念となり、DOSのMS-Windows、UNIXのX-WINDOW、 Motifなどは標準と言える.これらのことはハードが異なっていても、同じOSやGUI を使っていれば、ソフトは同じものが動作可能であり、ソフトの品質の一つであ る移植性が良いということにもなる.

当社では、1992年にアメリカの市場向けに、MS-Windowsを適用した粒度分布 測定装置を開発,販売を開始した.Windowsは、米国など海外では広く使われて おり、今後は国内でも理科学機器を中心に普及していくと考えている.

4.2 標準的OSとリアルタイム性

計測制御機器の分野では、リアルタイム処理、つまり何かの事象が発生した場 合に直ちに反応するこが必要となる.しかも反応時間の精度もに非常に重要であ る.

ところで、標準的なUNIX-OSにはクリティカルなリアルタイム処理機能はない. 一方、ソフト開発およびソフト走行環境としては、WSの標準的なOSとしてUNIXは 認知されており、開発する側にも使う側にも多大な利点がある.このような共通 なOSである利点を持ちながら、なおかつリアルタイム性のあるシステムを構築 することは、なかなか容易なことではなかった.

この課題の解決策としては、今日まで図2に示すようないろいろな方法が考えられている.



図 2 リアルタイム処理システムの構築 Building of real-time processing system

(1)OSとリアルタイムの分離

aとbの方式はいずれも2つのコンピュータシステムを使用する.上位のUNIXシ ステムは、下位のシステムの設定と結果の収集,あるいはオペレータインターフェース を提供する.一方下位のマイクロコンピュータシステムはリアルタイム処理を実 現する.

長所は、上位システムが下位とは独立にハードの変更やOSのバージョンアップ ができるため、最新のハードやOSが使用できる点である。上位側は標準的なUNIXで あるからソフトの生産性は良い.一方欠点は、上位と下位それぞれの技術知識が 必要で、開発要員も2系列の者が同時に必要となる点である.また、たった1件 の変更でも両方のソフトに影響し、コスト高になってしまう点も欠点といえよう. (2)リアルタイム核の埋め込み

cの方式は標準的なUNIX-OSにリアルタイム処理の機能を持つソフト(リアル タイム核)を埋め込む方法である.

長所はUNIXの流通ソフトが使えることである. aと同様に技術的, 組織的に UNIXの1系統に絞れることなど, アプリケーションプログラムの保守性は良い. 一 方, UNIX-OSの更新はリアルタイム機能の核プログラムがあるため, 標準UNIX と同時期に行うことは難しく, OS周辺の技術の恒常的な支援を必要とする欠点 がある.

(3)クリーン・ルーム方式

dの方式は、cの方式と似ているが、初めからリアルタイム機能の実現を目的 に開発されたもので、POSIX1003 準拠のUNIXと互換可能なOSである.いわゆる クリーン・ルーム方式で作られており、著作権上の問題もない.

この方式は,前の三つ方式の短所を補い,UNIXの技術をベースにしてアプリケーション開発が可能である.今後は当社もこの方向に進みたいと考えている.

4.3 今後のソフト開発環境

当社は、1988年に通産省の外郭団体である情報処理事業振興協会(IPA)のシグ マプロジェクトの指定モニタとして参加し、ソフト開発環境の統合化を試行した. これは当社がUNIX-OSのアプリケーション開発を始めるさいには大変貴重な経験 となった.

ソフト開発設備(ハード・ソフトのツール類)の効率的な運用や、知識と経験の 豊富な技術者の生産性を考えると、アプリケーションソフトから見たOSやGUIと のインターフェイスは統一されることが望ましい.最近米国のWSのベンダーが、 UNIXのアプリケーション・プログラム・インターフェースの統一に向けて動き だしたという¹⁾.このような動きが、他のOSやGUIの領域にも波及することを 期待している.

4.4 システム・インテグレーションへの展開

コンピュータ関連業務が点から線,面へ,さらには建物全体といった空間的広 がりを持つに従って,それらを統合するためのネットワーク化が進みつつある. オフィスオートメーション(OA)と同様に,実験室や研究室でもコンピュータシス テムのネットワーク化が必要となっている.とくに自動車計測関連の分野では, 実験室単位のシステム化から,さらに複数の実験室をネットワーク化して実験デ ータ,スケジュール,パラメータなどをデータベース化し,計測の自動化を進め るシステム・インテグレーションが求められており,当社の次世代のビジネスと して始まりつつある.

5. ソフト開発環境と海外交流

5.1 ソフト開発の作業環境

1989年に当社は研究開発棟(通称アクティブゾーン21)を建設した.この時, 一つの階全体をソフト開発専用のフロアとした.当時,どのようにして能率の良 いソフト開発の作業環境にするかを考えた.文献¹⁾に"プログラミングの生産 性の良否は作業環境が大きな要因である"とあり,当社でも以前からこう有りた いと考えていたソフト開発の作業環境を構築した(図3).



図 3 ソフト開発の作業環境 Software development room

ソフト開発室をパーティッションを使って区切り,開発担当者ごとに独立した 作業空間を設け,椅子に座れば視界が周りから遮断されて自分の業務に集中でき るようにした.この中にはパソコンがあり,ローカル・ネットワーク(LAN)で全 て接続されており,サーバーを介して電子メールが行き交うようにした.当時ま だ目新しかったツィストペア・イーサネット(10BASE-T)でネットワークを結び,さ らにパーソナル空間を持つ作業環境は,社内・外から注目をあびた.とくに,ソ フト技術者達のモラルが一段と高揚し,生産性・品質が著しく向上した.

5.2 海外子会社との技術交流

当社の製品が世界市場へ拡大するのに伴い,自動車計測分野を中心に,米国, ドイツ,イギリスなどの当社の海外子会社におけるコンピュータシステムの開発 も拡大している.これにともない,ソフト開発のための資源の共有化と無駄な 二重投資を避けるため,ホリバグループ各社間で人事・技術面で積極的に交流を 図っている.

例えば、当社の若手ソフト技術者を米国に1年間研修生として派遣し、先端の ソフト技術を体験させている。逆に、米国のソフト技術者を日本に1~2年受け 入れて、共同開発などを行っている。さらに年に数回各国の技術者が一堂に会し 情報交換を行っている。ここでは、各計測機器間の通信プロトコル、技術の解説、 プログラミングの規約の協議など、様々な討議を通じて情報の共有化に努めてい る.

6. まとめ

日頃"使い易いソフトをタイムリーに提供する"という理念を基本にして技術 の向上,能力の向上に努めている.

"脳神経の電流を捉えてコンピュータが人の概念を理解し,自動的に概念を記述し,処理手順を考えて自動的にプログラッミングする"といった空想の世界を 夢みている.しかし現実は,人間が文字や言葉や絵によって概念を理解し, 処理手順の記述を言葉にし,プログラムに変換し,それを動かして初めの概念と の違いを確かめつつ修正してる.当分はこの状況が続くであろう.

今最も大切な点は、創ろうとしているシステムの概念がどれだけスマートに整理されており、それをどれだけ明確に表現できるかであろう。今後は、CASEツ ールやオブジェクト指向などの技術を修得し、ソフト技術の問題改善とレベルアッ プに努力をしていきたい。

参考文献

"ピープルウエア", Tom DeMarco & Timothy Lister著
 日立ソフトウエア・エンジニアリング生産性研究会訳日経BP社



酒井 俊秀 Toshihide Sakai コンピュータ技術部 部長 1979年入社 マイクロコンピュータ応用製品の 開発に従事

卓上形蛍光 X 線元素分析装置 (MESA-500)

Desktop X-ray Fluorescence Element Analyzer (MESA-500)

吉良 昭道 Akimichi Kira

【要旨】

固体,粉体,液体などあらゆる形態の試料に含まれる元素の量を,非破壊でし かも標準試料を用いることなく,きわめて容易にかつ高精度で分析することがで きるエネルギー分散形蛍光X線分析装置MESA-500を開発した.本装置は,永年 培ってきたハード・ソフト技術を駆使して,誰れでも簡単に,X線スペクトル, 自動定性,スタンダードレス定量などの高精度分析情報を入手することを可能に した,極めてコンパクトな卓上形蛍光X線元素分析装置である.本稿では,測定 されたスペクトルデータから蛍光X線の強度を算出するスペクトル処理方法,基 礎パラメータ法によるマトリックスの補正方法など,どのようにして高精度の定 量分析を実現したかについて報告する.

Abstract

HORIBA has developered the MESA-500 energy dispersive X-ray fluorescence analyzer. This analyzer is capable of extremely easily and accurately analyzing the amount of elements contained in all types of samples (solids, powders, liquids, etc.) in a non-destructive manner and without the need to use standard samples. The MESA-500 is in an extremely compact design, and enables even anybody to easily obtain highly accurate analysis information such as X-ray spectra, automatic qualitative analysis, standard-less quantitative analysis, etc. This paper describes how highly-accurate quantitative analysis has been achieved by methods such as spectrum processing whereby the intensity of fluorescent X-rays is calculated from measured spectrum data, and matrix compensation using fundamental parameter method.

1. はじめに

従来, 蛍光X線分析装置を使って高い精度の定量分析を行うためには, 共存元 素の影響を少なくするためにガラスビード法*1のような希釈処理をしなければ ならず, 測定強度が低下するという欠点があった. とくに半導体検出器を使った エネルギー分散形蛍光X線分析装置は, 小型で高速の元素分析ができるなど多く の長所がある反面, 散乱X線を含む広いエネルギー範囲のX線を同時に検出する ため, 測定できる蛍光X線の強度に限界があり, 波長分散形蛍光X線分析装置に 比べ, 定量精度がやや劣る欠点があった. ところが最近, 基礎パラメータ法によ る共存元素影響の補正により, 試料の前処理が不要で, 小さな励起X線源でも十

<1 ガラスビード法 粉末試料をホウ酸リチウムな どで加熱融解して均一なガラ スにする試料の前処理方法 分な測定強度を得られるエネルギー分散形の優れた特長が活かせるようになった. 当社ではX線管,検出器,高圧電源,高速パルス処理回路,信号回復の演算処 理など各要素技術を徹底的に開発・改良し,小型で誰もが手軽に扱え,しかも定 量精度の高いエネルギー分散形蛍光X線分析装置MESA-500(図1)を開発した.



図 1 エネルギー分散形蛍光 X 線分析装置 MESA-500 Energy dispersive X-ray fluorescence analyzer MESA-500

2. エネルギー分散形蛍光 X 線分析装置

エネルギー分散形蛍光X線分析装置は、検出器自体でX線エネルギーを分離で きるため、分光結晶とゴニオメータを用いる波長分散形の蛍光X線分析装置に比 べ、試料と検出器の間を極めて短くし、検出立体角を大きくすることができる. このため小さな励起源で十分なX線強度が得られ、装置全体を小型化できる長所 がある.また試料表面の凹凸や、励起源-試料-検出器の間隔が多少変わって も、測定スペクトル上のピーク位置や強度にほとんど影響しない.したがって、 試料の研磨や粉砕などの複雑な前処理は不要となる.さらに図2に示すように、 MESA-500の分析部はゴニオメータのような可動部分がないため、 非常に単純・堅牢で故障しにくい構造となっている.これらのさまざまな特長 により、エネルギー分散形蛍光X線分析装置は、近年、研究室ばかりでなく品 質管理やプロセス制御など幅広い分野に急速に普及している.



▲ 2 MESA-50000分析部断面図 Cross-section of MESA-500 analyzer

3. MESA-500の特長

「だれもが、いつでも、容易に取扱うことができる高精度な元素分析装置」を 命題に開発したMESA-500にはさまざまな特長がある.

- ① NaからUまですべての元素をワンタッチで定量
- ② 固体,液体,粉体試料をそのままの形で前処理なしに測定
- ③ 各種の保護機構による人にも装置にもやさしい安全操作(X線発生の自動停止, 真空モニターと連動したシャッター,真空解除のスローリークなど)
- ④ 試料に応じて真空度,X線管の電圧・電流などを自動的に最適条件に設定
- ⑤ 標準試料が不要
- ⑥ 分析時のみ液体窒素を供給すればよい

図3にMESA-500のシステム構成を,表1に主な仕様を示す.



試料形状	最大径 <i>ϕ</i> 150mm~ <i>ϕ</i> 125mm
	(試料厚により変化)
	最大厚 75mm
試料室雰囲気	大気, 真空
照射面積	<i>ϕ</i> 5mm
X線管ターゲット	Rh (ロジウム)
X 線管電圧	①15kV ②50kV
X 線管電流	1∼500 µ A (15kV)
	1∼240 µA (50kV)
検出器	高純度シリコン検出器XEROPHY
デユワ容量	3リットル
液体窒素消費量	1リットル/日 以下
定性分析	自動定性およびマニュアル
定量分析	(1) 基礎パラメータ法
	①スタンダードレス
	②一点校正
	(2) 検量線法
測定条件設定	(1) 電圧:15kV, 50kV 全自動2段切
	り換え (マニュアル可能)
	(2) 電流:自動調整 (マニュアル可能)
プログラム機能	操作手順の記憶により任意の自動操作可能
コンピュータ	IBM-PC/AT互換機
	32ビット, 40メガバイトハードディスク,
	3.5インチフロッピーディスクドライブ
	OS:DOS/V
プリンタ	インパクトドットマトリックス式プリン
	タ、黒色印字
外部出力	RS-232C
周囲温度	10~35°C
周囲湿度	20~80% (相対湿度)
電源	AC100, 120, 220, 240V±10%, 50/60Hz,
	1kVA
	(ユーティリティとしてアース付コンセン
	トが2個必要です)
外形寸法	分析部 450 (W) x 600 (D) x 295 (H) mm
	ポンプ 265 (W) x 350 (D) x 305 (H) mm
重量	分析部 約55kg
	ポンプ 約13kg

表1 MESA-500の仕様 MESA-500 specifications

以下に, MESA-500の特長を生み出している要素技術について詳しく述べる.

4. 超高純度シリコン検出器

MESA-500には超高純度シリコン検出器を用いている.従来,シリコン半導体 検出器には,高純度のシリコン単結晶にリチウムをドープして不純物を補償した ものを用いていた.近年,当社では,補償の必要がない超高純度のシリコン単結 晶を使用した半導体検出器XEROPHYを開発・製品化した¹¹.本検出器の特長は, 使う時だけ液体窒素で冷却すればよく,保管時には冷却しておく必要がない点 で,エネルギー分散形X線検出器がフィールドでより広く使われるようになっ た原動力の一つである.

5. 自動定性分析

従来の蛍光X線分析装置では、測定スペクトルのピーク位置と、あらかじめ分 析装置に記憶させておいた元素ごとの蛍光X線エネルギー位置とを照合し、試料 中の元素を判断してきた.ところが、結晶試料の場合に生じる回折ピーク、 X線管ターゲット材料の特性X線の散乱ピーク、他の元素の蛍光X線などが目的 元素の蛍光X線のピークと重なり、元素の決定が困難な場合も少なくない.この ような場合には、ピークの半値幅や強度比率などX線エネルギー位置以外につい ても考慮する必要があり、装置および試料に対する分析者の知識に依存する割合 が高いものであった.

MESA-500では,誰もが簡単に定性分析できるようにするため,次のように自動的に元素を判断し表示するようにした.

- ① NaからUのすべての元素に対して、その蛍光X線エネルギー位置と測定スペクトルのピーク位置との一致度を、単なるON/OFFではなく、0から100までの数値(M)として算出する.
- ② Mは、測定ピークの大きさ、測定ピーク位置と蛍光X線エネルギー位置との 差、および蛍光X線の強度比率による重みを考慮して演算する。
- ③ M≥ a で確実に存在すると判断できる元素を(○), a >M≥ b で存在が微妙な 元素を(?)と表示. なお, a と b の値は各元素ごとに経験的に設定.

このような独特の判断操作の自動化によって,だれでも一定の正確度で定性分 析ができるようになった.



図 4 シリコン検出器のエネルギー応答関数 Energy response function of a silicon detector

- ガウシャン :exp{-(E-Ep)²/(2σ²)} バックグラウンド:a₀+a₁・E+a₂E²
- テーリング : exp{(E−Ep)/(Bσ)}[1−erf{E−Ep)/ (σ√2)+1/(B√2)}]
 - * 2 遷移確率1%以上の蛍光X線 (Και, Κα2, Κβ1, Κβ3, Κβ5, Κβ2, Lα1, Lα2, L1, Lη, Lβ2, Lβ6, Lβ15, Lβ7, Lβ5, Lβ, Lγ1, Lγ5, Lγ8, Lβ4, Lγ2, Lγ3, Mα1, Mα2, M51, M52, Mβ, MM4 α2, MM341, MM344, Mγ, MM304, MM4-02, MM3044, MM2-N4, MM1-N2, MM1-N2)

6. スペクトル処理

エネルギー分散形の蛍光X線分析装置のエネルギー分解能は、重なりあった測 定ピークを分離するのには必ずしも十分なものではないときがある.このような 場合は蛍光X線のピークの重なりやバックグラウンドを分離するスペクトル処理 が非常に重要となる.

蛍光X線だけを分離抽出し測定精度を向上させるためには、物理定数(蛍光X 線のピーク位置、蛍光X線の発生確率、吸収端位置など)、装置定数(検出器のエ ネルギー分解能、X線管電圧、X線管ターゲット材料など)、および波形情報 (バックグラウンドとピークの関数形)などをあらかじめ設定して使用することが 必要となる.

6.1 波形情報

シリコン検出器のエネルギー応答関数として,図4に示すように,ピークはガ ウシャンおよびテーリング²⁾の式で,バックグラウンドは2次式で近似させた. ピークには,ASTM Data Series DS 46³⁾に記載の蛍光X線の内,遷移確率1%以 上のもの*2をすべて考慮した.

6.2 スペクトル処理の手順

最初に,検出器に入射したX線の一部が,そのエネルギーより1.74keV(シリコンの蛍光X線エネルギー)低いエネルギーのX線として計測されるエスケープピークに対し,スペクトル上での減算と加算により補正を行う.エスケープ処理を行ったスペクトルに対して,蛍光X線のピークの重なりやバックグラウンドを分離して,蛍光X線の正味の強度を抽出する.このピーク分離は以下に述べる2段階で行う.

6.2.1 ピーク分離の初期値算出

最初に、ピーク分離の初期値を算出する.一つの元素に対して、Kα1, Kα2, Kβ1 などのピーク強度比率を固定した波形を作成しておく.測定スペクトルを,いくつ かの元素の波形とバックグラウンドの合成として,最もよく一致するように線形 の最小2乗法により各元素の比率を求め,初期値とする.

6.2.2 非負拘束非線形最小2乗法によるピーク分離

次に、この初期値を使い、定量計算に必要なピークに絞って、ピーク分離を行う. 図5のPtとAuを含む試料の測定スペクトル例では、PtL α_1 , L α_2 , L η とAuL α_1 , L α_2 に絞り込む. フィッティング範囲も狭くする. 初期値算出の場合には、一つの元素のピーク間の強度比率は遷移確率で固定していたが、ここでは非負の制約付きの可変にする. 最小2乗法は非線形となり、Marquardt法¹¹による繰り返しの収束計算で解を求めている. それぞれの蛍光X線強度が求められた後、L α_1 とL α_2 は合わせてL α 強度とし、またK α_1 とK α_2 は合わせてK α 強度として、定量計算に使う.

7. 基礎パラメータ法

基礎パラメータ法(Fundamental Parameter Method:FPM)によるマトリックス補正 は、スペクトル処理により算出した測定強度とシミュレーション強度とが一致す るように試料組成を求める計算である.シミュレーション強度は、X線管と試料 との距離や試料に照射されるX線の角度などの装置定数、蛍光X線の発生する確 率などの物理定数、測定試料の組成などから、共存元素による吸収効果と2次励 起効果を計算して求める.

この計算は,最終的に求めるべき試料の組成が必要であることから,初期値の 仮定から始めて,順次収束させていく繰り返し演算となる.計算に必要な物理定 数は,1次X線^{5),6)},質量吸収係数⁷⁾,蛍光X線エネルギー³⁾,遷移確率^{6),8)},蛍 光収率⁶⁾,ジャンプファクター⁸⁾などである.収束演算の方法は,N.Brollが 1986年に提案した基礎係数法⁶⁾を採用した.図6にFPMの計算フローを,計算式 を(1)式に示す.

$$C_i = R_i \times (1 + \alpha_{ij} \times C_j + \alpha_{ik} \times C_k + \cdots +)$$
(1)

$$\begin{split} \mathrm{Ri} &= \frac{\mathrm{Pi} + \sum\limits_{j} \mathrm{Sij}}{\mathrm{Pi}, 1} \\ \alpha_{ij} &= \frac{\mathrm{qEiCi} \int_{\lambda_{abs, i}}^{\lambda_{0}} \left\{ \frac{\mu_{i, \lambda} \mathrm{I}_{\lambda}}{\mu_{s, \lambda} + A\mu_{s, \lambda i}} \left(\frac{\mu_{j, \lambda} + A\mu_{j, \lambda i}}{\mu_{i, \lambda} + A\mu_{i, \lambda i}} - 1 \right) \right\} d\lambda \\ \alpha_{ij} &= \frac{\mathrm{Pi} - \frac{\mathrm{Pi}}{\mathrm{Pi}}}{-\frac{\mathrm{Sij}/\mathrm{Cj}}{\mathrm{Pi}}} \times \frac{\mathrm{qEiCi} \int_{\lambda_{abs, i}}^{\lambda_{0}} \frac{\mu_{i, \lambda} \mathrm{I}_{\lambda} \mathrm{d}\lambda}{\mu_{i, \lambda} + A\mu_{i, \lambda i}}}{\mathrm{Pi} + \sum\limits_{j} \mathrm{Sij}} \end{split}$$









1 次 X 線線質補正前 Standard-less quantity analysis of BNRM99 alloy: before correcting primary X-ray

8.1次X線の線質の補正

X線管から出射される1次X線は、連続X線と特性X線からなり、それらのエ ネルギー分布によって各元素の励起効率が大きく異なる.このため、シミュレー ション計算に使用する1次X線の線質と、実際の装置から発生するそれとの一致 が重要となる.

最初に、Pellaらが提案したもの⁵⁾に、NBSのFrame C⁶⁾に基づいて特性X線の 種類を増やした1次X線を使った.BNRM合金99試料のスペクトルに対して、こ の1次X線を使った基礎パラメータ法による、感度合わせなどの校正を一切せず に行ったスタンダードレス定量結果を図7に示す.この図には900点近いデータ が記載されているが、Al, Cu, Snなどに誤差が目立つ.とくに、AlやSnなどの 原子番号の離れた元素が比較的多く共存している銅合金の誤差が大きい.

この原因として1次X線の線質以外に装置定数と物理定数の誤差も考えられる が、これらをすべて1次X線の線質補正のみで補償できるかどうか試みた.つま り、蛍光X線のシミュレーション強度が実際の測定強度と一致するように、1次 X線を補正した. この補正後の1次X線を使ったスタンダードレス定量結果を図8に示す. Al, Cu, Snなどの誤差が少なくなり,標準偏差は0.39wt%と定量精度が大幅に向上した.

9. 複数条件FPM

MESA-500では、さらに精度を向上させるため、一つの試料をX線管の管電圧 を変えて測定し、得られた複数データから、より正確な定量結果を出すように工 夫している.この方法は、元素の検出感度がその原子番号と励起X線エネルギー により大きく異なることから、軽元素と重元素が共存するような試料では、1つ の管電圧だけではどちらかが不十分な測定になることを回避した巧妙な手法であ る.

例えばAIのような軽元素と、Cuような比較的原子番号の大きな元素が共存している試料の場合、AIの精度を上げるために管電圧を低くすればCuの精度が下がり、反対にCuの精度を上げるために管電圧を高くするとAIの精度が下がる.そのため、すべての元素の定量結果を情報とする基礎パラメータ法による定量計算では、どうしても全体の精度低下を招いていた.

そこで, 複数の管電圧による測定データから互いの共存元素影響を計算する複数条件FPM(図9)を開発し, 定量精度を向上させた⁹⁾.

以下に、この手法によって定量精度が向上することを計算とデータで示す.



図 9 管電圧自動切換によるFPMの計算フロー Flow of calculation of FPM by automatic switching of tube voltage





15/50kV:管電流で同じDT%に調整



9.1 管電圧と検出下限の関係

図10は水溶液試料を、管電圧15kVと50kVで測定したときの検出下限の計算値 を示している.それぞれの管電圧で適切な計数率となるように、管電流を調整し ており、管電圧15kVの管電流は50kVの約20倍である.原子番号が20番までの元 素の場合は、管電圧15kVの方が50kVよりも1桁程度検出下限が良く、逆に30番 以降の元素は50kVの方が1桁から2桁検出下限が良い.

図11は、銅合金試料の場合の検出下限の計算値である. 同様にそれぞれの管電 圧で適切な計数率となるように、管電流を調整している. 管電圧15kVと50kVと では管電流は10倍程度異なる. 50kVの場合のAlの検出下限は1.3wt%, 15kVの場 合の検出下限は0.2wt%と約6倍の差がある.

9.2 管電圧とスタンダードレス定量精度

MBH社のチタン合金14試料を、スタンダードレスで定量した結果を図12に示す. AlとSnが共に比較的高濃度で含まれているため、複数条件FPMの効果がよく現れる 試料である.管電圧15kV、50kV、自動の3通りで各100秒測定した.ただし、管 電圧自動の場合は、50kVで50秒後15kVで50秒測定の複数条件FPMである.

標準偏差は,15kVが1.0wt%,50kVが0.43wt%,管電圧自動が0.26wt%と定量 精度が良くなることが示されている.

図13にBNRM合金99試料を管電圧自動でスタンダードレス定量した結果を示 す.軽元素のAlを含む試料が少ない試料系であるにもかかわらず,標準偏差は 0.35wt%と精度が向上している.



Lower detection limit of alloy sample (calculated value) 15/50kV:管電法で同じDT%に調整



図12 MIDHATのデタン音높(101P)のスタンター ドレス定量結果(1次X線質補正後) Standard-less determination of MBH Analitical Ltd, titanium alloy (101P): after correcting primary X-ray



10. まとめ

MESA-500で実行している定量演算の内容を具体的に説明し、複数条件のFPMによ り定量精度が向上することを示した.これは演算だけの問題ではなく、管電圧の 安定性、試料と管電圧により500倍まで変化する管電流の比率の正確さ、 パルス処理のデッドタイム補正の正確さなどのハード技術の進歩があって初めて 実現したものである.蛍光X線の測定強度は共存元素の濃度を含む多くのパラメ ータによって影響を受けるが、パソコンのメモリー容量と処理スピードの向上に よって、それらすべてを演算処理できるようになり、操作の簡単化と高精度化が 実現した.励起源、光学系、検出器などのハード技術は、着実に進歩している. 演算処理の高度化とあいまって、簡単、小型、高精度をキーワードに、蛍光X線 分析装置は今後ますます身近なものになっていくものと考える.

参考文献

- 新井重俊 "超高純度シリコンX線検出器 (ゼロフィー)" Readout-HORIBA Technical Reports-, No.2, p.49-56(1991).
- M. Krumrey, E. Tegeler and G. Ulm "Complete characterization of a Si(Li) detector in the photon energy range 0.9-5keV" Rev. Sci. Instrum. 60 (7), July p.2287 (1989).
- G.G. Johnson, Jr., and E.W. White "X-RAY EMISSION WAVELENGTHS AND KEV TABLES FOR NONDIFFRACTIVE ANALYSIS" ASTM Data Series DS 46 (1970)
- 4) 粟屋隆 "データ解析:アナログとデイジタル"学会出版センター (1985) p.130-135.
- P.A. Pella, Liangyuan Feng and J.A. Small "An Analytical Algorithm for Calculation of Spectral Distributions of X-Ray Tubes for Quantitative X-Ray Fluorescence Analysis" X-RAY SPECTROMETRY, VOL. 14, NO.3, p.125 (1985).
- R.L. Myklebust, C.E. Fiori and K.F.J. Heinrich "Frame C: A Compact Procedure for Quantitative Energy-Dispersive Electron Probe X-ray Analysis" National Bureau of Standards Technical Note 1106, 111 pages (Sept. 1979).
- Tran Phuc Thinh, Jean Leroux "New Basic Empirical Expression for Computing Tables of X-Ray Mass Attenuation Coefficients" X-RAY SPECTROMETRY, VOL.8, NO.2, p.85 (1979).
- N. Broll "Quantitative X-Ray Fluorescence Analysis. Theory and Practice of the Fundamental Coefficient Method" X-RAY SPECTROMETRY, VOL.15, P.271-285 (1986).
- 9) A. Kira, Y. Okada, M. Pohl, "A New Development in Energy Dispersive X-ray Fluorescence" PITTCON '93 (USA).



吉良 昭道 Akimichi Kira

製品開発部 係長 1974年入社 X線分析装置の開発企画に従事

多層膜干渉フィルタ生産用全自動真空蒸着装置

Fully Automatic Vacuum Deposition Unit for Producing Multi-layer Interference Filters

祗園 聡・壽見 芳正 Satoshi Gion, Yoshitada Sumi

【要旨】

1992年4月,当社は多層膜干渉フィルタ生産用全自動 真空蒸着装置を新たに導入した.この新型蒸着装置は当 社の約30年間にわたる蒸着技術のノウハウを結集したも のである.本装置の最大の特長は,多層膜蒸着工程を完 全自動化したことで,これにより当社の多層膜干渉フィ ルタの生産効率は大幅に向上した.また,膜厚モニタを はじめとする周辺制御機器の機能を向上させ,高品質の フィルタを安定して供給することが可能となった.本稿 では,蒸着装置の自動化をはかる上での留意点ならびに 本蒸着装置の主な機能を紹介し,あわせて多層膜干渉フ ィルタの実例を示す.

Abstract

In April 1994, HORIBA installed a new fully automatic vacuum deposition unit for producing multi-layer interference layers. This new type vacuum deposition unit pooled together over 30 years of know-how in deposition technology. The biggest feature of this unit is that the process of multi-layer deposition is fully automated, and this has considerably improved the efficiency of producing multi-layer interference filters at HORIBA. Also, the functions of peripheral equipmet

such as film thickness monitors have been improved, which has enabled the stable supply of high-quality filters. This paper introduces the points to bear in mind when automating deposition units and the main functions of deposition unit, and shows actual examples of multi-layer interference filters.

1. はじめに

当社の多層膜干渉フィルタは,自動車排気ガスや工場 の煙導排出ガスの成分分析用として広く使われている各 種の非分散形赤外線ガス分析計の性能を左右する重要部 品の一つである.当社の多層膜干渉フィルタは,1960年 代に研究開発に着手して以来,およそ30年の実績がある. ところで当社では,近年の業容拡大に対応するため,生産 設備の拡大,生産効率の向上,さらにより働き易い作業環 境をめざして,工場部門の大幅な拡充・整備を行ってい る.全自動真空蒸着装置はこの整備計画の一環として導 入された.図1に多層膜干渉フィルタ生産用全自動真空 蒸着装置を示す.



図1 多層膜干渉フィルタ生産用全自動真空蒸着装置 Fully automatic vacuum deposition unit for producing multi-layer interference filters

2. 生産工程と自動化

多層膜干渉フィルタの生産は、①材料準備、②真空排 気、③真空蒸着、④製品検査の四つの工程によって順次 おこなわれる.多層膜干渉フィルタを安価かつ安定に生 産するためにはいずれの工程の自動化も重要だが、とく に多くの人手と高い経験が必要な真空蒸着工程の自動化 導入は、難しいが得られる効果は著しい.

自動真空蒸着装置では、目的とするスペクトルに相当 する膜構成、蒸発源温度(蒸発速度)、膜厚、さらには真 空度などの各種の蒸着条件をあらかじめコンピュータに 設定しておき、光学式膜厚計や真空度計などの計測機器 から得られる信号と比較しながら、リアルタイムに制御 や補正を行うようになっている.図2に真空蒸着装置の 概要¹¹を、また図3に真空蒸着工程のフローを示す.



3. 蒸着膜の特性と自動化の留意点

高品位で安定な多層膜干渉フィルタを製作するために は、各層の膜厚や屈折率などを正確かつ再現性よく制御 しなければならい.ところで真空蒸着によって形成した 薄膜の物性は、基板温度、蒸着速度、真空度など蒸着条 件によって大きく左右される.したがって、真空蒸着装 置の自動化にあたっては、これらの蒸着条件を最適な状 態に設定・制御できるよう注意が必要となる.以下に、 自動化するときの主な留意点を列記する.

(1)基板温度

蒸着基板の温度は蒸着膜の屈折率や膜強度など膜物性 ばかりでなく,膜の形成速度にも大きく影響を及ぼす. したがって,基板温度は蒸着開始時点はもちろん蒸着途 中も厳密に制御しなければならない.そこで,蒸着の自 動化は,基板加熱用ヒータと同時に,電子銃や抵抗加熱 蒸発源などチャンバー内全ての熱源の構造や熱流を考慮



図 3 真空蒸着工程のフロー Flow of vacuum

して設計・制御しなければならない.

(2) 蒸着速度

真空蒸着法によって薄膜を形成すると、基板温度や基 板状態はもちろん、蒸着速度によっても膜の特性は大き く左右される.蒸発源の加熱開始から蒸着完了まで、と くに蒸着開始直後の膜形成速度は重要で、高い精度の検 出・制御が必要となる.ところで単色光干渉式の膜厚モ ニタは、単位膜厚変化に対する光量変化の割合(ΔT/Δd) が非線形になるため、とくに安定性が必要となる.

(3) 真空度

真空度は、蒸発した分子が基板に到達するまでに残留 ガスとの衝突回数を規定するもので、形成される蒸着膜 の特性を左右する重要な因子の一つである.その影響度 合は衝突する残留ガスの種類によって異なり、とくに水 分の影響は著しい.したがって真空蒸着では、残留ガス 全体の真空度(全圧)だけではなく、個別の、とくに水分 の残留量(分圧)を低下させることが重要となる. 一方,厚さ数µm,数十層以上の多層膜で構成される 赤外線多層膜干渉フィルタは,真空蒸着開始から完了ま での全工程を一回の排気サイクルの中で行うことが望ま しい.このため蒸発材料が大量に必要となり,蒸着の自 動化にあたっては確実・安定に作動する蒸発材料補給機 構の工夫も課題の一つとなる.

4. 全自動蒸着装置の特長

このたび導入した全自動蒸着装置は,前章で述べた留 意点に基づいて設計した.表1におもな仕様を示す.以 下に主な特長を述べる.

(1) 排気系とチャンバ内壁加熱

主排気系は,油回転ポンプークライオポンプを採用した.これにより排気時間が大幅に短縮され,とくに干渉フィルタの特性に影響を及ぼしやすい水分の排気速度は従来の約2.3倍となった.さらに,チャンバ内壁にはシーズヒータを設けて水分の排気速度の促進をはかった.これにより残留水分による蒸着膜の屈折率変動が解消できた.

(2)蒸着基板の遊星回転

赤外線ガス分析計に使う多層膜干渉フィルタは, 膜厚 換算で±0.2%と非常に厳しく規定されている. 大量の 蒸着基板にこのような高い精度で蒸着するために, 自転 しながら公転できる, いわゆる遊星回転機構を採用した.

(3)蒸着材料補給機構

厚さμmオーダの膜を数十層以上連続して蒸着するために は、蒸発源へ材料を再現性よく安定に補給しなけならな い.とくにSiOなど顆粒状の原料を補給するときには注意 が必要となる.本蒸着装置では、振動形のフィーダの構 造と制御方法を調整することによってこれを解決した. (4)膜厚モニタ

精度の高い膜厚制御を行うためには,高感度で安定な 膜厚モニタが必要となる.本装置の膜厚モニタは,二波 長補償方式を採用するとともに,検出器の温度調節に フィードバック方式を取り入れ,装置の稼働開始後約1 時間で出力安定度0.2%/hの高い安定化がはかれた.

(5)その他の附属モニタ

さらに本蒸着装置には,蒸着基板の温度監視用として 赤外線放射温度計(当社製プロセス用放射温度計 IT-240), 残留ガス測定用質量分析計などを附属モニタとして取り 付けた.これにより,基板温度の直接監視により薄膜の 均一化・品質向上など,新しい干渉フィルタの開発やト ラブル解析にも素早く対応できるようにした.

排気系 ・ 各ポンプの排気速度 ・ 到達圧力 ・ 排気時間	油回転ボンプ 排気速度 300l/min メカニカルブースターボンプ 排気速度 600m ³ /hour クライオポンプ 排気速度 31000l/sec (H ₂ O) 6.7×10 ⁻⁵ Pa台 (5×10 ⁻⁷ Torr) 1.3×10 ⁻³ Pa (1×10 ⁻⁵ Torr)まで30分
 チャンバー ・ 内径 ・ 全高 ・ 基板回転機構 ・ 基板加熱用ヒータ ・ 基板温度センサ ・ 蒸着源 ・ 蒸着方法 ・ 膜厚モニタ 	

表1 全自動真空蒸着装置の主な仕様

Main specifications of fully automatic vacuum deposition unit
5. 一酸化炭素ガス分析用バンドパスフィルタ

図4は本蒸着装置で製作した一酸化炭素ガス分析用バンドパスフィルタの赤外線スペクトルを示す.透過率は約90%と良好で,また中心波数は目標値2108cm⁻¹に対して2106cm⁻¹とほぼ設計どおりの値を示した.





6. おわりに

全自動蒸着装置の導入により,多層膜干渉フィルタを 大量に生産する体制は大幅に整備された.今後は,さら に生産実績を積み重ね,より高性能なフィルタを安定に 供給できるように,蒸着技術の研鑽に励んでいきたい.

参考文献

1) 石田正彦, "赤外線ガス分析計と赤外線多層膜干渉フィルタ", READOUT,No.1,p47-56,(1990).



祇園 聡 Satoshi Gion

開発センター 1991年入社 多層膜干渉フィルターの 開発・設計に従事



壽見 芳正 Yoshitada Sumi

自動車計測製造部 1992年入社 多層膜干渉フィルターの 生産に従事



血液分析用試薬の保管方法 How to Store the Blood Analysis Reagent

臼井 誠次 Seiji Usui

●血液分析装置と試薬の保管

当社の血液用分析装置には、NaやKなど各種イオンを 測る電解質分析装置SERAシリーズ、白血球など血球成 分を計数する血球計数装置LCシリーズなどがある.

これらの分析装置に使う試薬は次のようなものがある. ① 分析装置の目盛り校正用標準液

- ② 血液サンプルの希釈液
- ③ 配管やセンサなどの洗浄液
- ④ 分析装置の精度管理用コントロール血液

これらの試薬は,保管条件によっては変質することが ある.このため,試薬ごとに指定された保管条件を遵守 することが分析精度を保つ上で必須となる.

●試薬の保管方法

(1)イオン電極校正用標準液

電解質分析装置のセンサは,pH電極と同じ原理のイオン電極である.従ってpH電極と同様,NaやKなどのイオン電極も校正用の標準液が必要となる.本試薬の主成分は,塩化ナトリウムなどの塩類である.

血液中のイオン濃度の変化は微小なため,測定値の正 確さが要求される¹⁾.正確さを左右する要因の一つが, 本試薬中の塩化ナトリウムイオン濃度である.

この試薬の保管条件は, 暗所, 室温と規定されている. 試薬のパッケージに用いられているプラスチック容器は わずかではあるが水蒸気を透過するので, 高温下での長 時間保管は溶液の濃縮につながる. 使用開始までの保管 は, 室内の温度が上昇しない場所がよい. もちろん, 凍 結は, 容器の破壊を防ぐためにも避けなければならない. この試薬の有効期間は製造後1.5年で, ラベルに期限が記 載されている.

(2)血球計数用希釈液

血液中の血球数は、赤血球で1µ1あたり400万個と非 常に多数存在し、そのままでは血球計数装置で測定する ことができない.このため血球が壊れないように、あら かじめ適当な塩類を加え浸透圧を調整した水溶液を用い て、血液サンプルを希釈してから測定する. 希釈液の保管条件は, 暗所, 室温と規定されている. とくに, 凍結の恐れのあるところでの保存は避けるべき である. 1個あたりの容量が20 ℓと大きく, 一度凍結す ると完全に解凍するのは並大抵ではない. 解凍が不完全 だと測定精度が低下するばかりでなく, 測定ができなく なることもある. この試薬の有効期間は製造後1年で, ラベルに期限が記載されている.

(3)血球計数用コントロール血液

コントロール血液は、血球計数装置の精度管理に使用 されるもので、長期間にわたり安定な状態を保持するよ うに血球に特殊処理が施されている.

保管温度は、2~8℃と厳密に規定されている.とく に特殊処理を施し安定化を図ってはいるが、一般に血球 は温度変化に弱く、凍結すれば血球は壊れる.また、室 温で保管していても、血球数に変化をきたす.

この試薬の有効期間は、未開栓2~8℃保管の場合は製造後6ヶ月、または開栓後2~8℃保管の場合は21日となっており、何れか短い期間と規定されている.

●試薬の開封

今回は主に血液分析用試薬の使用開始前の保管条件に ついて述べたが,使用開始後は中断せずに使い切ることが もう一つのポイントである.パッケージの形状にもよる が,開封後は試薬の残量が少なくなると濃縮が加速された り,空気と接触により雑菌が入る可能性が高くなる. 総じて,血液分析用試薬は,抗菌剤を含有しているものの, 雑菌繁殖には適した組成のものが多いので注意が必要で ある.

参考文献

1) 金井泉 "臨床検査法提要 改訂第29版"金原出版 (1983) P.550



臼井 誠次
 Seiji Usui
 製品開発部 係長
 1975年入社
 医学用分析計の企画に従事

Patents 知有権メモ

果汁酸度計

【登録番号】実用新案登録第1845651号

【考案者】青海隆, 岩本恵和

【分野・目的】

本考案は,みかん,グレープフルーツ等の柑橘類をは じめとする果汁の酸度を,希釈した果汁溶液の導電率か ら測定する果汁酸度計に関し,温度による影響や, 希釈水の導電率の影響のない果汁酸度計を提供すること を目的とする.

【概要】

発振器と、希釈水によりほぼ150倍に希釈された果汁 溶液の液温によって抵抗値を変化する感温素子と、前 記果汁溶液の導電率を測定するための導電率セルと、 果汁溶液の導電率を減算し希釈水の影響を補正する補正回 路と、整流回路と、y=0.01912x-0.6684 {ここで、x は希釈水によってほぼ150倍に希釈された果汁溶液の25 ℃における導電率(μS/cm)を表し、また、yは果汁のク エン酸換算酸度(wt%)を表す | に基づいて酸度目盛が目 盛られている果汁酸度指示計とを備え、前記導電率セ ルより得る果汁溶液の導電率信号を前記離近回路にて 補正し、この補正された導電率信号を前記整流回路で 整流し、前記果汁酸度指示計にて酸度指示するように 構成してなる果汁酸度計.

【効果】

y=0.01912x-0.6684なる式に基づいて酸度目盛が 記されている果汁酸度指示計によって酸度指示するよう に構成しているので、測定レンジの値が低くならず、検 量目盛の直線性が良好に維持され、その結果、希釈水の 補正を確実に行うことができ、果汁の酸度測定を、希釈 水の導電率の影響や果汁溶液の液温による変動の影響を 受けることなく、高精度で行えるようになった。



ガス分析装置におけるサンプリング装置

【登録番号】実用新案登録第1892809号 【考案者】古賀富士夫

【分野・目的】

Patents 知有権メモ

本考案は、ガス分析装置におけるサンプリング装置 に関し、その目的は、サンプリング用プローブや一次 フィルターへのダスト付着等による吸引ポンプ前段の 負荷変動に対する安全機能、詰まり、吸引ポンプ前段 の負荷上昇によりドレンセパレーター内の圧力が低下 した際、ドレン排出ラインにあるドレンがガス分析計 ラインに流れ込むことを防止する機能を発揮させるた めの構造が簡単で信頼性の高いサンプリング装置を提 供することにある.

【概要】

1個の槽を漏斗状の仕切板で上下に区画し,上方の 区画室をドレンセパレーターとし,このドレンセパレー ターに,ガス入口と,ガス出口とを設ける一方,下方の 区画室をドレン収納室とし,このドレン収納室に, オーバーフローロを設けると共に,一端が前記オーバー フローロよりも上方において大気中に開口し,他端がド レン中に開口した通気管を設け,さらに,前記オーバー フローロと定圧トラップとの間をドレン排出ライン によって接続したことを特徴とするガス分析装置にお けるサンプリング装置.

【効果】

本考案によれば、吸引ポンプ前段の負荷上昇により、 ドレンセパレーター内の圧力が低下しても、ドレンセ パレーター内の圧力が一定値まで低下したとき、通気 管から大気が吸引されて、ドレンセパレーター内を大 気に開放するため、ドレン収納室のドレンがドレンセ パレーター内に吸い上げられてガス分析計ラインに流 れ込むといった不都合を防止できる.また、1個の槽 を上下に区画し、ドレンセパレーターとドレン収納室 を設けているので構造が簡単で、この種のサンプリン グ装置をよりコンパクトに構成することができる。



社外技術発表リスト

▶口頭発表

1992年11月~1993年4月

標題	氏名	発表機関(場所)	時期
FTIRの自動化対応機能の紹介と、高感度分析テクニックの実際と 応用例について	中田靖	'92分析機器展 (幕張メッセ)	1992年10月14日
卓上型元素(定量,定性)分析装置「蛍光X線分析」の簡易操作 性と自動化について	吉良 昭道	第24回全日本科学機器展 (晴海貿易センターホール)	1992年11月16日
FTIRの自動化対応機能の紹介と、高感度分析テクニックの実際と 応用例について	中田靖	第24回全日本科学機器展 (晴海貿易センターホール)	1992年11月17日
Concentration Analyzer for Sulfer Compounds in Town Gas with Odorant	1) K.Nukui H.Mikasa T.Imaki N.Kada	1992 International Gas Research Conference (Orlando, USA)	1992年11月19日
溶液系を対象とするセンシングの基礎、応用と特許	青海 隆	第22回電気化学講習会 (なにわ会館)	1992年11月26日
燃焼ガス中の多成分連続測定	足立 正之 井上 香	日本機械学会関西支部講習会 (同志社大学)	1992年12月25日
電気化学センサーと特許	青海隆	電気化学協会関西支部H5年総会 (堀場製作所本社)	1993年1月28日
A New Development in Energy Dispersive X-ray Fluorescence	A.Kira Y.Okada 2) M.Pohl	The 1993 Pittsburgh Conference (Atlanta,USA)	1993年3月8日
ガス軟窒化炉NH3計	古賀 富士夫	'93サーモテック展 日本工業炉協会併設講演会 (晴海展示会場)	1993年4月15日
金属中極微量酸素分析装置の応用例と問題点	伴弘一	鉄鋼/非鉄金属主催ワークショップ (東北大学)	1993年4月22日

注 1)東京ガス 2)HORIBA Instrum. Inc.

▶ 文書発表

標題	氏名	発表書誌名
モミ苗の生長に対する人工酸性雨の影響	 1) 伊豆田 猛 1) 大谷 知子 横山 政昭 1) 堀江 勝年 1) 戸塚 續 	大気汚染学会誌 28,1,29-38,1993
FITR法による自動車排ガス測定	井上 香 山岸 豊 足立 正之	自動車技術 47 ,3,22-27,1993
各種燃料車の排ガス特性について	足立 正之	日本機械学会平成4年度公害の防止に関する調査報告書 123-135,1993.3月
ビンボイント濃縮/顕微FTIRをHPLCの検出器とした微量非イオ ン系界面活性剤の同定法 —POEアルキルエーテルとPOEアルキルフェニルエーテルの高感 度検出法—	 2) 礒 節子 2) 中村 忠 内原 博 池田 昌彦 	環境化学 3 ,2,231-237,1993
蛍光X線分析技術の最新動向	吉良 昭道	日経マイクロデバイス 3 (No. 93),106—110,1993
排出ガス規制とその計測	大浦 政弘	自動車技術 47 ,3,4-6,1993
Multiplicity and Lattice Relaxation of DX Center in AlGaAs:Si Studied by Electron Emission Spectra under Pressure	 K. Takarabe H. Ashizawa S. Minomura H. Kato Y. Watanabe K. Matsuda 	Japanese Journal of Applied Physics 32 ,Suppl.32-1,255-257,1993
環境大気自動計測器の現状	山田 毅	産業公害 29 ,1,69-74,1993

注 1)東京農工大学 2)オルガノ株式会社 3)岡山理科大学 4)関西学院大学

2

Readout	No.5 特集●元素をはかる
□巻頭言 □特別寄稿	自由主義経済の行方 堀場雅夫 化学分析の微視化 ―ナノ時代に向かって― 池田重良 元素分析の過去と将来 ―鉄鋼業の場合― 佐伯正夫
●特集論文	X線マイクロアナリシスから見た惑星構成物質の形成史 北村雅夫・村瀬潤・大堀謙一 鉄鋼中極微量炭素の定量分析 田中清之・伴 弘一 元素分析関連製品の現状と技術課題 細川好則 蛍光X線硫黄分析計 SLFA-1800 岡田義明 エネルギー分散形軽元素X線検出器 新井重俊・河村隆文 固体中水素分析装置 EMGA-521/621 林 守伸 酸素・窒素・水素分析装置の自動化ニーズに向けて 平野影弘
□特別寄稿	分光分析の発達と元素の発見 清水 榮
 ●一般論文 ◆開発夜話 ◇一口メモ ●研究施設紹介 ◇知有権メモ ◇社外技術発表 ◇バックナンバ 	高速・高感度旋光計 SEPA-300 澤田喜行 酸性雨分取器「レインゴーランド」誕生記 出会いー試行錯誤ー失敗 − 笑い, そして願い 永井 博 飽和水酸化カルシウムpH標準液について 武市伸二 ▶ 多品種少量に応えるホリバのプリント基板生産ライン 中根正見 €ダイジェスト €リスト (1991年11月~1992年4月) Ňー掲載記事
Readout	No. 6 創立40周年記念号 特集●自動車をはかる
□巻頭言 爴創立40周年訂	トータルな計測を目指して 堀場 厚 記念座談会 —自動車排出ガスと計測技術の今後— 斎藤 孟・松本 清・中島泰夫
□特別寄稿	ス油政弘・石田耕二 低エミッションエンジンの展望 池上 詢
□特集寄稿	メタノールエンジン最近の動向 掘 政彦 水素ロータリエンジンの開発 寺本隆文 日本における天然ガス自動車の開発状況 中川二三雄 電気自動車の開発 北村晏一
●特集論文	 フーリエ変換赤外分光法を用いた自動車排出ガス分析 加地浩成・山岸 豊 自動車計測関連製品の現状と課題 上坂博二 Current Status of Automobile Analysis in the USA R. Neal Harvey 低濃度測定用自動車排出ガス分析装置 武田賢二 シャシダイナモメータ上における自動運転装置 野口進治・河原林成行 トランジェント運転に対応する自動エンジン計測システム 三輪清和・木村信治 蒸散ガス測定設備SHEDシステム 大橋秀樹 48インチシングルローラ・シャシダイナモメータ 毛野克彦・宮川久志
□特別寄稿	先端技術と土着技術 飯田賢一
∭創立40周年詞	記念総説 ――堀場製作所40年間の製品と技術―― 大志万繼影
∭創立40周年訂	記念放談会 ――中堅ホリバリアンたちが語る技術・製品開発―― 青山剛士・足立正之・井内 穣・内原 博・ 北村裕之・斉藤壽一・真鍋清隆・森 健
 ●施設紹介 ◇一口メモ ◇知有権メモ ◇社外技術発表 ◇社外技術発表 ◇バックナンバ 	ホリバ分析センター 小倉淑子 半導体中の不純物を容量過渡法で測定する 小畠裕子 モダイジェスト モリスト(1992年5月〜1992年10月) ヾー掲載記事

※バックナンバーに関しては当社 **Reaclout** 事務局(075)313-8121へお問い合わせ下さい。各論文の別刷りを 用意しております。

Readoul 編集委員会

委員長:石田	耕三
副委員長:青 海	隆
事務局:伊藤	省 二

●お問い合わせ先 株式会社 堀場製作所 知的所有権部 電話 (075)313-8121 Fax (075)321-5648



HORIBA Technical Reports

No.7 1993年7月30日発行

編集·発行人 石 田 耕 三

発 行 所 株式会社 堀場製作所 〒601 京都市南区吉祥院宮の東町2番地 電話 (075)313-8121

印刷·製本 阿部写真印刷株式会社・大阪営業所 〒550 大阪市西区靱本町1-18-8 電話 (06)446-5177

◎株式会社堀場製作所 1993 無断転載を禁じます。

HORIBA